

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**Fixed capacitors for use in electronic equipment –  
Part 1: Generic specification**

**Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –  
Partie 1: Spécification générique**



**THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED**  
**Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland**

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

#### **About the IEC**

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

#### **About IEC publications**

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

#### **IEC Catalogue - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)**

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

#### **IEC publications search - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)**

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

#### **IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)**

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

#### **Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)**

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

#### **IEC Glossary - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)**

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

#### **IEC Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)**

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

---

#### **A propos de l'IEC**

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

#### **A propos des publications IEC**

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### **Catalogue IEC - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)**

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

#### **Recherche de publications IEC - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)**

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

#### **IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)**

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

#### **Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)**

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

#### **Glossaire IEC - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)**

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

#### **Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)**

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).



IEC 60384-1

Edition 5.0 2016-02

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**Fixed capacitors for use in electronic equipment –  
Part 1: Generic specification**

**Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –  
Partie 1: Spécification générique**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 31.060

ISBN 978-2-8322-3153-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	11
1 General.....	13
1.1 Scope.....	13
1.2 Normative references.....	13
2 Technical data.....	15
2.1 Symbols, units and abbreviated terms.....	15
2.1.1 General.....	15
2.1.2 Letter symbols.....	15
2.1.3 Abbreviations.....	16
2.2 Terms and definitions.....	16
2.3 Preferred values and additional technical requirements.....	21
2.3.1 General.....	21
2.3.2 Preferred values of nominal capacitance.....	21
2.3.3 Preferred values of rated voltage.....	21
2.3.4 Rated a.c. load.....	21
2.3.5 Rated pulse load.....	22
2.3.6 Temperature derated voltage.....	22
2.4 Marking.....	23
2.4.1 General.....	23
2.4.2 Coding.....	23
3 Quality assessment procedures.....	23
4 Tests and measurement procedures.....	24
4.1 General.....	25
4.2 Standard atmospheric conditions.....	25
4.2.1 Standard atmospheric conditions for testing.....	25
4.2.2 Recovery conditions.....	25
4.2.3 Referee conditions.....	26
4.2.4 Reference conditions.....	26
4.3 Drying.....	26
4.4 Visual examination and check of dimensions.....	26
4.4.1 Visual examination.....	26
4.4.2 Dimensions (gauging).....	26
4.4.3 Dimensions (detail).....	26
4.5 Insulation resistance.....	27
4.5.1 Preconditioning.....	27
4.5.2 Measuring conditions.....	27
4.5.3 Test points.....	27
4.5.4 Test methods.....	27
4.5.5 Temperature compensation.....	28
4.5.6 Conditions to be prescribed in the relevant specification.....	28
4.6 Voltage proof.....	29
4.6.1 General.....	29
4.6.2 Test circuit (for the test between terminations).....	29
4.6.3 Test.....	30
4.6.4 Requirements.....	32

4.6.5	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	32
4.7	Capacitance.....	32
4.7.1	Measuring frequency and measuring voltage .....	32
4.7.2	Measuring equipment.....	33
4.7.3	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	33
4.8	Tangent of loss angle and equivalent series resistance (ESR).....	33
4.8.1	Tangent of loss angle.....	33
4.8.2	Equivalent series resistance (ESR).....	33
4.9	Leakage current.....	34
4.9.1	Preconditioning.....	34
4.9.2	Test method.....	34
4.9.3	Power source.....	34
4.9.4	Measuring accuracy .....	34
4.9.5	Test circuit.....	34
4.9.6	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	34
4.10	Impedance .....	34
4.11	Self-resonant frequency and inductance .....	35
4.11.1	Self-resonant frequency ( $f_r$ ).....	35
4.11.2	Inductance.....	38
4.11.3	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	38
4.12	Outer foil termination.....	38
4.13	Robustness of terminations .....	39
4.13.1	General .....	39
4.13.2	Test Ua <sub>1</sub> – Tensile.....	39
4.13.3	Test Ub – Bending (half of the sample).....	40
4.13.4	Test Uc – Torsion (remaining sample) .....	40
4.13.5	Test Ud – Torque .....	40
4.13.6	Visual examination.....	40
4.14	Resistance to soldering heat .....	41
4.14.1	Preconditioning and initial measurement.....	41
4.14.2	Test procedure.....	41
4.14.3	Recovery .....	41
4.14.4	Final inspection, measurement and requirements.....	41
4.15	Solderability.....	41
4.15.1	General .....	41
4.15.2	Preconditioning .....	41
4.15.3	Test procedure.....	42
4.15.4	Final inspection, measurements and requirements.....	42
4.16	Rapid change of temperature .....	42
4.16.1	Initial measurement.....	42
4.16.2	Test procedure.....	42
4.16.3	Final inspection, measurements and requirements.....	42
4.17	Vibration .....	42
4.17.1	Initial measurement.....	42
4.17.2	Test procedure.....	43
4.17.3	Electrical test (intermediate measurement) .....	43
4.17.4	Final inspection, measurements and requirements.....	43
4.18	Bump (repetitive shock).....	43
4.18.1	Initial measurement.....	43

4.18.2	Test procedure.....	43
4.18.3	Final inspection, measurements and requirements.....	43
4.19	Shock .....	43
4.19.1	Initial measurement.....	43
4.19.2	Test procedure.....	43
4.19.3	Final inspection, measurements and requirements.....	44
4.20	Container sealing .....	44
4.21	Climatic sequence.....	44
4.21.1	General .....	44
4.21.2	Initial measurements.....	44
4.21.3	Dry heat.....	44
4.21.4	Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle .....	44
4.21.5	Cold.....	44
4.21.6	Low air pressure .....	45
4.21.7	Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles .....	45
4.21.8	Final measurements.....	45
4.22	Damp heat, steady state.....	45
4.22.1	Initial measurement.....	45
4.22.2	Test procedure.....	45
4.22.3	Final inspection, measurements and requirements.....	46
4.23	Endurance .....	46
4.23.1	Initial measurements .....	46
4.23.2	Test procedure.....	46
4.23.3	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	46
4.23.4	Test voltage.....	46
4.23.5	Placement in the test chamber .....	47
4.23.6	Recovery .....	47
4.23.7	Final inspection, measurements and requirements.....	47
4.24	Variation of capacitance with temperature.....	48
4.24.1	Static method.....	48
4.24.2	Dynamic method .....	48
4.24.3	Methods of calculation .....	49
4.25	Storage.....	50
4.25.1	Storage at high temperature .....	50
4.25.2	Storage at low temperature .....	50
4.26	Surge.....	51
4.26.1	Initial measurement.....	51
4.26.2	Test procedure.....	51
4.26.3	Final inspection, measurements and requirements.....	52
4.26.4	Information to be given in the relevant detail specification.....	52
4.27	Charge and discharge tests and inrush current test.....	52
4.27.1	Initial measurement.....	52
4.27.2	Test procedure.....	52
4.27.3	Charge and discharge .....	53
4.27.4	Inrush current .....	54
4.27.5	Final inspection, measurements and requirements.....	54
4.28	Pressure relief (for aluminium electrolytic capacitors).....	54
4.28.1	General .....	54
4.28.2	AC test .....	54

4.28.3	DC test .....	54
4.28.4	Pneumatic test .....	54
4.28.5	Final inspection, measurements and requirements .....	54
4.29	Characteristics at high and low temperature.....	54
4.29.1	Test procedure.....	54
4.29.2	Requirements .....	55
4.30	Thermal stability test .....	55
4.31	Component solvent resistance .....	55
4.31.1	Initial measurements .....	55
4.31.2	Test procedure.....	55
4.31.3	Final inspection, measurements and requirements .....	55
4.32	Solvent resistance of marking.....	55
4.32.1	Test procedure.....	55
4.32.2	Final inspection, measurements and requirements .....	56
4.33	Mounting (for surface mount capacitors only).....	56
4.33.1	Substrate .....	56
4.33.2	Wave soldering .....	56
4.33.3	Reflow soldering .....	56
4.34	Shear test .....	59
4.34.1	Test procedure.....	59
4.34.2	Final inspection, measurements and requirements .....	59
4.35	Substrate bending test .....	59
4.35.1	Test procedure.....	59
4.35.2	Recovery .....	60
4.35.3	Final inspection and requirements .....	60
4.36	Dielectric absorption .....	60
4.36.1	Test procedure.....	60
4.36.2	Requirement .....	61
4.37	Damp heat, steady state, accelerated .....	61
4.37.1	Initial measurements .....	61
4.37.2	Test methods .....	61
4.37.3	Test procedures .....	61
4.37.4	Final inspection, measurements and requirements .....	61
4.38	Passive flammability .....	61
4.38.1	Test procedure.....	61
4.38.2	Final inspection, measurements and requirements .....	62
4.39	High surge current test .....	62
4.39.1	Initial measurements .....	62
4.39.2	Test procedure.....	62
4.39.3	Requirements for the charging circuit .....	63
4.39.4	Nonconforming items .....	63
4.40	Voltage transient overload (for aluminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte).....	63
4.40.1	Initial measurement.....	63
4.40.2	Test procedure.....	63
4.40.3	Final inspection, measurements and requirements .....	65
4.40.4	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	65
4.41	Whisker growth test.....	65
4.41.1	General .....	65

4.41.2	Preparation of specimen.....	66
4.41.3	Initial measurement.....	66
4.41.4	Test procedures.....	66
4.41.5	Test severities.....	66
4.41.6	Final inspection, measurements and requirements.....	66
Annex A (informative) Interpretation of sampling plans and procedures as described in IEC 60410 for use within quality assessment systems.....		67
Annex B (informative) Rules for the preparation of detail specifications for capacitors and resistors for electronic equipment for use within quality assessment systems.....		68
B.1	Drafting.....	68
B.2	Reference standard.....	68
B.3	Circulation.....	68
Annex C (informative) Layout of the first page of a PCP/CQC specification.....		69
Annex D (informative) Requirements for capability approval test report.....		70
D.1	General.....	70
D.2	Requirements.....	70
D.3	Summary of test information (for each CQC).....	70
D.4	Measurement record.....	70
Annex E (informative) Guide for pulse testing of capacitors.....		71
E.1	Overview.....	71
E.2	Typical capacitor pulse conditions.....	71
E.3	Effect of inductance on pulse testing.....	72
Annex F (informative) Guidance for the extension of endurance tests on fixed capacitors.....		74
F.1	Overview.....	74
F.2	Guidelines.....	74
Annex G (normative) Damp heat, steady state with voltage applied, for metallized film capacitors only.....		75
G.1	Overview.....	75
G.2	Test procedure.....	75
Annex H (normative) Accelerated damp heat, steady state, for multilayer ceramic capacitors only.....		76
H.1	Mounting of capacitors.....	76
H.2	Initial measurement.....	76
H.3	Test procedure.....	76
H.4	Recovery.....	76
H.5	Final inspection, measurements and requirements.....	76
Annex Q (informative) Quality assessment procedures.....		77
Q.1	General.....	77
Q.1.1	Scope of this annex.....	77
Q.1.2	Quality assessment definitions.....	78
Q.1.3	Rework.....	78
Q.1.4	Alternative test methods.....	79
Q.1.5	Certified test records of released lots.....	79
Q.1.6	Unchecked parameters.....	79
Q.1.7	Delayed delivery.....	79
Q.1.8	Repair.....	79
Q.1.9	Registration of approvals.....	80
Q.1.10	Manufacture outside the geographical limits.....	80

Q.2	Qualification approval (QA) procedures .....	80
Q.2.1	Eligibility for qualification approval.....	80
Q.2.2	Application for qualification approval .....	80
Q.2.3	Subcontracting.....	80
Q.2.4	Test procedure for the initial product qualification approval .....	80
Q.2.5	Granting of qualification approval .....	80
Q.2.6	Maintenance of qualification approval.....	81
Q.2.7	Quality conformance inspection.....	81
Q.3	Capability approval (CA) procedures.....	81
Q.3.1	General .....	81
Q.3.2	Eligibility for capability approval .....	81
Q.3.3	Application for capability approval .....	82
Q.3.4	Subcontracting.....	82
Q.3.5	Description of the capability .....	82
Q.3.6	Demonstration and verification of capability .....	82
Q.3.7	Granting of capability approval .....	82
Q.3.8	Maintenance of capability approval.....	82
Q.3.9	Quality conformance inspection.....	82
Q.4	Technology approval (TA) procedure .....	83
Q.4.1	General .....	83
Q.4.2	Eligibility for technology approval .....	83
Q.4.3	Application of technology approval .....	83
Q.4.4	Subcontracting.....	83
Q.4.5	Description of technology .....	83
Q.4.6	Demonstration and verification of the technology .....	83
Q.4.7	Granting of technology approval.....	84
Q.4.8	Maintenance of technology approval.....	84
Q.4.9	Quality conformance inspection.....	84
Bibliography .....		85
Figure 1 – Reactive power against frequency .....		22
Figure 2 – Relation between category temperature range and applied voltage.....		23
Figure 3 – Voltage-proof test circuit.....		30
Figure 4 – Schematic diagram of the impedance measuring circuit.....		35
Figure 5 – Capacitor mounting arrangement .....		36
Figure 6 – Capacitor mounting arrangement .....		37
Figure 7 – Typical diagram of an absorption oscillator-wavemeter.....		37
Figure 8 – Schematic diagram of the measuring circuit .....		38
Figure 9 – Test circuit .....		39
Figure 10 – Test circuit for electrolytic capacitors .....		47
Figure 11 – Relay circuit .....		51
Figure 12 – Thyristor circuit .....		51
Figure 13 – Voltage waveform across capacitor.....		52
Figure 14 – Voltage and current waveform .....		53
Figure 15 – Suitable substrate for mechanical tests .....		58
Figure 16 – Suitable substrate for electrical tests.....		59

Figure 17 – High surge current test .....63  
Figure 18 – Voltage transient overload test circuit .....64  
Figure 19 – Voltage waveform.....65

Table 1 – Referee conditions.....26  
Table 2 – Measurement of insulation resistance .....27  
Table 3 – Measuring points .....29  
Table 4 – Tensile force .....40  
Table 5 – Torque .....40  
Table 6 – Number of cycles.....45  
Table 7 – Severities and requirements .....62

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

## Part 1: Generic specification

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60384-1 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment

This fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2008 and constitutes a technical revision, including minor revisions related to tables, figures and references.

This edition contains the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- INTRODUCTION added;
- 4.41 Whisker growth test added;
- Annex Q completely restructured.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/2420/FDIS	40/2444/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

A list of all the parts of the IEC 60384 series, under the general title *Fixed capacitors for use in electronic equipment*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

The specification system for fixed capacitors for use in electronic equipment is structured in a hierarchical system consisting of the following specification types.

### Generic specification

The generic specification covers all subjects mainly common to the family of fixed capacitors for use in electronic equipment, such as terminology, methods of measurement and tests. Where the individual subjects require the prescription conditions or parameters specific to the particular subfamily or type of fixed capacitor, such prescriptions are required to be given by one of the subordinate specifications.

For the scope of fixed capacitors, the numeric reference to the generic specification is IEC 60384-1.

### Sectional specification

Sectional specifications cover all subjects additional to those given in the generic specification, which are specific to a defined sub-group of fixed capacitors. These subjects normally are preferred values for dimensions and characteristics, additional test methods and relevant prescriptions for test methods given in the generic specification, prescriptions for sampling and for the preparation of specimen, recommended test severities and preferred acceptance criteria. The sectional specification also outlines the structure and scope of the test schedules which are to be applied in all subordinate detail specifications.

For the scope of fixed capacitors, the numeric references to the sectional specifications reach from IEC 60384-2 for polyester film capacitors to currently IEC 60384-26 for aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte. The variety of sectional specifications may be adapted to the portfolio of different technologies of fixed capacitors.

### Detail specification

Detail specifications give directly, or by making reference to other specifications, all information necessary to completely describe a given type and range of fixed capacitors, including prescriptions of all values for dimensions and characteristics. They also give all information required for the quality assessment of the covered type and range of fixed capacitors within a suitable quality assessment system, including prescriptions for all applied test severities and acceptance criteria, and the completed test schedules.

Detail specifications can be either specifications within the IEC system, another specification system linked to IEC, or specified by the manufacturer or user. For the scope of fixed capacitors, the numeric references to detail specifications are for example IEC 60384-3-101, if related to the sectional specification IEC 60384-3 and to the ancillary blank detail specification IEC 60384-3-1.

### Blank detail specification

The hierarchical system of specifications is supplemented by one or more blank detail specifications to a sectional specification, which are used to ensure a uniform presentation of detail specifications. The blank detail specifications provide the specification writer with a template on the layout to be adopted and on the information to be given and with guidance for the preparation of detail specifications in line with the requirements of the superior generic or sectional specifications. Blank detail specifications are not considered as relevant specifications since they do not themselves describe any particular component.

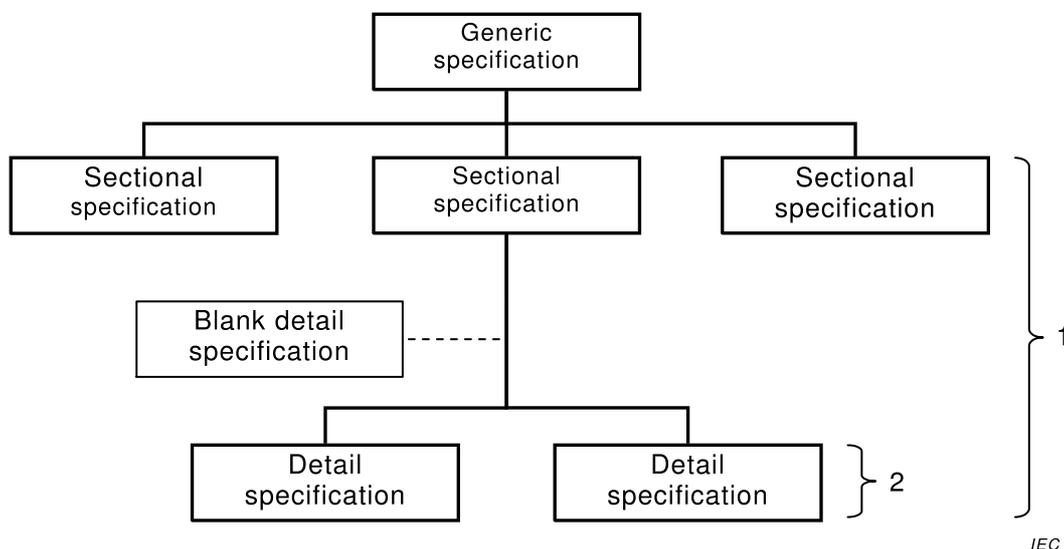
The presence of an established hierarchical specification system with blank detail specifications permits the preparation of detail specifications even outside of the relevant IEC technical committee.

For the scope of fixed capacitors, the numeric references to blank detail specifications are, for example, IEC 60384-3-1, if related to the sectional specification IEC 60384-3.

Relevant specification

In this system the term “relevant specification” addresses subordinate specifications containing specific requirements, where applicable.

Any generic or sectional specification may use abstract and universal references to subordinate specifications of either hierarchical level by use of the expression “relevant specification”.



Key

- 1 Indicates the range of “*Relevant specifications*” to the superior generic specification, where applicable.
- 2 Indicates the range of “*Relevant specifications*” to the superior sectional specification, where applicable.

# FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

## Part 1: Generic specification

### 1 General

#### 1.1 Scope

This part of IEC 60384 is a generic specification and is applicable to fixed capacitors for use in electronic equipment.

It establishes standard terms, inspection procedures and methods of test for use in sectional and detail specifications of electronic components for quality assessment or any other purpose.

#### 1.2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary*<sup>1</sup>

IEC 60062, *Marking codes for resistors and capacitors*

IEC 60063, *Preferred number series for resistors and capacitors*

IEC 60068-1:2013, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1:2007, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold*

IEC 60068-2-2:2007, *Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-6:2007, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-13:1983, *Environmental testing – Part 2-13: Tests – Test M: Low air pressure*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-17:1994, *Environmental testing – Part 2-17: Tests – Test Q: Sealing*

IEC 60068-2-20:2008, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60068-2-21:2006, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

---

<sup>1</sup> [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

- IEC 60068-2-27:2008, *Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock*
- IEC 60068-2-30:2005, *Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)*
- IEC 60068-2-45:1980, *Environmental testing – Part 2-45: Tests – Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents*  
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993
- IEC 60068-2-54:2006, *Environmental testing – Part 2-54: Tests – Test Ta: Solderability testing of electronic components by the wetting balance method*
- IEC 60068-2-58:2015, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*
- IEC 60068-2-67:1995, *Environmental testing – Part 2-67: Tests – Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components*
- IEC 60068-2-69:2007, *Environmental testing – Part 2-69: Tests – Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method*
- IEC 60068-2-78:2012, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*
- IEC 60068-2-82:2007, *Environmental testing – Part 2-82: Tests – Test XW1: Whisker test methods for electronic and electric components*
- IEC 60294, *Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations*
- IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams*
- IEC 60695-11-5:2004, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*
- IEC 60717, *Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations*
- IEC 61193-2, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages*
- IEC 61249-2-7:2002, *Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad – Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad*
- ISO 3, *Preferred numbers – Series of preferred numbers*
- ISO 80000-1, *Quantities and units – Part 1: General*

## 2 Technical data

### 2.1 Symbols, units and abbreviated terms

#### 2.1.1 General

Units, graphical symbols and letter symbols should, whenever possible, be taken from the following publications:

- IEC 60027 (series);
- IEC 60050 (series);
- IEC 60617;
- ISO 80000-1.

When further items are required, they should be derived in accordance with the principles of the publications listed above.

#### 2.1.2 Letter symbols

$C_N$	Nominal capacitance
$DA$	Dielectric Absorption
$du/dt$	Pulse handling capability
$f_r$	Self-resonant frequency
$I_{leak}$	leakage current
$k_0$	Maximum permissible pulse characteristics
$L$	Self-inductance
$R_{INS}$	Insulation resistance
$T_A$	Lower category temperature
$\tan \delta$	Tangent of loss angle
$T_B$	Upper category temperature
$T_C$	Category temperature
$T_{op}$	Operating temperature
$T_R$	Rated temperature
$U_C$	Category voltage
$U_{op}$	Operating voltage
$U_R$	Rated voltage
$U_{RS}$	Surge voltage

- Z Impedance
- $\alpha$  Temperature coefficient of capacitance
- $\tau = C_N \times R_{INS}$  Time constant
- 2.1.3 Abbreviations
- CA Capability Approval
- CB Certification Body
- CQC Capability Qualifying Components
- DMR Designated Management Representative
- ESR Equivalent Series Resistance
- IPA Isopropyl alcohol
- PCP Process Control Plan
- QA Qualifying Approval
- SMD Surface Mount Device
- TA Technology Approval
- TADD Technology Approval Declaration Document

2.2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE They have been listed in alphabetical order.

2.2.1

a.c. capacitor  
capacitor designed essentially for application with alternating voltages

2.2.2

bipolar capacitor  
<electrolytic capacitor> capacitor designed to withstand an alternating voltage and/or reversal of the applied direct voltage

2.2.3

category of passive flammability  
category indicating the maximum burning time after a specified time of flame application

2.2.4

category temperature range  
ambient temperature range for which the capacitor has been designed to operate continuously

Note 1 to entry: The temperature range is limited by the lower and upper category temperature (see 2.2.10 and 2.2.41).

## 2.2.5

category voltage

$U_C$

maximum voltage that can be applied continuously to a capacitor at its upper category temperature (2.2.41)

## 2.2.6

d.c. capacitor

capacitor designed essentially for application with direct voltage

Note 1 to entry: It may not be suitable for use on a.c. supplies.

## 2.2.7

family

<electronic components> group of components which predominantly displays a particular physical attribute and/or fulfils a defined function

## 2.2.8

grade

term to indicate an additional general characteristic concerning the intended application of the component

## 2.2.9

insulated capacitor

capacitor in which all terminations of a section may be raised to a potential different (but not less than the rated voltage) from that of any conducting surface with which the case is liable to come into contact in normal use

## 2.2.10

lower category temperature

minimum ambient temperature for which a capacitor has been designed to operate continuously

## 2.2.11

maximum storage temperature

maximum ambient temperature which the capacitor withstands in the non-operating condition without damage

## 2.2.12

maximum temperature of a capacitor

temperature at the hottest point of its external surface

Note 1 to entry: The terminations are considered to be part of the external surface.

## 2.2.13

minimum storage temperature

minimum ambient temperature which the capacitor withstands in the non-operating condition without damage

## 2.2.14

minimum temperature of a capacitor

temperature at the coldest point of the external surface

Note 1 to entry: The terminations are considered to be part of the external surface.

## 2.2.15

nominal capacitance

$C_N$

designated capacitance value, usually indicated on the capacitor

2.2.16

passive flammability

ability of a capacitor to burn with a flame as a consequence of the application of an external source of heat

2.2.17

polar capacitor

<electrolytic capacitor> capacitor intended for use with a unidirectional voltage connected according to the polarity indication

2.2.18

pulse capacitor

capacitor for use with pulses of current or voltage

Note 1 to entry: The definitions of IEC 60469 apply.

2.2.19

pulse equivalent circuit of a capacitor

equivalent circuit consisting of an ideal capacitor in series with its residual inductance and the equivalent series resistance (ESR)

Note 1 to entry: For pulse operation the equivalent series resistance will be similar to, but not identical with, the ESR measured with a sinusoidal voltage. The pulse ESR depends on the series of harmonics in the pulse and the variation of the losses with frequency.

2.2.20

rated a.c. load

maximum sinusoidal a.c. load which may be applied continuously to the terminations of a capacitor at any temperature between the lower category temperature (2.2.10) and the rated temperature (2.2.24)

2.2.21

rated pulse load

maximum pulse load which may be applied at a certain pulse repetition frequency to the terminations of a capacitor at any temperature between the lower category temperature (2.2.10) and the rated temperature (2.2.24)

2.2.22

rated ripple current

r.m.s. value of the maximum allowable alternating current of a specified frequency, at which the capacitor can be operated continuously at a specified temperature

Note 1 to entry: As the ripple current will generate a ripple voltage across the capacitor, the sum of the direct voltage and the peak value of the alternating voltage applied to the capacitor should not exceed the rated voltage or temperature derated voltage, as applicable.

2.2.23

rated ripple voltage

r.m.s. value of the maximum allowable alternating voltage at a specified frequency superimposed on the d.c. voltage at which the capacitor may be operated continuously at a specified temperature

Note 1 to entry: The sum of the direct voltage and the peak value of the alternating voltage applied to the capacitor should not exceed the rated voltage or temperature derated voltage, as applicable.

2.2.24

rated temperature

maximum ambient temperature at which the rated voltage may be continuously applied

2.2.25  
rated voltage  
 $U_R$

2.2.25.1  
rated d.c. voltage  
maximum d.c. voltage which may be applied continuously to a capacitor at the rated temperature (2.2.24)

Note 1 to entry: The maximum d.c. voltage is the sum of the d.c. voltage and peak a.c. voltage or peak pulse voltage applied to the capacitor.

2.2.25.2  
rated a.c. voltage  
maximum r.m.s. alternating voltage which may be applied continuously to a capacitor at the rated temperature (2.2.24) and at a given frequency

2.2.25.3  
rated pulse voltage  
peak value of the pulse voltage within a given pulse wave form which may be applied continuously to a capacitor at the rated temperature (2.2.24)

2.2.26  
reverse voltage  
<polar capacitor> voltage applied to the capacitor terminations in the reverse polarity direction

Note 1 to entry: Reverse voltage applies to polar capacitors only.

2.2.27  
self-healing  
process by which the electrical properties of the capacitor, after a local breakdown of the dielectric, are rapidly and essentially restored to the values before the breakdown

2.2.28  
style  
subdivision of a type (2.2.39), generally based on dimensional factors, which may include several variants, generally of a mechanical order

2.2.29  
subfamily  
<electronic components> group of components within a family (2.2.7) manufactured by similar technological methods

2.2.30  
surface mount capacitor  
fixed capacitor whose small dimensions and nature or shape of terminations make it suitable for use in hybrid circuits and on printed boards

2.2.31  
surge voltage ratio  
quotient of the maximum instantaneous voltage which can be applied to the terminations of the capacitor for a specified time at any temperature within the category temperature range (2.2.4) and the rated voltage (2.2.25) or the temperature derated voltage (2.2.36), as appropriate

2.2.32

tangent of loss angle

$\tan \delta$

power loss of the capacitor divided by the reactive power of the capacitor at a sinusoidal voltage at a specified frequency

2.2.33

temperature characteristics of capacitance

maximum variation of capacitance produced over a given temperature range within the category temperature range (2.2.4)

Note 1 to entry: The term characterizing this property applies mainly to capacitors of which the variations of capacitance as a function of temperature, linear or non-linear, cannot be expressed with precision and certainty.

Note 2 to entry: This characteristic is normally expressed as a percentage of the capacitance related to a reference temperature of 20 °C.

2.2.34

temperature coefficient of capacitance

$\alpha$

rate of change of capacitance with temperature measured over a specified range of temperature

Note 1 to entry: The term characterizing this property applies to capacitors of which the variations of capacitance as a function of temperature are linear or approximately linear and can be expressed with a certain precision.

Note 2 to entry: This coefficient is normally expressed in parts per million per Kelvin ( $10^{-6}/K$ ).

2.2.35

temperature cyclic drift of capacitance

maximum irreversible variation of capacitance observed at room temperature during or after the completion of a number of specified temperature cycles

Note 1 to entry: The term characterizing this property applies to capacitors of which the variations of capacitance as a function of temperature are linear or approximately linear and can be expressed with a certain precision.

Note 2 to entry: This drift is normally expressed as a percentage of the capacitance related to a reference temperature, usually 20 °C.

2.2.36

temperature derated voltage

maximum voltage that may be applied continuously to a capacitor, when it is at any temperature between the rated temperature (2.2.24) and the upper category temperature (2.2.41)

Note 1 to entry: Refer to 2.3.6.

2.2.37

temperature rise

temperature rise of the capacitor relative to the ambient temperature resulting from the losses in the capacitor due to operation under a.c., pulse or charge/discharge conditions

2.2.38

time constant

$\tau$

product of the insulation resistance and the capacitance

Note 1 to entry: The time constant is normally expressed in seconds.

### 2.2.39

#### type

group of components having similar design features and manufacturing techniques, enabling them to be considered together, either for qualification approval or for quality conformance inspection

Note 1 to entry: These components are generally covered by a single detail specification.

Note 2 to entry: Components described in several detail specifications, may, in some cases, be considered as belonging to the same type.

### 2.2.40

#### uninsulated capacitor

capacitor in which one or more of the terminations of a section cannot be raised to a potential different (but not less than the rated voltage) from that of any conducting surface with which the case is liable to come into contact in normal use

### 2.2.41

#### upper category temperature

maximum ambient temperature for which a capacitor has been designed to operate continuously

### 2.2.42

#### visible damage

visible damage which reduces the usability of the capacitor for its intended purpose

## 2.3 Preferred values and additional technical requirements

### 2.3.1 General

Each sectional specification shall prescribe the preferred values appropriate to the subfamily; for nominal capacitance, see also 2.3.2.

### 2.3.2 Preferred values of nominal capacitance

The preferred values of nominal capacitance shall be taken from the series specified in IEC 60063.

### 2.3.3 Preferred values of rated voltage

The preferred values of the rated voltage are the values of the R10 series of ISO 3: 1,0 – 1,25 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,15 – 4,0 – 5,0 – 6,3 – 8,0 and their decimal multiples ( $\times 10^n$ ,  $n$ : integer).

### 2.3.4 Rated a.c. load

The rated a.c. load may be expressed:

- a) at low frequencies as a rated a.c. voltage;
- b) at high frequencies as a rated a.c. current;
- c) at intermediate frequencies as a rated reactive power (var).

This is shown in Figure 1.

For a particular type of capacitor, it may be necessary to specify one or more of the above characteristics.

Capacitors within the scope of this standard are normally less than 500 var at 50 Hz to 60 Hz. Low frequencies may be 50 Hz to 60 Hz, 100 Hz to 120 Hz, or 400 Hz. Voltages may be up to 600 V r.m.s. at 50 Hz to 60 Hz. However, capacitors for filters, transmitter or converter circuits

may be required to operate under power over a wide range of frequencies and up to 10 kvar at the higher frequencies with voltages up to 1 000 V r.m.s.

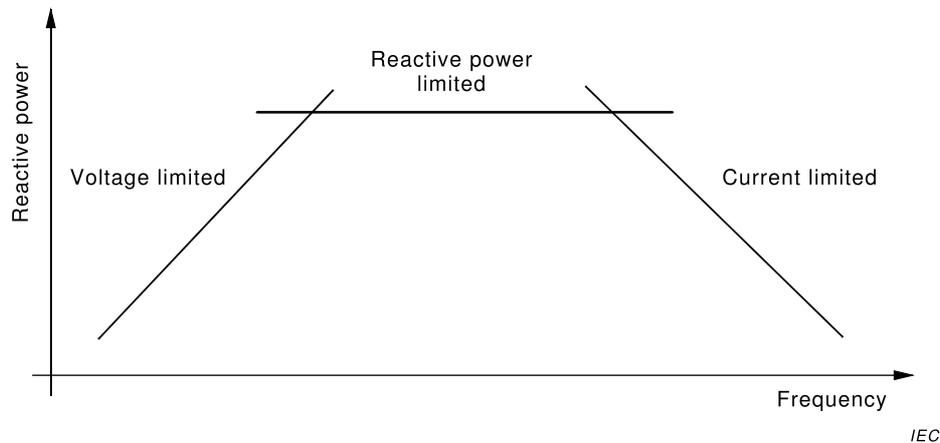


Figure 1 – Reactive power against frequency

### 2.3.5 Rated pulse load

The rated pulse load may be expressed as a) and b) and any of the remaining items:

- a) peak current per  $\mu\text{F}$  or  $du/dt$  ( $\text{V}/\mu\text{s}$ );
- b) relative duration of charge and discharge periods;
- c) current;
- d) peak voltage;
- e) peak reverse voltage;
- f) pulse repetition frequency;
- g) maximum active power.

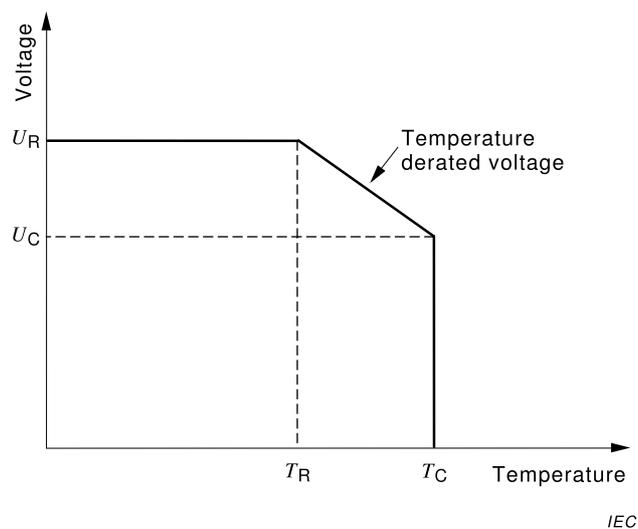
These parameters are fixed for periodic pulses.

In the case of intermittent pulses, the duty cycle should be specified. In the case of random pulses, the total number expected over a given time period should be stated.

The r.m.s. pulse current should be calculated in accordance with IEC 60469:2013, 3.2.17.5. In the case of intermittent or random pulses, the time interval should be chosen to correspond to the maximum temperature rise.

### 2.3.6 Temperature derated voltage

Information on the voltage/temperature dependence at temperatures between the rated temperature and the upper category temperature should, if applicable, be given in the relevant specification (see Figure 2).



#### Key

- $U_R$  is the rated voltage
- $U_C$  is the category voltage
- $T_R$  is the rated temperature
- $T_C$  is the category temperature

Figure 2 – Relation between category temperature range and applied voltage

## 2.4 Marking

### 2.4.1 General

The sectional specification shall indicate the identification criteria and other information to be shown on the capacitor and/or packaging.

The order of priority for marking small capacitors shall be specified.

### 2.4.2 Coding

When coding is used for capacitance value, tolerance or date of manufacture, the method shall be selected from those given in IEC 60062.

## 3 Quality assessment procedures

See Annex Q.

## 4 Tests and measurement procedures

General information on test and measurement procedures	Subclause
General	4.1
Standard atmospheric conditions	4.2
Drying	4.3
Storage	4.25
Mounting (for surface mount capacitors only)	4.33
Electrical tests and measurements	
Insulation resistance	4.5
Voltage proof	4.6
Capacitance	4.7
Tangent of loss angle and equivalent series resistance (ESR)	4.8
Leakage current	4.9
Impedance	4.10
Self-resonant frequency and inductance	4.11
Variation of capacitance with temperature	4.24
Surge	4.26
High surge current test	4.39
Charge and discharge tests and inrush current test	4.27
Dielectric absorption	4.36
Voltage transient overload (for aluminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte)	4.40
Mechanical tests and measurements	
Visual examination and check of dimensions	4.4
Outer foil termination	4.12
Robustness of terminations	4.13
Vibration	4.17
Bump (repetitive shock)	4.18
Shock	4.19
Container sealing	4.20
Shear test	4.34
Substrate bending test	4.35
Environmental and climatic tests	
Rapid change of temperature	4.16
Climatic sequence	4.21
Damp heat, steady state	4.22
Endurance	4.23
Characteristics at high and low temperature	4.29
Thermal stability test	4.30
Damp heat, steady state, accelerated	4.37
Tests related to component assembly	
Resistance to soldering heat	4.14
Solderability	4.15
Component solvent resistance	4.31
Solvent resistance of marking	4.32
Whisker growth test	4.41
Test related to safety	
Pressure relief (for aluminium electrolytic capacitors)	4.28
Passive flammability	4.38

## 4.1 General

The sectional and/or blank detail specification shall indicate the tests to be made, which measurements are to be made before and after each test or subgroup of tests, and the sequence in which they shall be made. The stages of each test shall be carried out in the order written. The measuring conditions shall be the same for initial and final measurements.

If national specifications within any quality assessment system include methods other than those specified in the above specifications, they shall be fully described.

Limits given in all specifications are absolute limits. The principle to take measurement uncertainty into account shall be applied.

## 4.2 Standard atmospheric conditions

### 4.2.1 Standard atmospheric conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out under standard atmospheric conditions for testing as given in IEC 60068-1:2013, 4.3:

- temperature: 15 °C to 35 °C;
- relative humidity: 25 % to 75 %;
- air pressure: 86 kPa to 106 kPa.

Before the measurements are made, the capacitor shall be stored at the measuring temperature for a time sufficient to allow the entire capacitor to reach this temperature. The period as prescribed for recovery at the end of a test is normally sufficient for this purpose.

When measurements are made at a temperature other than the specified temperature, the results shall, where necessary, be corrected to the specified temperature. The ambient temperature during the measurements shall be stated in the test report. In the event of a dispute, the measurements shall be repeated using one of the referee temperatures (as given in 4.2.3) and such other conditions as are prescribed in this standard.

When tests are conducted in a sequence, the final measurements of one test may be taken as the initial measurements for the succeeding test.

During measurements the capacitor shall not be exposed to draughts, direct sunlight or other influences likely to cause error.

### 4.2.2 Recovery conditions

Unless otherwise specified recovery shall take place under the standard atmospheric conditions for testing (4.2.1).

If recovery under closely controlled conditions is necessary, the controlled recovery conditions of IEC 60068-1:2013, 4.4.2, shall be used.

Unless otherwise specified in the relevant specification, a duration of 1 h to 2 h shall be used.

The definition of recovery is as given in IEC 60068-1:2013, 3.4, being further restricted for capacitors as follows:

When a recovery period is specified as, for example, 1 h to 2 h, this means that measurement (or other subsequent action) on a batch of capacitors may start after 1 h and shall be completed before 2 h from the beginning of the recovery period.

The preferred method of specifying a recovery period is in the form "x h to y h".

#### 4.2.3 Referee conditions

For referee purposes, one of the standard atmospheric conditions for referee tests taken from IEC 60068-1:2013, 4.2, as given in Table 1 below, shall be selected.

Table 1 – Referee conditions

Temperature °C	Relative humidity %	Air pressure kPa
20 ± 1	63 to 67	86 to 106
23 ± 1	48 to 52	86 to 106
25 ± 1	48 to 52	86 to 106
27 ± 1	63 to 67	86 to 106

#### 4.2.4 Reference conditions

For reference purposes, the standard atmospheric conditions for reference given in IEC 60068-1:2013, 4.1, apply:

- temperature: 20 °C;
- air pressure: 101,3 kPa.

#### 4.3 Drying

Unless otherwise specified in the relevant specification, the capacitor shall be conditioned for 96 h ± 4 h by heating in a circulating air oven at a temperature of 55 °C ± 2 °C and a relative humidity not exceeding 20 %.

The capacitor shall then be allowed to cool in a desiccator using a suitable desiccant, such as activated alumina or silica gel, and shall be kept therein from the time of removal from the oven to the beginning of the specified tests.

#### 4.4 Visual examination and check of dimensions

##### 4.4.1 Visual examination

The condition, workmanship and finish shall be satisfactory, as checked by visual examination (see 2.2.42).

Marking shall be legible, as checked by visual examination and shall conform with the requirements of the detail specification.

##### 4.4.2 Dimensions (gauging)

The dimensions indicated in the detail specification as being suitable for gauging shall be checked, and shall comply with the values prescribed in the detail specification.

When applicable, measurements shall be made in accordance with IEC 60294 or IEC 60717.

##### 4.4.3 Dimensions (detail)

All dimensions prescribed in the detail specification shall be checked and shall comply with the values prescribed.

## 4.5 Insulation resistance

### 4.5.1 Preconditioning

Before this measurement is made, the capacitors shall be fully discharged.

### 4.5.2 Measuring conditions

Unless otherwise specified in the relevant specification, the insulation resistance shall be measured at the voltage specified in Table 2.

The insulation resistance shall be measured after the voltage has been applied for  $60 \text{ s} \pm 5 \text{ s}$ , unless otherwise prescribed in the detail specification.

Table 2 – Measurement of insulation resistance

Voltage rating of capacitor V	Measuring voltage V
$U_R$ or $U_c < 10$	$U_R$ or $U_c \pm 10 \%$
$10 \leq U_R$ or $U_c < 100$	$10 \pm 1^a$
$100 \leq U_R$ or $U_c < 500$	$100 \pm 15$
$500 \leq U_R$ or $U_c$	$500 \pm 50$
<sup>a</sup> When it can be demonstrated that the voltage has no influence on the measuring result, or that a known relationship exists, measurements can be performed at voltages up to the rated or category voltage. In case of dispute, 10 V shall be used, unless otherwise specified in the sectional specification.	

$U_R$  is the rated voltage for use in defining the measuring voltage to be used under standard atmospheric conditions for testing.

$U_c$  is the category voltage for use in defining the measuring voltage to be used at the upper category temperature.

### 4.5.3 Test points

The insulation resistance shall be measured between the measuring points defined in Table 3, specified in the relevant specification.

Test A, between terminations, applies to all capacitors, whether insulated or not.

Test B, internal insulation, applies to insulated capacitors in uninsulated metal cases and to insulated and uninsulated multiple section capacitors.

Test C, external insulation, applies to insulated capacitors in non-metallic cases or in insulated metal cases. For this test, the measuring voltage shall be applied using one of the three following methods as specified in the relevant specification:

### 4.5.4 Test methods

#### 4.5.4.1 Foil method

A metal foil shall be closely wrapped around the body of the capacitor.

For capacitors with axial terminations this foil shall extend beyond each end by not less than 5 mm, provided that a minimum distance of 1 mm can be maintained between the foil and the terminations. If this minimum distance cannot be maintained, the extension of the foil shall be reduced by as much as is necessary to establish the distance of 1 mm.

For capacitors with unidirectional terminations, a minimum distance of 1 mm shall be maintained between the edge of the foil and each termination.

#### 4.5.4.2 Method for capacitors with mounting devices

The capacitor shall be mounted in its normal manner on a metal plate, which extends at least 12,7 mm in all directions beyond the mounting face of the capacitor.

#### 4.5.4.3 V-block method

The capacitor shall be clamped in the trough of a 90° metallic V-block of such size that the capacitor body does not extend beyond the extremities of the block.

The clamping force shall be such as to guarantee adequate contact between the capacitor and the block.

The capacitor shall be positioned in accordance with the following:

- a) for cylindrical capacitors: the capacitor shall be positioned in the block so that the termination furthest from the axis of the capacitor is nearest to one of the faces of the block;
- b) for rectangular capacitors: the capacitor shall be positioned in the block so that the termination nearest the edge of the capacitor is nearest to one of the faces of the block.

For cylindrical and rectangular capacitors having axial terminations any out-of-centre positioning of the terminations at their emergence from the capacitor body shall be ignored.

#### 4.5.5 Temperature compensation

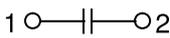
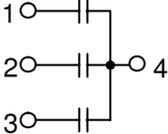
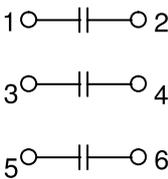
When prescribed in the detail specification, the temperature at which the measurement is made shall be noted. If this temperature differs from 20 °C, a correction shall be made to the measured value by multiplying the value by the appropriate correction factor prescribed in the sectional specification.

#### 4.5.6 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- a) the measuring points and the measuring voltage corresponding to each of these test points;
- b) the method of applying the voltage (one of the methods described in 4.5.4);
- c) time of electrification if other than 1 min;
- d) any special precautions to be taken during measurements;
- e) any correction factors required for measurement over the range of temperatures covered by the standard atmospheric conditions for testing;
- f) the temperature of measurement if other than the standard atmospheric conditions for testing;
- g) the minimum value of insulation resistance for the various measuring points (see Table 3).

Table 3 – Measuring points

Test	Applicable to:	1: Single-section capacitors  e.g. 	2: Multiple-section capacitors having common termination for all sections  e.g. 	3: Multiple-section capacitors having no common termination  e.g. 
A. Between terminations <sup>a</sup>	All capacitors	1a: Between terminations (1-2)	2a: Between each of the terminations and the common termination (1-4, 2-4, 3-4)	3a: Between terminations of each section (1-2, 3-4, 5-6)
B. Internal insulation	Insulated single- and multiple-section capacitors in uninsulated metal cases (1b, 2b, 3b)	1b: Between terminations connected together and the case [(1 to 2)- case]	2b: Between all terminations connected together and the case [(1 to 4)- case]	3b: Between all terminations connected together and the case [(1 to 6)- case]
	Insulated and uninsulated multiple-section capacitors (2c and 3c)		2c: Between the non-common termination of each section and all the other terminations connected together e.g. [2-(1, 3, 4)]	3c: Between the terminations of separate sections, the two terminations of each section being connected together e.g. [(1 to 2)-(3 to 6)]
C. External insulation	Insulated capacitors in non-metallic cases or in insulated metal cases	1c: Between the two terminations connected together and, as appropriate, the metal foil, the metal plate or the metal V-block [(1 to 2)-metal jig]	2d: [(1 to 4)-metal jig]	3d: [(1 to 6)-metal jig]
			Between all terminations connected together and, as appropriate: the metal foil, the metal plate or the metal V-block	
<sup>a</sup> Where a capacitor has more than two terminations, the measuring points are the two terminations which are insulated from one another by the capacitor's element dielectric. For example, for a coaxial lead-through capacitor, the measuring points should be one of the terminations connected to the central conductor and the coaxial metal case or mounting face.				

## 4.6 Voltage proof

### 4.6.1 General

The test prescribed below is a d.c. test. When an a.c. test is applied, the test circuit shall be prescribed in the relevant specification.

### 4.6.2 Test circuit (for the test between terminations)

The test circuit elements shall be selected in such a way as to ensure that the conditions relating to the charging and discharging currents and the time constant for charging, prescribed in the relevant specification, are maintained.

Figure 3 specifies the characteristics of a suitable test circuit.

The resistance of the voltmeter shall be not less than 10 000 Ω/V.

The resistor  $R_1$  includes the internal resistance of the voltage source.

The resistors  $R_1$  and  $R_2$  shall have a value sufficient to limit the charging and discharging current to the value prescribed in the relevant specification.

The capacitance of capacitor  $C_1$  shall be not less than 10 times the capacitance of the capacitor under test.

If applicable, the time constant  $R_1 \times (C_X + C_1)$  shall be less than, or equal to, the value prescribed in the relevant specification.

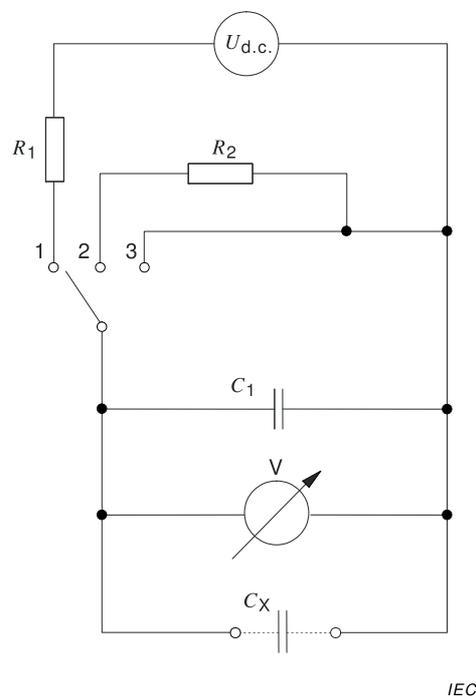


Figure 3 – Voltage-proof test circuit

The capacitor  $C_1$  may be omitted for the testing of certain types of capacitors. This should be stated in the sectional specification.

#### 4.6.3 Test

##### 4.6.3.1 General

Depending on the case, the test comprises one or more parts in accordance with Table 3 and the requirements of the relevant specification.

Repeated application of the voltage proof test may cause permanent damage to the capacitor and should be avoided as far as possible.

#### 4.6.3.2 Test A – Between terminations

##### 4.6.3.2.1 Test points

The test voltage is applied to 1a, 2a, 3a of Table 3 in accordance with the requirements of the relevant specification.

##### 4.6.3.2.2 Procedure

With the switch in position 2, connect the two terminals in Figure 3 to a variable d.c. supply of sufficient power adjusted to the required test voltage.

Connect the capacitor to be tested ( $C_X$ ) to the test circuit as indicated in Figure 3.

Move the switch to position 1 so as to charge capacitors  $C_1$  and  $C_X$  via  $R_1$ .

The switch remains in this position for the time specified after the test voltage has been reached.

Discharge the capacitors  $C_1$  and  $C_X$  through  $R_2$  by moving the switch to position 2. As soon as the voltmeter reading has fallen to zero, short-circuit the capacitors by moving the switch to position 3 and disconnect the capacitor  $C_X$ .

#### 4.6.3.3 Test B – Internal insulation

##### 4.6.3.3.1 Test points

The test voltage is applied to 1b, 2b, 2c, 3b, 3c of Table 3 in accordance with the requirements of the relevant specification.

##### 4.6.3.3.2 Procedure

The specified test voltage is applied instantaneously via the internal resistance of the power supply for the time specified in the relevant specification. For point 2c use the test circuit and the procedure indicated for the test between terminations (4.6.2 and 4.6.3.2).

#### 4.6.3.4 Test C – External insulation (applicable only to insulated capacitors in a non-metallic case or in an insulated metal case)

##### 4.6.3.4.1 Test points

The test voltage is applied to 1c, 2d or 3d, using one of the three following methods for the application of the voltage in accordance with the requirements of the relevant specification.

##### 4.6.3.4.2 Foil method

A metal foil shall be closely wrapped around the body of the capacitor.

For capacitors with axial terminations this foil shall extend beyond each end by not less than 5 mm, provided that a minimum distance of 1 mm/kV can be maintained between the foil and the terminations. If this minimum cannot be maintained, the extension of the foil shall be reduced by as much as is necessary to establish the distance of 1 mm/kV of test voltage.

For capacitors with unidirectional terminations, a minimum distance of 1 mm/kV shall be maintained between the edge of the foil and each termination.

In no case shall the distance between the foil and the terminations be less than 1 mm.

#### 4.6.3.4.3 Method for capacitors with mounting devices

The capacitor shall be mounted in its normal manner on a metal plate which extends by not less than 12,7 mm in all directions beyond the mounting face of the capacitor.

#### 4.6.3.4.4 V-block method

The capacitor shall be clamped in the trough of a 90° metallic V-block of such a size that the capacitor body does not extend beyond the extremities of the block.

The clamping force shall be such as to guarantee adequate contact between the capacitor and the block.

The capacitor shall be positioned as follows:

- a) for cylindrical capacitors: the capacitor shall be positioned in the block so that the termination furthest from the axis of the capacitor is nearest to one of the faces of the block;
- b) for rectangular capacitors: the capacitor shall be positioned in the block so that the termination nearest the edge of the capacitor is nearest to one of the faces of the block.

For cylindrical and rectangular capacitors having axial terminations any out-of-centre positioning of the termination at its emergence from the capacitor body shall be ignored.

#### 4.6.3.4.5 Procedure

The specified test voltage is applied instantaneously through the internal resistance of the power source for the time specified in the relevant specification.

#### 4.6.4 Requirements

For each of the specified test points there shall be no sign of breakdown or flashover during the test period.

#### 4.6.5 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- a) the test points (see Table 3) and the test voltage corresponding to each of these points;
- b) for the external insulation test (test C), the method of applying the test voltage (one of the methods described in 4.6.3.4);
- c) the time for which the voltage is applied;
- d) the maximum charging and discharging currents;
- e) when applicable, the maximum value of the time constant for charging ( $R_1 \times (C_1 + C_X)$ ).

#### 4.7 Capacitance

##### 4.7.1 Measuring frequency and measuring voltage

The capacitance shall be measured at one of the following frequencies, unless otherwise prescribed in the relevant specification:

– electrolytic capacitors:		100 Hz to 120 Hz
– other capacitors:	$C_N \leq 1 \text{ nF}$ :	100 kHz, 1 MHz or 10 MHz (1 MHz shall be reference)
	$1 \text{ nF} < C_N \leq 10 \text{ }\mu\text{F}$ :	1 kHz or 10 kHz (1 kHz shall be reference)
	$C_N > 10 \text{ }\mu\text{F}$ :	50 Hz (60 Hz) or 100 Hz (120 Hz)

The tolerance on all frequencies for measuring purposes shall not exceed  $\pm 20\%$ .

The measuring voltage shall not exceed 3 % of  $U_R$  or 5 V, whichever is the smaller, unless otherwise prescribed in the relevant specification.

#### 4.7.2 Measuring equipment

The accuracy of the measuring equipment shall be such that the error does not exceed:

- a) for absolute capacitance measurements: 10 % of the capacitance tolerance or 2 % absolute, whichever is the smaller;
- b) for measurement of variation of capacitance: 10 % of the specified maximum change of capacitance.

In neither case a) nor case b) need the accuracy be better than the minimum absolute measurement error (for example 0,5 pF) prescribed in the relevant specification.

#### 4.7.3 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- a) the measurement temperature if other than the standard atmospheric conditions for testing;
- b) the frequencies for measurement and the capacitance range over which they apply, if different from those specified in 4.7.1;
- c) the absolute measurement error, when applicable (for example 0,5 pF);
- d) measuring voltage if different from the one specified in 4.7.1;
- e) the applied polarizing voltage, when applicable.

### 4.8 Tangent of loss angle and equivalent series resistance (ESR)

#### 4.8.1 Tangent of loss angle

##### 4.8.1.1 Measuring frequency

The tangent of loss angle shall be measured under the same conditions as those given for the measurement of capacitance at one or more frequencies taken from the list in 4.7.1, as prescribed in the relevant specification.

##### 4.8.1.2 Measuring accuracy

Unless otherwise specified in the sectional specification, the measuring method shall be such that the error does not exceed 10 % of the specified value or 0,000 3, whichever is the greater.

#### 4.8.2 Equivalent series resistance (ESR)

##### 4.8.2.1 Measuring frequency

The ESR shall be measured at one of the following frequencies, unless otherwise prescribed in the relevant specification:

50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz and 10 MHz.

##### 4.8.2.2 Measuring accuracy

The accuracy of the measuring equipment shall be such that the error does not exceed 10 % of the requirement, unless otherwise specified in the relevant specification.

#### 4.8.2.3 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe

- a) the frequency of measurement;
- b) the absolute error measurement;
- c) the measuring voltage, if different from that specified in 4.7.1;
- d) the applied polarizing voltage, where applicable;
- e) the temperature at which measurements shall be made, if other than the standard atmospheric conditions for testing.

### 4.9 Leakage current

#### 4.9.1 Preconditioning

Before this measurement is made, the capacitors shall be fully discharged.

#### 4.9.2 Test method

The leakage current shall be measured, unless otherwise prescribed in the relevant specification, using the direct voltage ( $U_R$  or  $U_C$ ) appropriate to the test temperature, after a maximum electrification period of 5 min. The full 5 min electrification need not be applied if the specified leakage current limit is reached in a shorter time.

#### 4.9.3 Power source

For the object of test, a steady source of power such as a regulated power supply shall be used.

#### 4.9.4 Measuring accuracy

The measurement error shall not exceed  $\pm 5\%$  or  $0,1\ \mu\text{A}$ , whichever is the greater.

#### 4.9.5 Test circuit

When prescribed in the relevant specification, a  $1\ 000\ \Omega$  protective resistor shall be placed in series with the capacitor to limit the charging current.

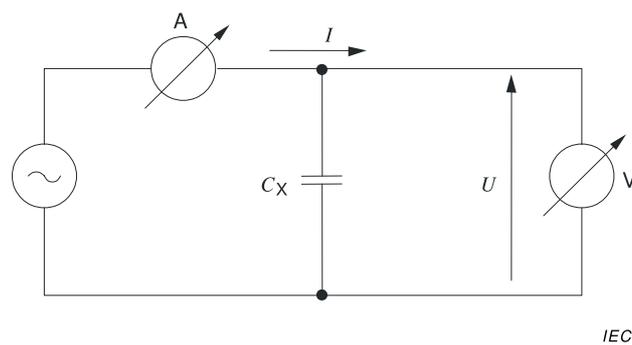
#### 4.9.6 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- a) the leakage current limit at a reference temperature of  $20\ ^\circ\text{C}$ , and at other specified temperatures;
- b) when necessary, the correction factor, if the measurements are made at a temperature other than  $20\ ^\circ\text{C}$ , but within the range of temperatures covered by the standard atmospheric conditions for testing;
- c) the electrification time, if different from 5 min;
- d) whether or not a  $1\ 000\ \Omega$  protective resistor shall be placed in series with the capacitor to limit the charging current as defined in 4.9.5.

### 4.10 Impedance

Impedance shall be measured by the voltmeter-ammeter method according to the circuit of Figure 4, or equivalent.



Key

$C_X$	capacitance of specimen
$U$	measuring voltage
$I$	measuring current
A	ammeter
V	voltmeter

Figure 4 – Schematic diagram of the impedance measuring circuit

The impedance  $Z_X$  of the capacitor  $C_X$  is given by  $Z_X = \frac{U}{I}$ .

The frequency of the measuring voltage shall, preferably, be chosen from the following values:

50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz and 10 MHz.

The accuracy of the measuring equipment shall be such that the error does not exceed 10 % of the requirement, unless otherwise specified in the relevant specification.

At frequencies above 120 Hz, precautions are necessary to avoid errors arising from stray currents. The current flowing through the capacitor should be limited so that the measuring result is not significantly affected by the rise of the temperature of the capacitor.

The relevant specification shall prescribe:

- the frequency of measurement;
- the temperature(s) at which measurements shall be made;
- the limits of impedance, or ratio of impedances measured at different temperatures.

#### 4.11 Self-resonant frequency and inductance

##### 4.11.1 Self-resonant frequency ( $f_r$ )

###### 4.11.1.1 General

For this measurement three methods are described. The first method is for general application; the other methods may be particularly suitable for measuring certain types of capacitors having low capacitance.

The accuracy of the measuring equipment shall be such that the error does not exceed 10 % of the requirement, unless otherwise specified in the relevant specification.

###### 4.11.1.2 Method 1

Using the impedance measuring method of 4.10 and a variable frequency source, the lowest frequency shall be determined at which the impedance passes through a minimum. This is the self-resonant frequency.

When it is difficult to determine precisely the frequency at which the impedance is at a minimum, then use may be made of a phase-meter to compare the phase of the voltage across the capacitor with the phase of the voltage across a low-inductance resistor connected in series with the capacitor. The resonant frequency is then the frequency when there is no phase difference. A Q-meter may be used for this purpose.

#### 4.11.1.3 Method 2

##### 4.11.1.3.1 General

For this measuring method, use shall be made of an absorption oscillator-wavemeter (grid dip meter).

##### 4.11.1.3.2 Mounting of capacitors with terminations for general use

Four capacitors of nearly equal value and configuration shall be soldered in series at right angles to form a closed loop. The wires shall be of the specified length and no additional wiring or connections shall be employed (see Figure 5). This loop shall be coupled as loosely as possible to an absorption oscillator-wavemeter and the resonant frequency shall then be determined.

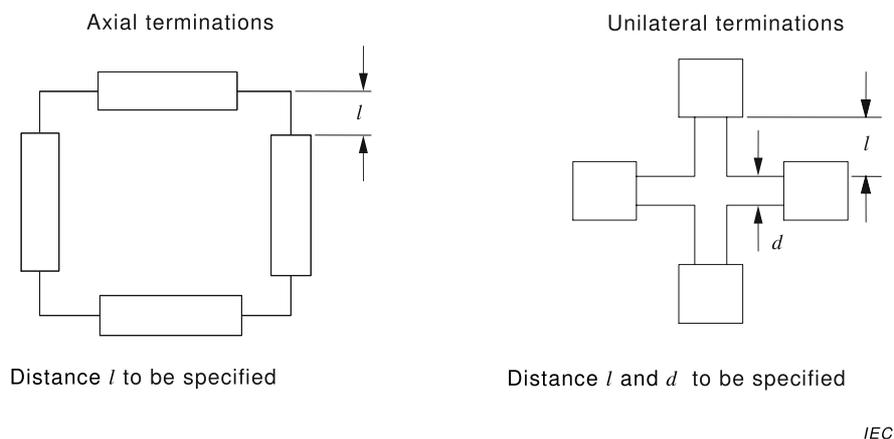


Figure 5 – Capacitor mounting arrangement

##### 4.11.1.3.3 Mounting of capacitors with terminations for printed circuit use

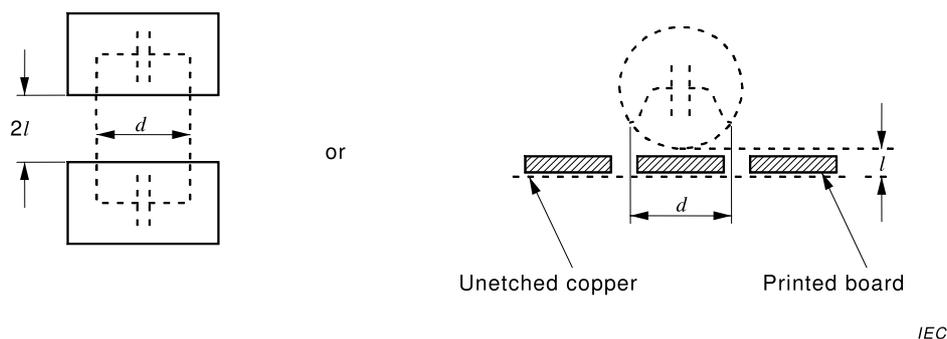
To determine the resonant frequency under the conditions of the capacitor being mounted on a printed circuit board and where the configuration of the case and/or the terminations does not permit a four capacitor loop to be formed correctly, the loop shall be formed by two (nearly) identical capacitors with straight terminations of specified length (see Figure 6).

The second capacitor may be substituted by its mirror image on a conductive plane in the following way.

A copper-clad, unetched sheet of printed circuit base material, whose edges are at least three times as long as the maximum dimension of the capacitor is drilled in its centre to accommodate the capacitor in its normal way.

The relevant specification shall prescribe the details of mounting. The capacitor is soldered in place with the capacitor being short-circuited by the copper laminate. Then the capacitor is coupled to the search coil and measured as in 4.11.1.3.5.

Metal-cased capacitors may necessitate special arrangements for coupling, which should be prescribed in the relevant specification.



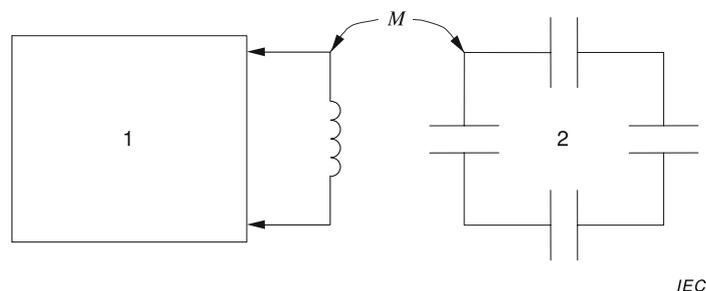
Distances  $l$  and  $d$  to be specified, where  $l$  is to be measured from the seating plane.

Figure 6 – Capacitor mounting arrangement

#### 4.11.1.3.4 Description of the method

The absorption oscillator-wavemeter is a variable frequency L-C oscillator with the inductor formed as an external search coil. When the search coil is coupled into another resonant circuit, power is absorbed causing a change in the mean grid (gate on FETs (field effect transistor)) voltage. This is monitored and hence "dips" at the resonant frequency of the coupled circuit. This coupled circuit consists of four capacitors mounted as described in 4.11.1.3.2 and connected in series to minimize the mutual inductance.

A typical diagram showing the use of an absorption oscillator-wavemeter is given in Figure 7.



#### Key

- 1 absorption oscillator-wavemeter (grid-dip meter)
- 2 coupled resonant circuit
- $M$  coupling factor

Figure 7 – Typical diagram of an absorption oscillator-wavemeter

#### 4.11.1.3.5 Use of the absorption oscillator-wavemeter

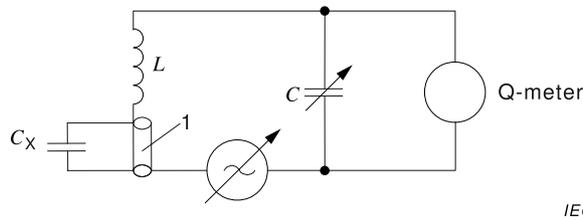
With the search coil of the wavemeter close to the capacitors under investigation, the resonant frequency is approached from a lower frequency. Dips should be checked by moving the wavemeter away from the capacitors (reducing the absorbed power) to make sure the dip is not due to internal effects of the wavemeter. The resonant frequency should be measured with as loose a coupling as is practical to avoid pulling the oscillator.

#### 4.11.1.3.6 Requirements

The resonant frequency shall not exceed the limits prescribed in the relevant specification.

4.11.1.4 Method 3

This method is particularly suitable for capacitors of low capacitance and with a self-resonant frequency within Q-meter operating range. Using a Q-meter and the circuit shown in Figure 8, the lowest frequency shall be determined at which the same resonant frequency is obtained, whether the capacitor shorting strap is in place or not. This frequency can be shown to be equal to the self-resonant frequency of the capacitor.



Key

- 1        shorting strap
- $C_X$     capacitor under test
- $C$        variable capacitor
- $L$        inductor
- $Q$        Q-meter

Figure 8 – Schematic diagram of the measuring circuit

4.11.2 Inductance

The series inductance  $L_X$  of a capacitor is calculated from the measured self-resonant frequency  $f_r$  of the capacitor using the formula given below:

$$L_X = \frac{1}{4\pi^2 \times f_r^2 \times C_X}$$

where  $C_X$  is the capacitance of the capacitor measured in accordance with 4.7 and the requirements of the relevant sectional specification.

4.11.3 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- a) which test method is preferred;
- b) the lead length of the capacitor to be employed in the measurement;
- c) any special mounting arrangement;
- d) the limits of series inductance or self-resonant frequency.

4.12 Outer foil termination

The correct indication of the termination which is connected to the outside metal foil shall be checked in such a way that the capacitor is not damaged.

A suitable method is given in Figure 9.

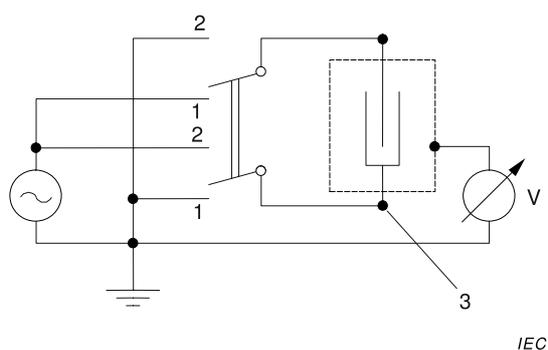
The frequency of the generator may be from 50 Hz to a few thousand Hertz and shall be so chosen as to give a clear result of measurement, the most appropriate value being dependent on the type of capacitor under test.

The voltage shall be of the order of 10 V.

The voltmeter shall have an input impedance of not less than 1 M $\Omega$ .

The stray capacitance of the wiring shall be kept low.

With the switch in position 1, the deflection of the voltmeter shall be markedly less than with the switch in position 2.



#### Key

- 1, 2     switching terminations
- 3        outer foil terminations
- V        voltmeter

Figure 9 – Test circuit

### 4.13 Robustness of terminations

#### 4.13.1 General

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-21, Tests  $U_{a1}$ ,  $U_b$ ,  $U_c$ , and  $U_d$ , as applicable.

#### 4.13.2 Test $U_{a1}$ – Tensile

The force applied shall be:

- for terminations other than wire terminations: 20 N;
- for wire terminations: see Table 4.

Table 4 – Tensile force

Nominal cross-sectional area ( <i>S</i> ) <sup>a</sup> mm <sup>2</sup>	Corresponding diameter ( <i>d</i> ) for circular-section wires mm	Force with tolerance of ± 10 % N
$S \leq 0,05$	$d \leq 0,25$	1
$0,05 < S \leq 0,1$	$0,25 < d \leq 0,35$	2,5
$0,1 < S \leq 0,2$	$0,35 < d \leq 0,5$	5
$0,2 < S \leq 0,5$	$0,5 < d \leq 0,8$	10
$0,5 < S \leq 1,2$	$0,8 < d \leq 1,25$	20
$1,2 < S$	$1,25 < d$	40

<sup>a</sup> For circular-section wires, strips or pins: the nominal cross-sectional area is equal to the value calculated from the nominal dimension(s) given in the relevant specification. For stranded wires, the nominal cross-sectional area is obtained by taking the sum of the cross-sectional areas of the individual strands of the conductor specified in the relevant specification.

4.13.3 Test Ub – Bending (half of the sample)

Method 1: Two consecutive bends shall be applied in each direction. This test shall not apply if, in the detail specification, the terminations are described as rigid.

4.13.4 Test Uc – Torsion (remaining sample)

Method 1, severity 2 (two successive rotations of 180°) shall be used.

This test shall not apply if in the detail specification the terminations are described as rigid and to components with unidirectional terminations designed for printed wiring applications.

4.13.5 Test Ud – Torque

This test shall apply to capacitors for terminations with threaded studs or screws and for integral mounting devices. Torque and severity shall be selected from Table 5.

Table 5 – Torque

Severity	Torque Nm								
	Nominal thread diameter mm								
	2,6	3	3,5	4	5	6	8	10	12
1	0,4	0,5	0,8	1,2	2,0	2,5	5	7	12
2	0,2	0,25	0,4	0,6	1,0	1,25	2,5	3,5	6

4.13.6 Visual examination

After each of these tests, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

#### 4.14 Resistance to soldering heat

##### 4.14.1 Preconditioning and initial measurement

When prescribed in the relevant specification, the capacitors shall be dried using the method of 4.3.

The capacitors shall be measured as prescribed in the relevant specification.

##### 4.14.2 Test procedure

Unless otherwise stated in the relevant specification, one of the following tests as set out in the same specification shall be applied.

The test conditions shall be defined in the relevant specification.

- a) For all capacitors except those of item b) and c) below:  
IEC 60068-2-20, Test Tb, method 1 (solder bath).
- b) For capacitors not designed for use in printed boards, but with connections intended for soldering as indicated by the detail specification:
  - 1) IEC 60068-2-20, Test Tb, method 1 (solder bath),
  - 2) IEC 60068-2-20, Test Tb, method 2 (soldering iron).
- c) For surface mount capacitors  
IEC 60068-2-58, reflow or solder bath method.

##### 4.14.3 Recovery

The period of recovery shall, unless otherwise specified in the detail specification, be not less than 1 h nor more than 2 h, except for surface mount capacitors, for which the period of recovery shall be  $24 \text{ h} \pm 2 \text{ h}$ .

##### 4.14.4 Final inspection, measurement and requirements

For all capacitors, except surface mount capacitors, the following shall apply:

- when the test has been carried out the capacitors shall be visually examined;
- there shall be no visible damage and the marking shall be legible;
- the capacitors shall then be measured as prescribed in the relevant specification.

Surface mount capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements as prescribed in the relevant specification.

#### 4.15 Solderability

##### 4.15.1 General

This test shall not be applied to those terminations which the detail specification describes as not designed for soldering.

##### 4.15.2 Preconditioning

The relevant specification shall prescribe whether ageing is to be applied. If accelerated ageing is required, one of the ageing procedures given in IEC 60068-2-20 shall be applied.

Unless otherwise stated in the relevant specification, the test shall be carried out with non-activated flux.

#### 4.15.3 Test procedure

Unless otherwise stated in the relevant specification, one of the following tests as set out in the same specification shall be applied.

The test conditions shall be defined in the relevant specification.

a) For all capacitors except those of item b) and c) below:

1) IEC 60068-2-20, Test Ta, method 1 (solder bath)

Depth of immersion (from the seating plane or component body):

2,0 mm  $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$  mm, using a thermal insulating screen of 1,5 mm  $\pm$  0,5 mm thickness;

2) IEC 60068-2-20, Test Ta, method 2 (soldering iron)

3) IEC 60068-2-54, solder bath wetting balance method.

NOTE IEC 60068-2-54 is applicable only when prescribed in the detail specification or when agreed upon between manufacturer and customer.

b) For capacitors not designed for use in printed boards, but with connections intended for soldering as indicated by the detail specification:

1) IEC 60068-2-20, Test Ta, method 1 (solder bath)

Depth of immersion (from the seating plane or component body): 3,5 mm  $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$  mm.

2) IEC 60068-2-20, Test Ta, method 2 (soldering iron).

c) For surface mount capacitors

1) IEC 60068-2-58, reflow or solder bath method

2) IEC 60068-2-69, solder bath wetting balance or solder globule wetting balance method.

NOTE IEC 60068-2-69 is applicable only when prescribed in the detail specification or when agreed upon between manufacturer and customer.

#### 4.15.4 Final inspection, measurements and requirements

The terminations shall be examined for good tinning as evidenced by free flowing of the solder with wetting of the terminations.

The capacitors shall meet the requirements as prescribed in the relevant specification.

#### 4.16 Rapid change of temperature

##### 4.16.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

##### 4.16.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-14, Test Na, using the degree of severity as prescribed in the relevant specification.

##### 4.16.3 Final inspection, measurements and requirements

After recovery, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made.

#### 4.17 Vibration

##### 4.17.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

#### 4.17.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-6, Test Fc, using the mounting method and the degree of severity prescribed in the relevant specification.

#### 4.17.3 Electrical test (intermediate measurement)

When specified in the detail specification, during the last 30 min of the vibration test an electrical measurement shall be made in each direction of movement to check intermittent contacts, or open or short circuits.

The method of measurement shall be prescribed in the detail specification.

The duration of the measurement shall be the time needed for one sweep of the frequency range from one frequency extreme to the other.

#### 4.17.4 Final inspection, measurements and requirements

After the test the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage. When capacitors are tested as specified in 4.17.3, the requirements shall be stated in the detail specification.

The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made.

### 4.18 Bump (repetitive shock)

#### 4.18.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

#### 4.18.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-27, Test Ea (repetitive shock), using the mounting method and the severity prescribed in the relevant specification.

Preferred conditions are:

- pulse shape: half-sine;
- number of shocks in each direction: a minimum of 100;
- peak acceleration: to be chosen from recommended severities.

#### 4.18.3 Final inspection, measurements and requirements

After the test, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made.

### 4.19 Shock

#### 4.19.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

#### 4.19.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-27, Test Ea (non-repetitive shock), using the mounting method and the severity prescribed in the relevant specification.

#### 4.19.3 Final inspection, measurements and requirements

After the test the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made.

#### 4.20 Container sealing

The capacitors shall be subjected to the procedure of the appropriate method of IEC 60068-2-17, Test Q, as prescribed in the relevant specification.

#### 4.21 Climatic sequence

##### 4.21.1 General

In the climatic sequence, an interval of a maximum of three days is permitted between any of the tests, except that the cold test shall be applied immediately after the recovery period for the first cycle of the damp heat, cyclic, IEC 60068-2-30, Test Db.

##### 4.21.2 Initial measurements

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

##### 4.21.3 Dry heat

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-2, Test Bb, for 16 h, using the degree of severity of the upper category temperature, as prescribed in the detail specification.

The test specimens may be introduced into the chamber at any temperature from laboratory temperature to the upper category temperature.

While still at the specified high temperature and at the end of the period of high temperature, the measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

After the specified conditioning, the capacitors shall be removed from the chamber and exposed to standard atmospheric conditions for testing for not less than 4 h.

##### 4.21.4 Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-30, Test Db, for one cycle of 24 h, using a temperature of 55 °C (severity b).

Unless otherwise specified in the relevant specification, variant 2 shall be used.

After recovery the capacitors shall be subjected immediately to the cold test.

##### 4.21.5 Cold

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-1, Test Ab, for 2 h, using the degree of severity of the lower category temperature, as prescribed in the relevant specification.

The test specimens may be introduced into the chamber at any temperature from laboratory temperature to the lower category temperature.

While still at specified low temperature and at the end of the period of low temperature, the measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

After the specified conditioning, the capacitors shall be removed from the chamber and exposed to standard atmospheric conditions for testing for not less than 4 h.

#### 4.21.6 Low air pressure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-13, Test M, using the appropriate degree of severity prescribed in the relevant specification. The duration of the test shall be 10 min, unless otherwise stated in the relevant specification.

The relevant specification shall prescribe:

- a) duration of test; if other than 10 min;
- b) temperature;
- c) degree of severity.

While at the specified low pressure, the rated voltage shall be applied during the last 60 s of the test period, unless otherwise prescribed in the relevant specification.

During and after the test, there shall be no evidence of permanent breakdown, flashover, harmful deformation of the case, or seepage of impregnant.

#### 4.21.7 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-30, Test Db, for the following number of cycles of 24 h as indicated in Table 6, under the same conditions as used for the first cycle.

Table 6 – Number of cycles

Climatic categories	Number of cycles
-/-56	5
-/-21	1
-/-10	1
-/-04	None

#### 4.21.8 Final measurements

After the prescribed recovery, the measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

#### 4.22 Damp heat, steady state

##### 4.22.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

##### 4.22.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-78, Test Cab, using the degree of severity corresponding to the climatic category of the capacitor as indicated in the detail specification. The temperature and humidity of test shall be  $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ,  $(93 \pm 3) \%RH$ , unless otherwise specified in the relevant specification.

When specified in the blank detail specification, the detail specification may specify the application of a polarizing voltage during the whole period of damp heat conditioning. For metallized film capacitors this test should be carried out in accordance with Annex G.

With the exception of electrolytic capacitors, within 15 min after removal from the test chamber, the voltage proof test of 4.6 shall be carried out at test point A only, using the rated voltage, unless otherwise specified in the detail specification.

#### 4.22.3 Final inspection, measurements and requirements

After recovery, the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage. The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made.

In case of testing metallized film capacitors, when specified in the blank detail specification, the permissible deviation of the average C-value of test group with and the test group without d.c. voltage shall be described in the relevant detail specification.

### 4.23 Endurance

#### 4.23.1 Initial measurements

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

#### 4.23.2 Test procedure

The tests of IEC 60068-2-2 apply as follows:

- a) d.c. tests – Test Bb;
- b) a.c. tests – Test Bb or Bd as applicable;
- c) pulse tests – Test Bb or Bd as applicable.

The test specimens may be introduced into the chamber at any temperature, from laboratory temperature to the upper category temperature, but the voltage shall not be applied to the capacitor before it has reached the chamber temperature.

#### 4.23.3 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- a) duration of the test (for example, hours or number of pulses);
- b) test temperature (for example, room, rated or upper category temperature);
- c) voltage and/or current to be applied (see also 4.23.4).

When capacitors have to meet additional requirements for electric shock hazard protection, additional test conditions for endurance testing (for example, pulse voltage application) shall be prescribed in the relevant specification.

#### 4.23.4 Test voltage

Unless otherwise specified in the relevant specification, the voltage to be applied during the test shall be selected from the following.

##### a) d.c. tests

The test shall be carried out at a multiplying factor times the rated voltage (d.c.) at temperatures up to the rated temperature. The test temperature and the value of the multiplying factor shall be specified in the relevant specification. For tests at the upper category temperature the derating factor for the voltage shall also be given.

##### b) a.c. tests (sinusoidal voltage)

The test shall be made at 50 Hz to 60 Hz and at a multiplying factor times the rated voltage (a.c.) (see 2.3.4 a)) at temperatures up to the rated temperature, or at the upper category temperature with a derating factor for the voltage. The test temperature and the

value of the multiplying factor/derating factor for the voltage shall be specified in the relevant specification.

c) a.c. tests (sinusoidal current)

This test shall be made with a current applied in accordance with 2.3.4 b). The test temperature, the value of current and frequency shall be specified in the relevant specification.

To facilitate testing, the test may be made with a voltage of specified frequency applied to a group of capacitors in parallel or in series/parallel.

d) sinusoidal a.c. tests (reactive power)

This test shall be made with reactive power in accordance with 2.3.4 c). The test temperature, the value of the reactive power, and the frequency shall be specified in the relevant specification.

To facilitate testing, the test may be made with a voltage of specified frequency applied to a group of capacitors in parallel or in series/parallel.

A thermal stability test (see 4.30) may constitute an alternative to this test. The test to be carried out shall be specified in the detail specification.

e) pulse tests

This test shall be made with pulses applied in accordance with 2.3.5 and as specified in the relevant specification. Guidance for pulse tests is given in Annex E.

f) sinusoidal a.c. or pulse tests with superimposed d.c.

Tests b) to e) may be carried out with superimposed d.c. as required in the relevant specification (see also 2.2.23).

An example of a test circuit suitable for electrolytic capacitors is given in Figure 10.

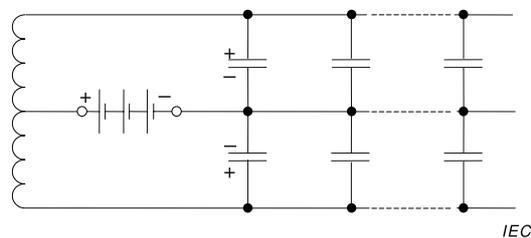


Figure 10 – Test circuit for electrolytic capacitors

#### 4.23.5 Placement in the test chamber

The capacitors shall be placed in the test chamber in such a manner that

- for heat dissipating capacitors, no capacitor is within 25 mm of any other capacitor,
- for non-heat dissipating capacitors, no capacitor is within 5 mm of any other capacitor.

#### 4.23.6 Recovery

After the specified period, the capacitors shall be allowed to cool to standard atmospheric conditions for testing and where specified in the relevant specification, the capacitors shall be subjected to recovery.

#### 4.23.7 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall then be visually examined.

The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made. A capacitor shall be considered to have failed when the requirements of the relevant specification during or at the end of the test are not satisfied.

## 4.24 Variation of capacitance with temperature

### 4.24.1 Static method

#### 4.24.1.1 Initial measurement

Measurements of capacitance shall be made under the conditions prescribed in the relevant specification.

#### 4.24.1.2 Test procedure

The capacitor shall be maintained at each of the following temperatures in turn:

- a)  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ;
- b) lower category temperature  $\pm 3\text{ °C}$ ;
- c) intermediate temperatures, if required in the detail specification;
- d)  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ;
- e) intermediate temperatures, if required in the detail specification;
- f) upper category temperature  $\pm 2\text{ °C}$ ;
- g)  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ .

If required for a particular type of capacitor, the relevant specification shall prescribe whether thermal shock is to be avoided or whether a maximum rate of change of temperature shall be specified.

The conditions of measurement, during or after temperature cycling, a description of the temperature cycle and the number of cycles, should be stated.

#### 4.24.1.3 Measuring method

Capacitance measurements shall be made at each of the temperatures specified above, after the capacitor has reached thermal stability.

The condition of thermal stability is judged as having been reached when two readings of capacitance taken at an interval of not less than 5 min do not differ by an amount greater than that which can be attributed to the measuring apparatus.

The measurement of the actual temperature shall be made with a precision compatible with the requirements of the detail specification.

Care shall be taken during measurements to avoid condensation or frost on the surface of the capacitors.

#### 4.24.1.4 Reduced procedure

For the lot-by-lot quality conformance testing, the detail specification may prescribe a reduced procedure, for example, measurements d), f) and g) in 4.24.1.2 covering the temperature range from  $20\text{ °C}$  to the upper category temperature.

### 4.24.2 Dynamic method

As an alternative to the static method of 4.24.1, a dynamic plotting method may be employed. The capacitors shall be subjected to a slowly varying temperature.

A temperature-sensing device shall be embedded in a dummy capacitor to be included with the capacitor under test in a manner that will ensure that the measured temperature is the

same as that occurring in the capacitor under test. The capacitance shall be measured using a self-balancing bridge or comparator.

The output of the bridge or comparator shall be coupled to the "Y" axis of a plotting table.

The output of the temperature sensing device shall be coupled to the "X" axis of a plotting table.

The temperature shall be varied slowly enough to produce a uniform curve with no loop at the lower or upper category temperature. The temperature shall be varied subsequently from 20 °C to the lower category temperature, then to the upper category temperature and back to 20 °C. Two cycles shall be carried out.

This method may be employed only when it can be demonstrated that the results are the same as for the method employing stabilized temperatures.

In case of dispute, the static method shall be used.

#### 4.24.3 Methods of calculation

##### 4.24.3.1 General

The following applies:

$C_0$  is the capacitance measured at point d) of 4.24.1.2;

$T_0$  is the temperature measured at point d) of 4.24.1.2;

$C_i$  is the capacitance measured at the test temperature, other than at points a), d) and g) of 4.24.1.2;

$T_i$  is the temperature measured on test.

##### 4.24.3.2 Temperature characteristics of capacitance

The variation of capacitance as a function of temperature shall be calculated for all the values of  $C_i$  as follows:

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{C_i - C_0}{C_0}$$

The variation of capacitance is normally expressed in per cent.

##### 4.24.3.3 Temperature coefficient of capacitance and temperature cyclic drift of capacitance

Temperature coefficient of capacitance and temperature cyclic drift of capacitance shall be calculated as follows:

###### a) Temperature coefficient of capacitance ( $\alpha$ )

Temperature coefficient of capacitance ( $\alpha$ ) shall be calculated for all the values of  $C_i$  as follows:

$$\alpha_i = \frac{C_i - C_0}{C_0(T_i - T_0)} \times 10^6$$

The temperature coefficient is normally expressed in parts per million per Kelvin ( $10^{-6}/K$ ).

###### b) Temperature cyclic drift of capacitance

The temperature cyclic drift of capacitance shall be calculated for the points of measurement of 4.24.1.2 a), d) and g) in the following manner:

$$\delta_{da} = \frac{C_0 - C_a}{C_0}$$

$$\delta_{gd} = \frac{C_g - C_0}{C_0}$$

$$\delta_{ga} = \frac{C_g - C_a}{C_0}$$

as required in the relevant specification. The largest of these values is the "temperature cyclic drift of capacitance".

The capacitance drift is normally expressed in per cent.

#### 4.25 Storage

##### 4.25.1 Storage at high temperature

###### 4.25.1.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

###### 4.25.1.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-2, Test Bb, using the following severities:

- temperature: upper category temperature;
- duration: 96 h ± 4 h.

The test specimens may be introduced into the chamber at any temperature from laboratory temperature to the upper category temperature.

###### 4.25.1.3 Final inspection, measurements and requirements

After recovery for at least 16 h, the measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

##### 4.25.2 Storage at low temperature

###### 4.25.2.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

###### 4.25.2.2 Test procedure

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-1, Test Ab. The capacitors shall be stored at –40 °C for either a period of 4 h after thermal stability has been reached, or for 16 h, whichever is the shorter period.

The test specimens may be introduced into the chamber at any temperature from laboratory temperature to –40 °C.

#### 4.25.2.3 Final inspection, measurements and requirements

After recovery for at least 16 h, the measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

#### 4.26 Surge

##### 4.26.1 Initial measurement

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

##### 4.26.2 Test procedure

Suitable test circuits are shown in Figure 11 and Figure 12.

NOTE The thyristor circuit has the advantage of high repetition rates and is free from troubles associated with dirty contacts and contact bounce.

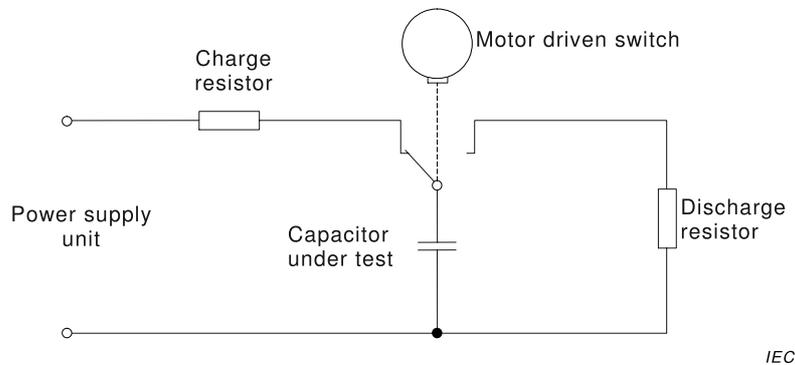


Figure 11 – Relay circuit

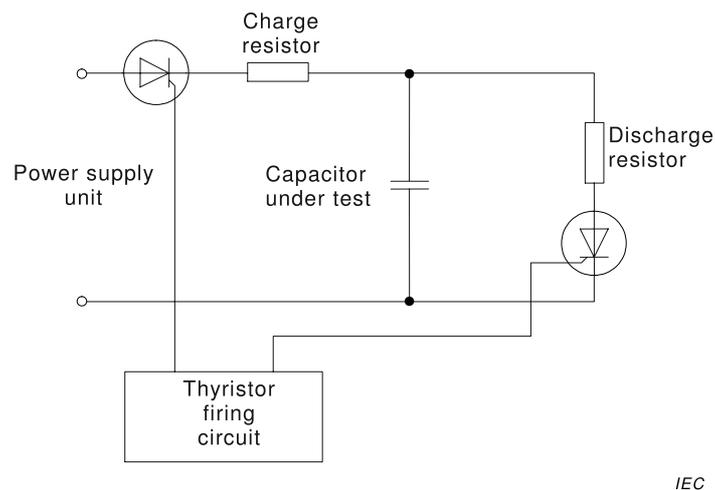


Figure 12 – Thyristor circuit

The voltage waveform across the capacitor under test shall be approximately as shown in Figure 13.

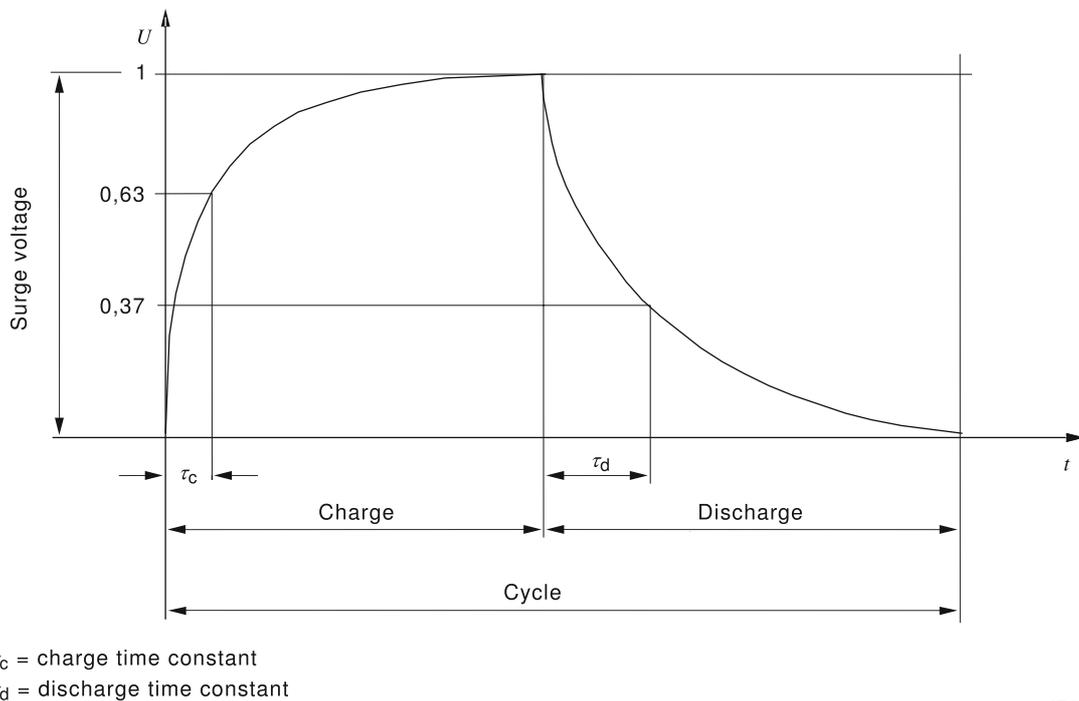


Figure 13 – Voltage waveform across capacitor

4.26.3 Final inspection, measurements and requirements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

4.26.4 Information to be given in the relevant detail specification

The following information shall be given in the relevant specification:

- a) the charge time constant arising from the internal resistance of the power supply and the resistance of the charge circuit and the capacitance of the capacitor under test;
- b) the discharge time constant arising from the resistance of the discharge circuit and the capacitance of the capacitor under test;
- c) the ratio of the surge voltage to rated or category voltage (as appropriate);  
 The number of times per hour that this voltage may be applied should be specified.
- d) the number of cycles of test;
- e) the duration of the charge period;
- f) the duration of the discharge period;
- g) the repetition rate (cycles per second);
- h) temperature, if different from standard atmospheric conditions for testing.

4.27 Charge and discharge tests and inrush current test

4.27.1 Initial measurement

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

4.27.2 Test procedure

Suitable test circuits are given in 4.26.2, Figure 11 and Figure 12.

The voltage and current waveforms across and through the capacitor under test are approximately as shown in Figure 14.

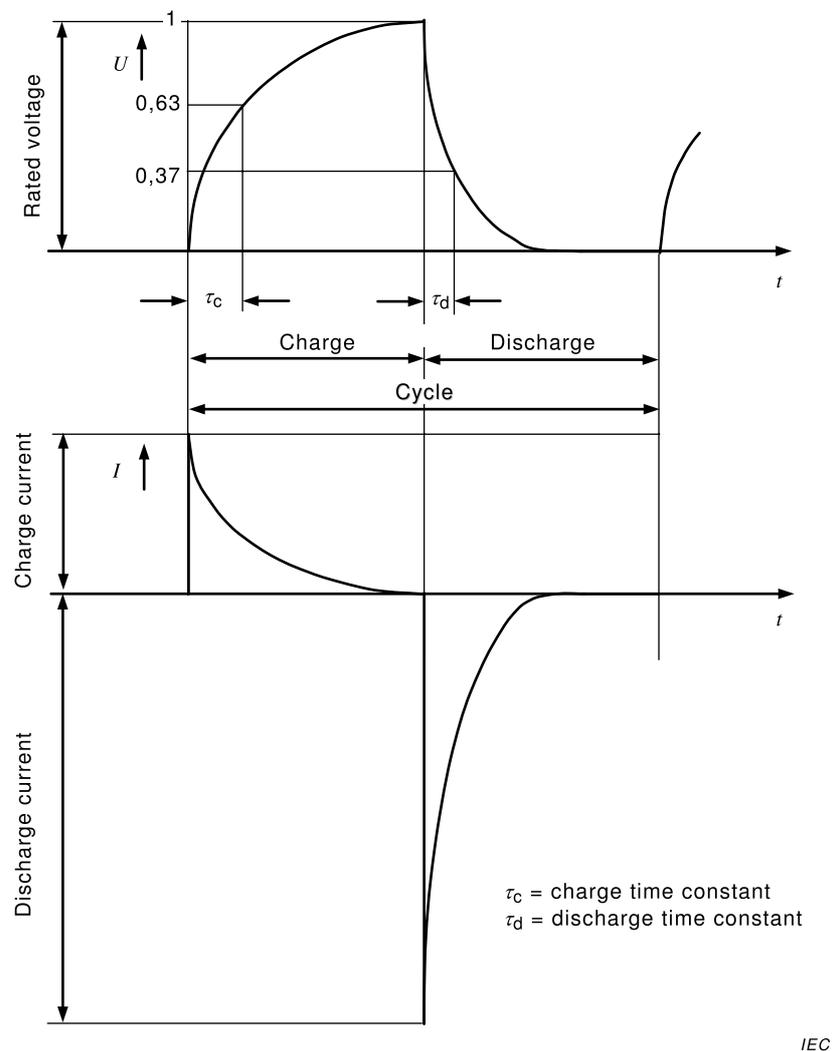


Figure 14 – Voltage and current waveform

#### 4.27.3 Charge and discharge

The following information shall be given in the relevant specification:

- the charge time constant arising from the internal resistance of power supply and the resistance of the charge circuit and the capacitance of the capacitor under test;
- the discharge time constant arising from the resistance of the discharge circuit and the capacitance of the capacitor under test;
- the voltage to be applied during the charge period, if different from the rated voltage;
- the number of cycles of test;
- the duration of the charge period;
- the duration of the discharge period;
- the repetition rate (cycles per second);
- temperature, if different from standard atmospheric conditions for testing.

#### 4.27.4 Inrush current

The following information shall be given in the relevant specification:

- a) the peak charge current;
- b) the voltage to be applied during the charge period if different from the rated voltage;
- c) the number of cycles of test;
- d) the duration of the charge period in milliseconds;
- e) the duration of the discharge period;
- f) the repetition rate;
- g) the temperature if different from standard atmospheric conditions for testing.

#### 4.27.5 Final inspection, measurements and requirements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

### 4.28 Pressure relief (for aluminium electrolytic capacitors)

#### 4.28.1 General

Unless otherwise specified in the relevant specification, one of the following tests shall be used to test the pressure relief device of the capacitors.

#### 4.28.2 AC test

Applied voltage: alternating voltage with r.m.s. value not exceeding 0,7 times the rated direct voltage.

Frequency of the applied voltage: 50 Hz or 60 Hz.

Series resistor:  $R = 0,5$  times the impedance of the capacitor at the test frequency.

#### 4.28.3 DC test

Applied voltage: direct voltage applied in the reverse direction, of an amplitude necessary to produce a current of 1 A to 10 A.

#### 4.28.4 Pneumatic test

Applied pneumatic pressure: gas pressure introduced from outside shall be increased at a rate of 20 kPa/s continuously.

#### 4.28.5 Final inspection, measurements and requirements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

### 4.29 Characteristics at high and low temperature

#### 4.29.1 Test procedure

The capacitors shall be subjected to the procedures of the dry heat and cold test (4.21.3 and 4.21.5, respectively) with the following details.

The degree of severity for these tests shall be the same as for the dry heat and cold tests. Tests at intermediate temperatures may be prescribed in the relevant specification.

Measurements shall be made at each of the specified temperatures after the capacitor has reached thermal stability.

The condition of thermal stability is judged to be reached when two readings of a characteristic, taken in an interval of not less than 5 min, do not differ by an amount greater than that which can be attributed to the measuring apparatus.

#### 4.29.2 Requirements

The capacitors shall not exceed the limits prescribed in the relevant specification.

#### 4.30 Thermal stability test

A thermal stability test may constitute an alternative to the endurance test in accordance with 4.23.4 d). The test to be carried out shall be specified in the detail specification.

The capacitor shall be loaded with a specified factor times the rated reactive power dissipation at the rated temperature and duration as specified in the relevant specification.

A test for thermal stability shall be made by measuring the temperature rise as a function of time over the last part of the specified duration. The temperature rise shall be within specified limits.

The measurement of the temperature rise may be made by the use of a thermocouple, thermistor, infrared thermometer, infrared photography, etc. Care should be taken to ensure that the error of measurement does not exceed  $\pm 1$  °C and that errors due to heat conduction along measuring connections are kept to a minimum.

The relevant specification shall specify the point at which the measurements shall be made and the method of mounting (see IEC 60068-2-2:2007, 6.4).

#### 4.31 Component solvent resistance

##### 4.31.1 Initial measurements

The measurements prescribed in the relevant specification shall be made.

##### 4.31.2 Test procedure

The components shall be subjected to IEC 60068-2-45, Test XA, with the following details:

- a) solvent to be used: IPA (IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993, 3.1.2);
- b) solvent temperature:  $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ , unless otherwise specified in the detail specification;
- c) conditioning: method 2, (without rubbing);
- d) recovery time: 48 h, unless otherwise stated in the detail specification.

##### 4.31.3 Final inspection, measurements and requirements

The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made and the specified requirements be met.

#### 4.32 Solvent resistance of marking

##### 4.32.1 Test procedure

The components shall be subjected to IEC 60068-2-45, Test XA, with the following details:

- a) solvent to be used: IPA (IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993, 3.1.2);

- b) solvent temperature: 23 °C ± 5 °C;
- c) conditioning: method 1 (with rubbing);
- d) rubbing material: cotton wool;
- e) recovery time: not applicable, unless otherwise stated in the detail specification.

#### 4.32.2 Final inspection, measurements and requirements

After the test the marking shall be legible.

### 4.33 Mounting (for surface mount capacitors only)

#### 4.33.1 Substrate

Surface mount capacitors shall be mounted on a suitable substrate, the method of mounting being dependent on the capacitor construction. The substrate material shall normally be an epoxide woven glass fabric laminated printed board (as defined in IEC 61249-2-7) with a thickness of 1,6 mm ± 0,20 mm or 0,8 mm ± 0,10 mm, or a 90 % to 98 % alumina substrate having a thickness of 0,635 mm ± 0,05 mm or more, and shall not affect the result of any test or measurement. The detail specification shall indicate which material is to be used for the electrical measurements.

The substrate shall have metallized land areas of proper spacing to permit mounting of surface mount capacitors and shall provide electrical connection to the surface mount capacitor terminals. The details shall be specified in the detail specification.

Examples of test substrates for mechanical and electrical tests are shown in Figure 15 and Figure 16, respectively.

If another method of mounting applies, the method should be clearly described in the detail specification.

#### 4.33.2 Wave soldering

When the detail specification specifies wave soldering, suitable glue, details of which may be specified in the detail specification, shall be used to fasten the component to the substrate before soldering is performed.

Small dots of the glue shall be applied between the conductors of the substrate by means of a suitable device securing repeatable results.

The surface mount capacitors shall be placed on the dots using tweezers. To ensure that no glue is applied to the conductors, the surface mount capacitors shall not be moved about.

The substrate with the surface mount capacitors shall be heat-treated in an oven at 100 °C for 15 min.

The substrate shall be soldered in a wave soldering apparatus. The apparatus shall be adjusted to have a pre-heating temperature of 80 °C to 100 °C, a solder bath at 260 °C ± 5 °C and a soldering time of 5 s ± 0,5 s.

The substrate shall be cleaned for 3 min in a suitable solvent (see IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993, 3.1.2).

#### 4.33.3 Reflow soldering

When the detail specification specifies reflow soldering, the following mounting procedure applies.

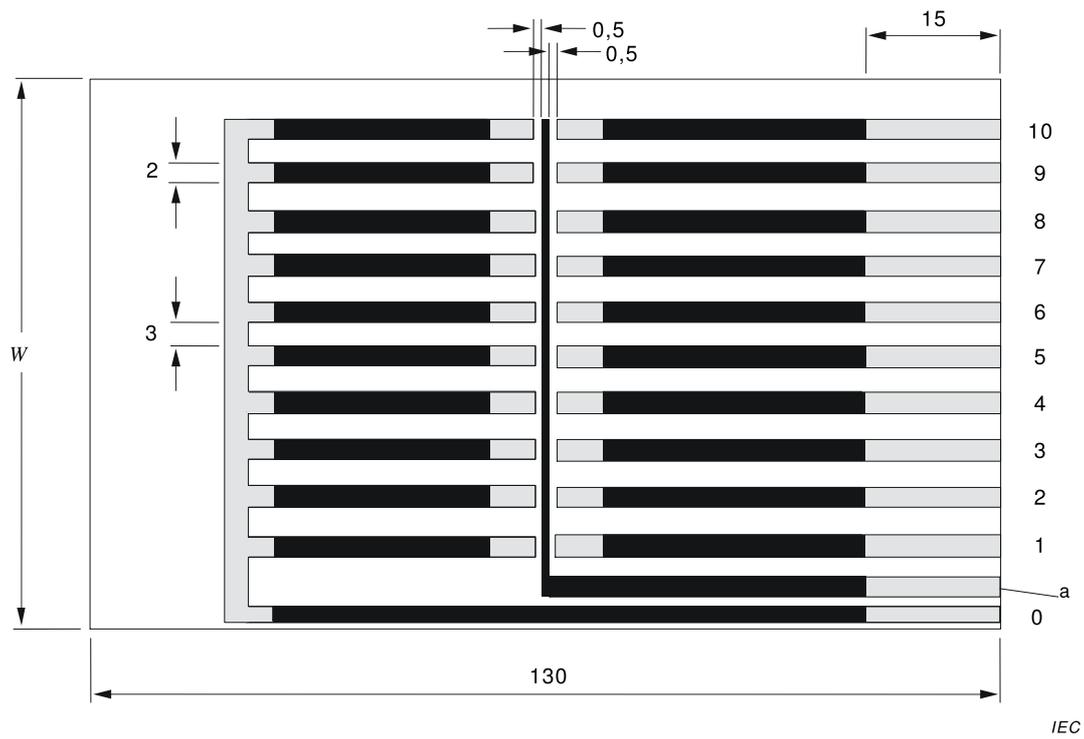
- a) The solder used in preform or paste form shall be silver bearing (2 % minimum) eutectic Sn/Pb solder together with a flux as stated in IEC 60068-2-20. Alternative solders such as 60/40 or 63/37 may be used on chips whose construction includes solder leach barriers. Pb-free solder used in preform or paste form shall be Sn96,5Ag3,0Cu0,5 or derivative solder together with a flux as stated in IEC 60068-2-58, or as defined in the relevant specification.
- b) The surface mount capacitor shall then be placed across the metallized land areas of the test substrate so as to make contact between surface mount and substrate land areas.
- c) The substrate shall then be placed in or on a suitable heating system (molten solder, hot plate, tunnel oven, etc.). The temperature of the unit shall be maintained between 215 °C and 260 °C, until the solder melts and reflows forming a homogeneous solder bond, but for not longer than 10 s.

Flux should be removed by a suitable solvent (see IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993, 3.1.2). All subsequent handling should be such as to avoid contamination. Care should be taken to maintain cleanliness in test chambers and during post test measurements.

The detail specification may require a more restricted temperature range.

If vapour phase soldering is applied, the same method may be used with the temperatures adapted.

A suitable substrate for mechanical tests is shown in Figure 15. Note that this substrate may not be suitable for impedance measurements. A suitable substrate for electrical tests is shown in Figure 16.



Key

-  Solderable areas
-  Non-solderable areas (covered with non-solderable lacquer)

All dimensions are in millimetres. Tolerances: medium.

Material: epoxide woven glass

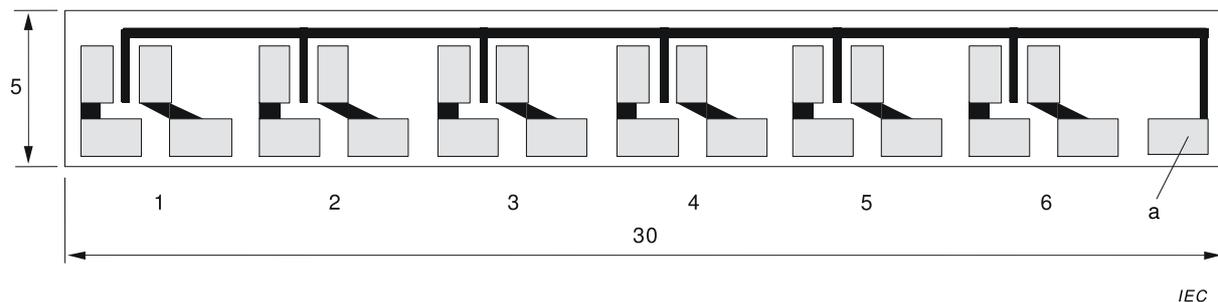
Thickness: 1,6 mm ± 0,20 mm, or 0,8 mm ± 0,10 mm

Dimensions not given should be chosen according to the design and size of the specimens to be tested.

Dimension *W* is dependent on the design of the test equipment.

<sup>a</sup> This conductor may be omitted or used as a guard electrode.

Figure 15 – Suitable substrate for mechanical tests



## Key

- Solderable areas
- Non-solderable areas (covered with non-solderable lacquer)

All dimensions are in millimetres. Tolerances: medium.

Material: 90 % to 98 % alumina substrate

Thickness: 0,635 mm ± 0,05 mm, or more

Dimensions not given should be chosen according to the design and size of the specimens to be tested.

Dimension *W* depends on the design of the test equipment.

<sup>a</sup> This conductor may be omitted or used as a guard electrode.

Figure 16 – Suitable substrate for electrical tests

#### 4.34 Shear test

##### 4.34.1 Test procedure

The surface mount capacitors shall be mounted as described in IEC 60068-2-21, Test U.

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-21, Test Ue3, under the following condition.

A force shall be applied to the surface mount capacitor body progressively, without shock, and shall be maintained for a period of 10 s ± 1 s. Unless otherwise specified in the relevant specification, a force shall be selected from 1 N, 2 N, 5 N or 10 N.

##### 4.34.2 Final inspection, measurements and requirements

The surface mount capacitors shall be visually examined in the mounted state. There shall be no visible damage.

#### 4.35 Substrate bending test

##### 4.35.1 Test procedure

The surface mount capacitor shall be mounted on an epoxide woven glass printed board as described in 4.33.

- a) The capacitance of the surface mount capacitor shall be measured as specified in 4.7 and in the relevant sectional specification.
- b) The capacitor shall be subjected to IEC 60068-2-21, Test Ue, using the conditions as prescribed in the relevant specification for the deflection *D* and the number of bends.
- c) The capacitance of the surface mount capacitors shall be measured as specified in a) with the board in the bent position. The change of capacitance shall not exceed the limits prescribed in the relevant specification.

#### 4.35.2 Recovery

The printed board shall be allowed to recover from the bent position and then removed from the test jig.

#### 4.35.3 Final inspection and requirements

The surface mount capacitors shall be visually examined, and there shall be no visible damage.

### 4.36 Dielectric absorption

#### 4.36.1 Test procedure

The capacitor under test shall be placed in a screened enclosure to reduce the effect of electric fields.

For the measurement of the voltage an electrometer or other suitable instrument having an input resistance of minimum 10 000 MΩ shall be used.

The resistance of any jigs, switches, etc. used shall not affect the input resistance of the measuring system.

The capacitor shall then be charged at the d.c. voltage rating for 60 min ± 1 min. The initial surge current shall not exceed 50 mA.

At the end of this period the capacitor shall be disconnected from the power source and shall be discharged through a 5 Ω ± 5 % resistor for 10 s ± 1 s, unless the specified  $du/dt$  value is exceeded.

The discharge resistor shall be disconnected from the capacitor at the end of the 10 s discharge period. The voltage remaining or regained on the capacitor (recovery voltage) shall be measured.

NOTE The recovery voltage is the maximum voltage occurring across the capacitor terminations within a 15 min period.

The dielectric absorption shall be calculated from the following formula:

$$DA = \frac{U_1}{U_2} \times 100 \times \frac{C_X + C_0}{C_X}$$

where

$DA$  is the per cent dielectric absorption;

$U_1$  is the recovery voltage;

$U_2$  is the charging voltage;

$C_X$  is the capacitance of capacitor under test;

$C_0$  is the input capacitance of measuring system.

If  $C_0$  is less than 10 % of  $C_X$ , the above formula can be simplified to:

$$DA = \frac{U_1}{U_2} \times 100$$

#### 4.36.2 Requirement

The dielectric absorption calculated shall not exceed the limit specified in the detail specification.

#### 4.37 Damp heat, steady state, accelerated

NOTE This test is also known as humidity load test or (85/85)-test.

##### 4.37.1 Initial measurements

The capacitors shall be measured as prescribed in the relevant specification.

##### 4.37.2 Test methods

The capacitors shall be subjected to IEC 60068-2-67, Test Cy.

Preferred test durations: 168 h, 504 h or 1 000 h.

##### 4.37.3 Test procedures

Test condition: rated voltage applied, unless otherwise prescribed in the relevant specification.

For metallized film capacitors this test should be carried out in accordance with Annex G, for multilayer ceramic capacitors in accordance with Annex H.

With the exception of electrolytic capacitors, within 15 min after removal from the test chamber, the voltage proof test of 4.6 shall be carried out at test point A only, using the rated voltage, unless otherwise specified in the detail specification.

##### 4.37.4 Final inspection, measurements and requirements

After recovery (4 h to 24 h), the capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage. The measurements prescribed in the relevant specification shall then be made.

In case of testing metallized film capacitors, when specified in the blank detail specification, the permissible deviation of the average C-value of test group with and the test group without d.c. voltage shall be described in the relevant detail specification.

#### 4.38 Passive flammability

##### 4.38.1 Test procedure

The test shall be made according to IEC 60695-11-5.

The capacitor under test shall be held in the flame in the position which best promotes burning (if this position is not given in the detail specification it shall be evaluated by pre-testing). Each specimen shall be exposed only once to the flame.

The smallest, a medium (in the case of more than four case sizes), and the biggest case size shall be tested. Of each case size, three specimens of the maximum and three specimens of the minimum capacitance shall be tested, resulting in six specimens per case size.

For time of exposure to flame and burning time, see Table 7. If applicable, the detail specification shall specify the category of passive flammability.

4.38.2 Final inspection, measurements and requirements

The burning time of any specimen shall not exceed the time specified in Table 7.

Burning droplets or glowing parts falling down shall not ignite the tissue paper.

Table 7 – Severities and requirements

Category of flammability	Severities Flame exposure time, in seconds, for capacitor volume ranges				Maximum burning time s
	Volume ≤250 mm <sup>3</sup>	Volume >250 mm <sup>3</sup> ≤ 500 mm <sup>3</sup>	Volume >500 mm <sup>3</sup> ≤ 1 750 mm <sup>3</sup>	Volume >1 750 mm <sup>3</sup>	
A	15	30	60	120	3
B	10	20	30	60	10
C	5	10	20	30	30

4.39 High surge current test

4.39.1 Initial measurements

Not required.

4.39.2 Test procedure

The test shall be carried out at a temperature of (23 ± 3) °C.

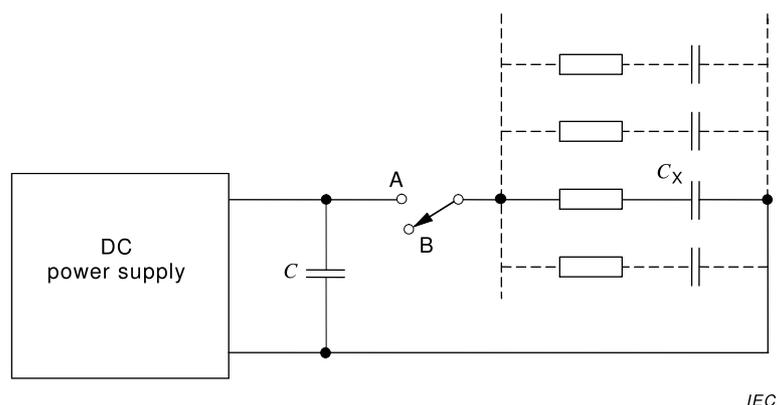
The test circuit is shown in Figure 17. The switch may be mechanical or electronic but is preferably electronic. With the switch in position A, the capacitor under test is charged for 1 s from a low-impedance electrolytic capacitor of capacitance at least 20 000 µF to the rated voltage of the capacitor under test ( $U_R \pm 2\%$ ) from a regulated power supply capable of delivering 10 A. The impedance of the circuit through which the capacitor under test is charged shall meet the requirements of 4.39.3. After 1 s charging time the capacitor under test shall be discharged for 1 s with the switch in position B through a circuit whose resistance is greater than 0,05 Ω, but less than 0,2 Ω.

The voltage across the capacitor under test shall be monitored. Four further chargings and dischargings of the capacitor under test shall be carried out under the same conditions.

Capacitors may be tested in parallel provided that

- a) their total capacitance is less than 2 % of the capacitance of the reservoir capacitor, and
- b) all the conditions specified above are met for each capacitor under test.

The fuse may be a wire fuse designed to blow between 0,5 A and 2,0 A or an electronic circuit designed to trip in the same current range.



## Key

$C_x$  capacitor under test

$C$  low-impedance electrolytic capacitor of capacitance at least 20 000  $\mu\text{F}$

A, B switching positions

Figure 17 – High surge current test

#### 4.39.3 Requirements for the charging circuit

The test procedure of 4.39.2 shall be carried out with a capacitor of  $47 \mu\text{F} \pm 10 \%$ , 35 V in the test position, or in every one of the test positions if provision is made for testing capacitors in parallel. The monitoring of the voltage across the capacitor under test shall demonstrate that the peak voltage across the capacitor during charging is  $U_R^{+5}_{-2} \%$ , and that 90 % of the measured peak voltage is achieved within 60  $\mu\text{s}$  from the time of closure of the switch and without unwanted transients due to switch bounce or circuit inductance. Where there is provision for testing capacitors in parallel, this requirement shall be verified for each capacitor under test.

It is unlikely that this requirement will be met unless the d.c. resistance of the charging circuit including wiring, fuse, fixtures, and the series resistance of the tank capacitor is less than 0,5  $\Omega$ .

#### 4.39.4 Nonconforming items

A capacitor shall be considered a nonconforming item if the fuse blows or the electronic circuit trips at any single charging or discharging of the capacitor.

#### 4.40 Voltage transient overload (for aluminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte)

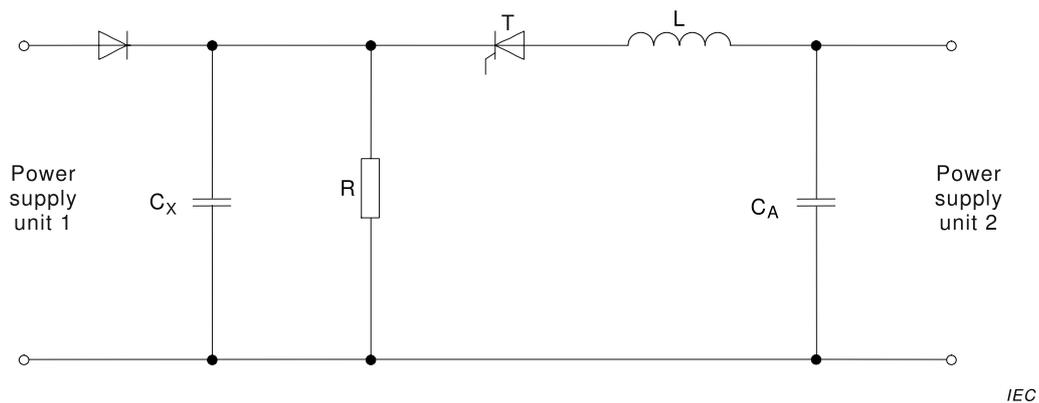
##### 4.40.1 Initial measurement

The measurements prescribed in the detail specification shall be made.

##### 4.40.2 Test procedure

The capacitor(s) shall then be conditioned at the test temperature by having  $U_R \pm 1 \%$  applied from a regulated power supply. At the end of this period, the test may commence but not later than 48 h after conditioning.

An example of a test circuit is shown in Figure 18.



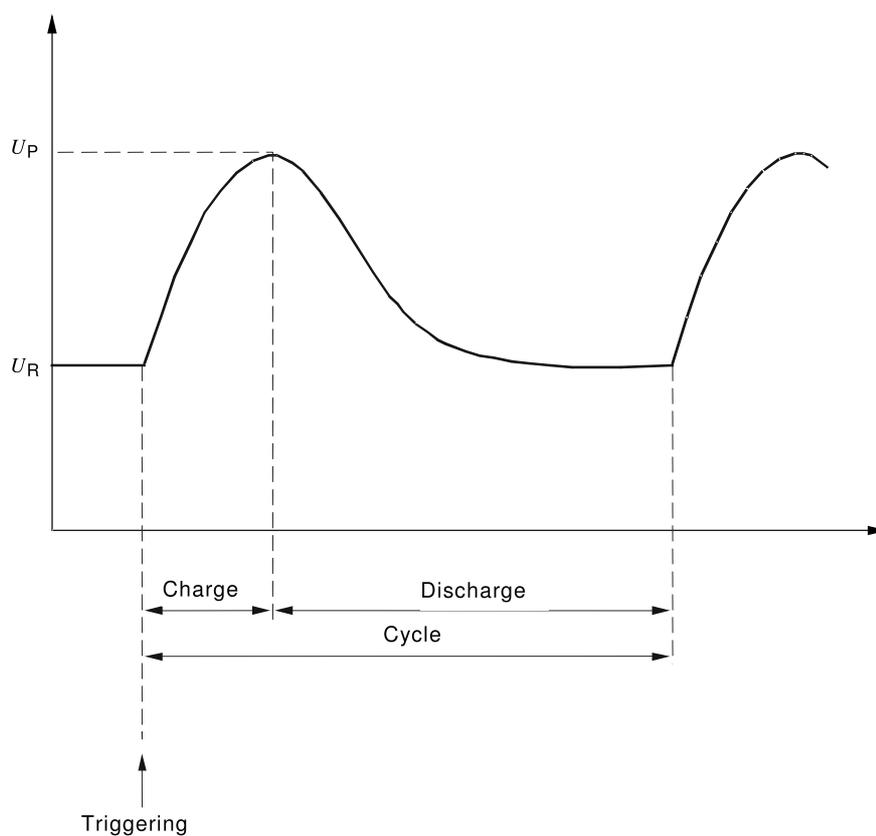
Key

- $C_X$  capacitor under test
- $C_A$  bank capacitor to give a maximum charge time
- R resistor to give a maximum charge time
- L inductor to give a maximum charge time
- T thyristor

Figure 18 – Voltage transient overload test circuit

The capacitor under test  $C_X$  is charged from the power supply unit 1, and the auxiliary capacitor bank  $C_A$  is charged to a voltage higher than the test voltage  $U_P$  from the power supply unit 2. On triggering the thyristor T, the capacitor bank  $C_A$  is discharged through the inductor L charging the test capacitor  $C_X$  to  $U_P$ . On turning the thyristor off, the test capacitor  $C_X$  is discharged through the resistor R from  $U_P$  down to  $U_R$ .

The voltage waveform across the capacitor under test shall be approximately as shown in Figure 19.



IEC

Key

 $U_P$  transient peak voltage $U_R$  rated voltage

Figure 19 – Voltage waveform

#### 4.40.3 Final inspection, measurements and requirements

The measurements specified in the relevant specification shall be made.

#### 4.40.4 Conditions to be prescribed in the relevant specification

The relevant specification shall prescribe:

- the duration of the conditioning period;
- the value of the transient peak voltage  $U_P$ ;
- the value of  $C_A$ ,  $L$  and  $R$  to give a maximum charge time of 15 ms;
- the duration of each test cycle;
- the number of test cycles;
- the temperature if different from standard atmospheric conditions of testing.

#### 4.41 Whisker growth test

##### 4.41.1 General

If prescribed in the relevant specification, the whisker test shall be based on the recommendations of IEC 60068-2-82.

The relevant specification shall prescribe a suitable fixing jig for the support of the specimen during this test.

#### 4.41.2 Preparation of specimen

The preparation of specimen shall be according IEC 60068-2-82:2007, Clause 5.

Capacitors intended for soldering shall receive a preconditioning by heat treatment according to IEC 60068-2-82:2007, 5.5.

Capacitors with leads shall receive a preconditioning by leads forming according to IEC 60068-2-82:2007, 5.6.

#### 4.41.3 Initial measurement

The appearance of capacitors shall be examined according to IEC 60068-2-82:2007, 7.2.

#### 4.41.4 Test procedures

The ambient test, the damp heat test and the temperature cycling test shall be applied according to the prescriptions in IEC 60068-2-82:2007, Clause 6.

#### 4.41.5 Test severities

The severities of IEC 60068-2-82:2007, Table 6 according to the component's material composition shall be applied.

The following discrimination shall be applied to the selection of the severity of the temperature cycling test:

- a) the severity N,  $-55\text{ °C} / 125\text{ °C}$  shall be applied for capacitors with LCT =  $-55\text{ °C}$  or below and UCT =  $125\text{ °C}$  or above,
- b) the severity K,  $-40\text{ °C} / 85\text{ °C}$  shall be applied for capacitors with LCT above  $-55\text{ °C}$  and/or UCT below  $125\text{ °C}$ .

#### 4.41.6 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be examined for appearance according to IEC 60068-2-82:2007, Annex A.

The whisker shall not exceed the limit prescribed in the detail specification.

## Annex A (informative)

### Interpretation of sampling plans and procedures as described in IEC 60410 for use within quality assessment systems

When using IEC 60410 for inspection by attributes, the interpretations of the clauses and subclauses of IEC 60410, as indicated below, apply for the purpose of this standard.

- 1 The responsible authority is the national authorized institution implementing the basic rules and rules of procedure.
- 1.5 The unit of product is the electronic component defined in a detail specification.
- 2 Only the following definitions from this clause are required:
  - a “defect” is any nonconformance of the unit of product to specified requirements;
  - a “defective” is a unit of product which contains one or more nonconformances.
- 3.1 The extent of nonconformance of a product shall be expressed in terms of per cent defective.
- 3.3 Not applicable.
- 4.5 The responsible authority is the IEC technical committee drafting the blank detail specification which forms part of the generic or sectional specification.
- 5.4 The responsible authority is the designated management representative (DMR), acting in accordance with the procedures prescribed in the document describing the inspection department of the approved manufacturer, and approved by the Certification Body (CB).
- 6.2 The responsible authority is the DMR.
- 6.3 Not applicable.
- 6.4 The responsible authority is the DMR.
- 8.1 Normal inspection shall always be used at the start of inspection.
- 8.3.3 d) The responsible authority is the DMR.
- 8.4 The responsible authority is the national supervising inspectorate.
- 9.2 The responsible authority is the IEC technical committee drafting the blank detail specification which forms part of the generic or sectional specification.
- 9.4 (Fourth sentence only) Not applicable.  
(Fifth sentence only) The responsible authority is the DMR.
- 10.2 Not applicable.

## Annex B (informative)

### Rules for the preparation of detail specifications for capacitors and resistors for electronic equipment for use within quality assessment systems

#### B.1 Drafting

The drafting of a complete detail specification, if required, shall begin only when all the following conditions have been met.

- a) The generic specification has been approved.
- b) The sectional specification, when appropriate, has been circulated for approval as an Final Draft International Standard (FDIS).
- c) The associated blank detail specification has been circulated for approval as an FDIS.
- d) There is evidence that at least three national committees have formally approved, as their own national standard, specifications covering a component of closely similar performance.

When a national committee formally asserts that substantial or significant use is made within its country of a part described by some other national standard, this assertion may count towards the foregoing requirement.

#### B.2 Reference standard

Detail specifications shall use the standard of preferred values, ratings and characteristics and severities for environmental tests, etc., which are given in the appropriate generic or sectional specifications.

#### B.3 Circulation

The detail specification should not be circulated as an FDIS until the sectional and blank detail specifications have been approved for publication.

Annex C  
(informative)

Layout of the first page of a PCP/CQC specification

Manufacturer's name

Location

Capability approval number

PCP/CQC specification number

Issue

Capability manual reference number

Date

Description of PCP/CQC

Purpose of PCP/CQC

Drawing reference

Part identity

## Annex D (informative)

### Requirements for capability approval test report

#### D.1 General

Capability approval is described in Q.1.1 b).

The test report shall include the information given in Clauses D.2, D.3 and D.4.

#### D.2 Requirements

The test report shall be dated and include the following general information:

- manufacturer's name and address;
- place of manufacture, if different from above;
- generic and sectional specification number, issue and amendment date;
- the issue number and date of the description of capability;
- reference to PCP/CQC specification;
- reference to the test programme for capability approval, as applicable;
- a list of test equipment used together with appropriate uncertainties of measurement.

#### D.3 Summary of test information (for each CQC)

The test report shall include the following summary of test information:

- tests;
- number of specimens tested;
- number of nonconforming items allowed;
- number of nonconforming items found.

#### D.4 Measurement record

A record of the results of the measurements is taken before and after the various mechanical, environmental, and endurance tests for which post-test limits or final measurements are specified.

## Annex E (informative)

### Guide for pulse testing of capacitors

#### E.1 Overview

Existing testing methods covered by this standard are suitable for capacitors operating in circuits where the applied voltage is predominantly direct voltage. There are now an increasing number of applications in which the applied voltage is in the form of pulse with or without a reversal of polarity. These pulses may be continuous, intermittent, or random in occurrence.

This annex specifies the factors affecting pulse ratings and the way in which these ratings may be checked by appropriate endurance tests. The parameters of a pulse are defined. Different combinations of these parameters can give rise to different causes of failure as follows.

Type	Cause of failure	Test
Electrolytic	Surge voltage exceeded	Surge voltage
	Reverse voltage exceeded	Reverse voltage
	Overheating ( $I^2R$ )	Pulse or a.c.
Metallized types	Peak current	Charge/discharge (intermittent)
	$du/dt$	Pulse
	Overheating ( $I^2R$ )	Pulse or a.c.
	Ionization	a.c.
All other	$du/dt$	Pulse
	Overheating ( $I^2R$ )	Pulse or a.c.
	Excess peak voltage	Surge
	Ionization	a.c.

#### E.2 Typical capacitor pulse conditions

The figures listed below for typical applications show that test specifications requiring 100 000 or 1 million pulses correspond to operations of only 5 s to 50 s.

It is not possible to produce one circuit which will reproduce all of the required conditions.

It is likely, however, that circuits can be produced which will reproduce various groups of conditions. It does not appear possible at the present time to specify accelerated test conditions to simulate, for example, a five-year operation.

- a) Examples for TV applications
- S-correction
 

Typical peak voltage:	25 V, 50 V, 180 V
Typical peak currents:	5 A to 15 A
$du/dt$ :	about 5 V/ $\mu$ s
Frequency:	15 kHz to 20 kHz
Reactive power:	up to 250 var
  - Line tuning
 

Typical peak voltage:	up to 1 500 V
Typical peak current:	5 A
$du/dt$ :	180 V/ $\mu$ s
  - Multiplier capacitors
 

Typical peak voltage:	10 kV d.c. with ripple
Typical peak current:	0,1 A
$du/dt$ :	up to 1 000 V/ $\mu$ s
- b) Examples for power electronics
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Typical peak voltages: | 60 V to 100 V                 |
| Typical peak currents: | 40 A to 100 A                 |
| $du/dt$ :              | 1 V/ $\mu$ s to 20 V/ $\mu$ s |
| Frequencies:           | 50 Hz to 20 kHz               |
| Reactive power:        | up to 500 var                 |
- c) Example for d.c.-d.c. convertors
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typical peak voltage: | 30 V           |
| Typical peak current: | 6 A            |
| $du/dt$ :             | 600 V/ $\mu$ s |
| Frequency:            | up to 20 kHz   |
- d) Examples for switch-mode power supplies
- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Typical peak voltages: | 15 V to 400 V    |
| Typical peak currents: | 2 A to 10 A      |
| Frequencies:           | 100 Hz to 40 kHz |
- e) Examples for lasers and pulse light sources
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Typical peak voltages: | 1 kV to 3 kV         |
| Typical peak current:  | 1 000 A              |
| $du/dt$ :              | about 500 V/ $\mu$ s |
| Frequencies:           | 1 kHz to 5 kHz       |

### E.3 Effect of inductance on pulse testing

Proposed pulse test methods are likely to consist of test circuits involving repetitive charge and discharge of capacitors in resistive circuits. This will result in conventional exponential current and voltage characteristics.

In many applications, however, inductive effects are of considerable importance and have a major influence on the suitability of the capacitor for the application.

These are particularly important at high values of  $du/dt$ . If the conditions for critical damping exist ( $R^2 = 4 \times L/C$ ), the effect is a minor modification of the shape of the charge or discharge curve which will have little effect on the severity of the test.

If, however,  $R^2 < 4 \times L/C$ , there can be overshoot with or without damped oscillations.

These can result in overstress and increased power dissipation.

## Annex F (informative)

### Guidance for the extension of endurance tests on fixed capacitors

#### F.1 Overview

The regular repetition of endurance tests under the quality conformance inspection within a quality system offers the opportunity to collect not only their results for the certified test records (CTR), but to accumulate them, wherever possible, for the evaluation of reliability data. As the usual duration of endurance tests on capacitors is 1 000 h or 2 000 h, interested parties may wish to extend these tests to evaluate the long-term behaviour of the components concerned and to improve the base for the reliability evaluation. In the following, guidance is given for the performance and evaluation of such extended endurance tests.

#### F.2 Guidelines

The following guidelines apply.

- a) Test conditions should preferably be the same as for the standard endurance test. If, for any good reason, different test conditions are chosen, they should be clearly indicated.
- b) For final measurements, the same characteristic should be measured as for the standard endurance test.
- c) The preferred duration for such extended endurance tests is 8 000 h.
- d) The extended test is for information only on long-term behaviour and reliability. The measured values are therefore noted for variable analyses or other reliability evaluation without being linked to the failure criteria as specified.
- e) Intermediate measurements (between 2 000 h and 8 000 h) may be made.
- f) If agreed between the parties concerned, the results of the test may be included in the certified test record (CTR) of released lots.
- g) The “translation” of the results of accumulated tests into reliability data is normally the responsibility of the manufacturer. If somebody else wants to use these accumulated test results for his own reliability evaluation, an appropriate acceleration factor for the components concerned shall be taken into account.

## Annex G (normative)

### Damp heat, steady state with voltage applied, for metallized film capacitors only

#### G.1 Overview

For corrosion sensitivity detection of the metallization of the dielectric film an additional test for damp heat, steady state test with applied voltage shall be carried out.

The deviation of the average capacitance values of the test group with, and the test group without voltage, indicates a possible corrosion of the metallization.

#### G.2 Test procedure

The damp heat, steady state test shall be carried out with applied a.c. or d.c. voltage, depending on the specified rated voltage of the capacitors.

The damp heat, steady state test with applied voltage shall be carried out on an additional test group. The specimens for both test groups with and without voltage can only be prepared by the manufacturer of the components, who will take care that the specimen for both groups are produced with identical materials and in identical production processes. The number of specimens for an additional test group with voltage is the same as the number for the test group without voltage.

## Annex H (normative)

### Accelerated damp heat, steady state, for multilayer ceramic capacitors only

#### H.1 Mounting of capacitors

The capacitors shall be mounted so that each capacitor is connected in series with a resistor. Half of the capacitors shall be connected in series with resistors of  $100 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$  and half in series with resistors of  $6,8 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$ .

#### H.2 Initial measurement

The capacitors, mounted as in Clause H.1, shall be measured for insulation resistance with a voltage of  $1,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$  applied across the capacitor and resistor in series.

The insulation resistance shall meet the requirements given in the relevant specification.

#### H.3 Test procedure

The capacitors with associated resistors shall be subjected to conditioning at  $(85 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $(85 \pm 3) \%$  RH for a duration to be specified in the relevant specification. Those capacitors connected to  $100 \text{ k}\Omega$  resistors shall have a voltage of  $(1,5 \pm 0,1) \text{ V}$  applied, and those connected to  $6,8 \text{ k}\Omega$  resistors shall have  $(50 \pm 0,1) \text{ V}$  or  $U_R$  applied, whichever is the lower. In both cases the voltage shall be applied across the capacitor/resistor combination.

Care shall be taken to avoid condensation of water on to the capacitors or substrates. Condensation may happen if the door is opened during the test before the humidity is lowered.

#### H.4 Recovery

The applied voltage shall be disconnected and the capacitors and resistors shall be removed from the test chamber and allowed to recover for 4 h to 24 h in standard atmospheric conditions for testing.

#### H.5 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors, mounted as in accordance with Clause H.1, shall be measured for insulation resistance as in Clause H.2 above.

The insulation resistance shall be greater than 0,1 times the initial limit.

## Annex Q (informative)

### Quality assessment procedures

#### Q.1 General

##### Q.1.1 Scope of this annex

This generic specification and related sectional and detail specifications can be used for the purpose of a full quality assessment system. The following types of approval are provided.

- a) Qualification Approval (QA) is applicable to an identified component or range of components manufactured to similar design and production processes, for which a detail specification exists. Such a detail specification shall be based on this generic specification and a relevant sectional specification and shall give provisions for a QA.

QA is granted to a manufacturer according to the provisions of Clause Q.2 when it has been established that the components meet the requirements of the detail specification.

The test schedules prescribed in the detail specification for the initial product qualification approval and for the product quality conformance inspections apply directly to the component or range to be qualified.

- b) Capability Approval (CA) is applicable to an identified component manufacturing process and set of design rules for which an applicable sectional specification exists. Such a sectional specification shall be based on this generic specification and shall give provisions for a CA.

CA is granted to a manufacturer according to the provisions of Clause Q.3 when it has been established that his capability for manufacturing processes and quality control methods covering a specific component technology meet the requirements of the relevant specifications.

There are different detail specifications used under CA. At least one detail specification is released for the Capability Qualifying Components (CQC), identifying the component's purpose and prescribing the relevant tests and requirements. Other detail specifications are released for the deliverable components and thus may cover standard catalogue components or customer specific components.

- c) Technology Approval (TA) is appropriate when the complete technological process (design, process realization, product manufacture, test and shipment) covers the qualification aspects common to all components determined by the technology. It incorporates the most recent principles and techniques in quality management and provides for the use of statistical methods and tools, continuous improvement and procedural flexibility.

TA is applicable to an identified electronic component manufacturing activity for which a Technology Approval Schedule (TAS) exists.

TA is granted to a manufacturer according to the provisions of Clause Q.4, when it has been demonstrated that the quality management system established for his electronic component manufacturing activity complies with the contents of his/her Technology Approval Declaration Document (TADD), and meets the requirements of the TAS.

The identification of an electronic component manufacturing activity shall be based on component(s) or range(s) of components manufactured to similar design and production processes, for which detail specification(s) exist(s). Such detail specification(s) shall be based on this generic specification and relevant sectional specification(s) and shall give relevant provisions for a technology approval. Such applied detail specifications are to be referenced in the TA.

A prerequisite for obtaining any of these approvals is that a manufacturer has obtained the approval of manufacturer in accordance with the provisions of the relevant certification body.

## Q.1.2 Quality assessment definitions

### Q.1.2.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture shall be specified in the sectional specification.

Examples of the primary stage of manufacture are:

- For film capacitors:  
the winding of the capacitor element or the equivalent operation.
- For ceramic capacitors:  
the first common firing of the dielectric-electrode assembly.
- For electrolytic capacitors:  
the capacitor manufacturer's evaluation of the formed anode foil.

### Q.1.2.2 Structurally similar components

The grouping of structurally similar components for the initial product qualification approval testing or for the product quality conformance testing under QA, CA or TA shall be prescribed in the relevant sectional specification.

### Q.1.2.3 Assessment level

An assessment level prescribes the severity of the test schedules, the sampling plans and the number of permissible non-conforming items in each test group. Assessment levels EZ and DZ meet the requirements of the zero defect approach and align the assessment procedures and levels with the current industry practices, e.g. by setting the number of permitted non-conformities (acceptance number) to zero. The sectional specifications shall prescribe the requirements to the test schedules for use in all related detail specifications.

NOTE 1 A variety of assessment levels existed historically, e.g. with different numbers of permissible non-conformities per test. Only the assessment levels EZ and DZ are used in recent specifications.

The sampling plans and inspection levels for assessment levels EZ and DZ shall be selected from those given in IEC 61193-2, except for those elements of the test schedule which are based on fixed sample sizes, irrespective of the size of the lot being inspected.

NOTE 2 The assessment of a quality level close or equal to zero defects by sampling only would lead to an unreasonable increase of inspection efforts. Hence, zero acceptance number sampling plans can only apply to the inspection of products that are manufactured under suitable process control with the target of a zero-defect quality level before sampling inspection.

### Q.1.2.4 Failure rate level determination (if applied)

The determination of failure rate level and certification shall be described in the relevant specification.

## Q.1.3 Rework

Rework is the rectification of a processing error by means not differing from those used in the current process, or by an explicitly permitted rework process prior to release of the component.

Rework shall not be carried out if prohibited by the relevant sectional or detail specification.

Applicable rework procedures shall be permitted by the relevant sectional or detail specification and shall be fully described in the relevant documentation produced by the manufacturer. All rework shall be carried out under supervision of the Designated Management Representative (DMR) prior to the formation of the inspection lot offered for inspection to the requirements of the detail specification.

#### Q.1.4 Alternative test methods

The test and measurement methods given by the relevant specification are intended to unify test and measurement procedures. They are not necessarily the only methods which can be used except when specifically designated as referee or reference methods.

An approved manufacturer shall demonstrate to the Certification Body (CB) that any alternative method he uses will give results equivalent to those obtained by the specified method.

In case of dispute, the specified methods take precedence over any alternative method.

#### Q.1.5 Certified test records of released lots

When certified test records are prescribed in the relevant specification and are requested by a customer, the following information shall be given as a minimum.

- a) Attributes information (that is the number of components tested and the number of non-conforming components) for tests in the sub-groups covered by periodic inspection without reference to the parameter for which rejection was made.
- b) Variables information (that is average and range for the change in capacitance and number of tested components) for periodic tests specified in the relevant sectional specification.

NOTE Under CA a certified test record refers only to tests carried out on capability qualifying components.

#### Q.1.6 Unchecked parameters

Only those parameters of a component which have been specified in the detail specification and which were subject to testing shall be assumed to be within the specified limits. It cannot be assumed that any unspecified parameter will remain unchanged from one component to another.

A new, more extensive specification shall be used if control of any additional parameter is required. Then the additional test method shall be fully described with specification of sampling plans, inspection levels and requirements and applied in a relevant test schedule.

#### Q.1.7 Delayed delivery

Components are considered to meet the stated requirements for a period of two years after manufacture and lot release when stored under appropriate conditions, unless otherwise specified in the relevant specification.

Components held for a period exceeding that retention period shall prior to delivery be re-examined for solderability and for electrical characteristics as prescribed in the relevant specification. The sampling and procedure applied for re-examination shall be approved by the Certification Body (CB).

Components are qualified for another retention period, if all relevant requirements were met in the re-examination.

#### Q.1.8 Repair

Repair consists of rendering an approved component usable which has been damaged or has become defective after its release.

Components which have been repaired shall not be released under any specified quality assessment system.

#### Q.1.9 Registration of approvals

Approvals shall be based on a published detail specification complying with this generic specification and a relevant sectional specification.

The achieved approvals shall be entered in a relevant and published Register of Approvals, e.g. in the approvals section “online certificates” of the website [www.iecq.org](http://www.iecq.org). Such entries shall contain all necessary details on the approval, including the applied specifications and the scope of the approval, e.g. designation, variant(s) and range(s) of the approved component(s).

#### Q.1.10 Manufacture outside the geographical limits

See the requirements of the specified quality assessment system (if any).

### Q.2 Qualification approval (QA) procedures

#### Q.2.1 Eligibility for qualification approval

A qualification approval may be granted to a manufacturer holding a manufacturer's approval.

A component is eligible for QA if the manufacturing process, including the prescribed primary stage of manufacture, is carried out under direct supervision of the relevant Designated Management Representative (DMR).

#### Q.2.2 Application for qualification approval

The manufacturer shall comply with the specified quality assessment system (if any).

#### Q.2.3 Subcontracting

The relevant specification may restrict subcontracting according to the specified quality assessment system (if any).

If subcontracting of the primary stage of manufacture and/or subsequent stages is employed, it shall be in accordance with the specified quality assessment system (if any).

#### Q.2.4 Test procedure for the initial product qualification approval

The detail specification shall prescribe the test schedule and the requirements for the initial product qualification approval testing.

The sampling and formation of inspection lots shall be prescribed in the sectional specification or in the detail specification. The sampling plan for the initial product qualification approval testing is based on the fixed sample size procedure, with the number of permissible non-conforming specimen set to zero (e.g. assessment level EZ).

The specimen for an inspection lot shall be collected at random over a short time within an inspection period, not including any major change of the manufacturing process.

#### Q.2.5 Granting of qualification approval

Qualification approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified quality assessment system (if any) have been completed satisfactorily.

### Q.2.6 Maintenance of qualification approval

A QA shall be maintained by regular quality conformance inspections in order to demonstrate the compliance with the requirements for quality conformance prescribed in the detail specification.

### Q.2.7 Quality conformance inspection

The test schedule and the requirements for the product quality conformance inspection shall be prescribed in the detail specification.

The sampling and formation of inspection lots shall be prescribed in the sectional specification or in the detail specification. The sampling plans and inspection levels shall be selected from those given in IEC 61193-2, for the part of the product quality conformance inspection schedule based on variable sample sizes, as used for the lot-by-lot testing. The sampling plan for the periodic product quality conformance inspection testing is based on the fixed sample size procedure. The number of permissible nonconforming specimen for each test group of both test schedules is set to zero (e.g. assessment level EZ).

The specimen for an inspection lot shall be collected at random over a short time within an inspection period, not including any major change of the manufacturing process.

Utilisation of the switching rule for reduced inspection in Group C of the test schedule is permitted in all subgroups except endurance, unless otherwise prescribed in the relevant specification.

## Q.3 Capability approval (CA) procedures

### Q.3.1 General

Capability Approval covers a manufacturing process and quality control methods (including design aspects as applicable) for a specific component technology with clearly defined scope and limits of the employed manufacturing capability.

The capability shall be demonstrated on Capability Qualifying Components (CQC), which serve as specimen for initial qualification testing and for subsequent quality conformance inspections. There shall be a detail specification for a CQC, based on this generic specification and on a sectional specification, giving the provisions for a CA.

A detailed Process Control Plan (PCP) shall be used for inspections to be carried out during the manufacturing process applied to the manufacturing of components for release.

There shall be specific detail specifications for standard catalogue components and for customer specific components to be released under capability approval. They shall be based on this generic specification and on the same sectional specification supporting the detail specification for the CQC.

### Q.3.2 Eligibility for capability approval

The manufacturer shall comply with the requirements of the specified quality assessment system (if any).

A component manufacturer is eligible for CA if the manufacturing process, including the prescribed primary stage of manufacture, is carried out under direct supervision of the relevant Designated Management Representative (DMR).

### Q.3.3 Application for capability approval

The manufacturer shall comply with the requirements of the specified quality assessment system (if any), and with the requirements of the relevant sectional specification.

### Q.3.4 Subcontracting

The relevant specification may restrict subcontracting according to the rules of the specified quality assessment system (if any).

If subcontracting of the primary stage of manufacture and/or subsequent stages is employed, it shall be in accordance with the specified quality assessment system (if any).

### Q.3.5 Description of the capability

The manufacturer shall describe the capability relevant to the manufacturing technology and range of products involved in a Capability Manual (CM), which shall meet the requirements of the specified quality assessment system (if any). The CM shall state the limits of the covered technology, and design rules, if applicable.

The CM may be subject to confidentiality, hence the manufacturer shall provide an abstract of the description of capability suitable for publication.

### Q.3.6 Demonstration and verification of capability

The verification of the claimed capability shall demonstrate compliance with the contents of the CM and utilize Capability Qualifying Components (CQC) and the Process Control Plan (PCP), as required by the specified quality assessment system (if any).

The CQCs shall be used to demonstrate the limits of capability and compliance with the relevant detail specification.

### Q.3.7 Granting of capability approval

Capability approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified quality assessment system (if any) have been completed satisfactorily and the requirements of the relevant sectional specification have been met.

### Q.3.8 Maintenance of capability approval

A Capability Approval shall be maintained according to the specified quality assessment system (if any) and to the respective descriptions of the CM by regular quality conformance inspections on the CQCs in order to demonstrate the compliance with the requirements for quality conformance prescribed in the relevant detail specification.

### Q.3.9 Quality conformance inspection

Quality conformance inspections shall be executed according to the provisions of the specified quality assessment system (if any) and to the respective descriptions of the CM.

The test schedule and the requirements for the quality conformance inspection shall be prescribed in the relevant detail specification(s) for deliverable components, e.g. the specific detail specifications for standard catalogue components or for customer specific components.

The sampling and formation of inspection lots shall be prescribed in the sectional specification or in the detail specification. The sampling plans and inspection levels shall be selected from those given in IEC 61193-2, except for those elements of the test schedule which are based on fixed sample sizes.

The specimen for an inspection lot shall be collected at random over a short time within an inspection period, not including any major change of the manufacturing process.

## Q.4 Technology approval (TA) procedure

### Q.4.1 General

Technology Approval is a method of approving a complete technological process covering the approval aspects common to all products as determined by the technology under consideration. It extends the existing suite of approval concepts (QA and CA) by adding the following principles as mandatory aspects:

- a) a formal system for quality management, actively involving all employees in the commitment to quality;
- b) use of in-process control methods, for example, SPC, to be defined in a Technology Approval Schedule (TAS);
- c) a strategy for continuous quality improvement;
- d) monitoring the overall technologies and operations associated with the design and manufacturing processes as well as the components themselves;
- e) procedural flexibility due to the underlying quality assurance management system and market sector requirements;
- f) acceptance of a manufacturer's operational documentation to provide means for rapid approval or extension of approval.

### Q.4.2 Eligibility for technology approval

A TA may be granted to a manufacturer holding an Approval of Manufacturer to the specified quality assessment system (if any).

Prerequisite to a TA is a Technology Approval Schedule (TAS) covering the entire scope of technology for which approval is intended, written according to the requirements of the specified quality assessment system (if any).

### Q.4.3 Application of technology approval

The procedure and requirements for an application for TA are given in the specified quality assessment system (if any).

### Q.4.4 Subcontracting

The TAS or the relevant specification may restrict subcontracting according to the rules of the specified quality assessment system (if any).

### Q.4.5 Description of technology

The manufacturer shall describe the implementation of the TAS in his organisation in a Technology Approval Declaration Document (TADD) which shall meet the requirements of the specified quality assessment system (if any). The TADD shall describe the relevant scope of technology and relate to, but not exceed the range of activities covered by the TAS.

### Q.4.6 Demonstration and verification of the technology

For verification of the operational and technological processes, the manufacturer shall demonstrate compliance with the contents of the TADD, as required in the specified quality assessment system (if any).

For manufacturing verification, characterisation and evaluation of process performance shall be performed on components, for which a detail specification exists. Such detail specification

shall be based on this generic specification and a sectional specification and shall give provisions for a TA.

#### Q.4.7 Granting of technology approval

TA shall be granted by the Certification Body (CB) when the requirements of the specified quality assessment system (if any) have been met.

#### Q.4.8 Maintenance of technology approval

A TA shall be maintained according to the provisions of the specified quality assessment system (if any).

#### Q.4.9 Quality conformance inspection

The quality conformance inspection shall be carried out in accordance with the relevant TAS.

The quality conformance inspection of the manufacturing shall be performed on components for which a detail specification has been registered in the TADD. The test schedule and the requirements for the quality conformance inspection shall be prescribed in the detail specification.

The sampling and formation of inspection lots shall be prescribed in the sectional specification or in the detail specification. The sampling plans and inspection levels shall be selected from those given in IEC 61193-2, except for those elements of the test schedule which are based on fixed sample sizes.

The specimen for an inspection lot shall be collected at random over a short time within an inspection period, not including any major change of the manufacturing process.

Utilisation of the switching rule for reduced inspection in Group C of the test schedule is permitted in all subgroups except endurance, unless otherwise prescribed in the relevant specification.

## Bibliography

IEC 60384-2, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 2: Sectional specification – Fixed metallized polyethylene terephthalate film dielectric d.c. capacitors*

IEC 60384-3, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 3: Sectional specification – Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with manganese dioxide solid electrolyte*

IEC 60384-3-1, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 3-1: Blank detail specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with manganese dioxide solid electrolyte – Assessment level EZ*

IEC 60384-3-101, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 3-101: Detail specification – Fixed tantalum chip capacitors for surface mounting with solid electrolyte and porous anode, style I – Assessment level E*

IEC 60384-26, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 26: Sectional specification – Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte*

IEC 60410, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 60469:2013, *Transitions, pulses and related waveforms – Terms, definitions and algorithms*

ISO 9000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*

---

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	93
INTRODUCTION.....	95
1 Généralités.....	97
1.1 Domaine d'application .....	97
1.2 Références normatives.....	97
2 Données techniques .....	99
2.1 Symboles, unités et abréviations .....	99
2.1.1 Généralités .....	99
2.1.2 Symboles littéraux.....	99
2.1.3 Abréviations.....	100
2.2 Termes et définitions.....	100
2.3 Valeurs préférentielles et exigences techniques supplémentaires.....	105
2.3.1 Généralités .....	105
2.3.2 Valeurs préférentielles de la capacité nominale .....	105
2.3.3 Valeurs préférentielles de la tension assignée .....	105
2.3.4 Charge assignée en alternatif.....	105
2.3.5 Charge assignée en impulsions.....	106
2.3.6 Tension corrigée en fonction de la température.....	106
2.4 Marquage .....	107
2.4.1 Généralités .....	107
2.4.2 Codage.....	107
3 Procédures d'assurance de la qualité.....	107
4 Essais et procédures de mesure .....	108
4.1 Généralités .....	109
4.2 Conditions atmosphériques normalisées .....	109
4.2.1 Conditions atmosphériques normalisées d'essai .....	109
4.2.2 Conditions de reprise .....	109
4.2.3 Conditions d'arbitrage .....	110
4.2.4 Conditions de référence .....	110
4.3 Séchage .....	110
4.4 Examen visuel et contrôle des dimensions.....	110
4.4.1 Examen visuel .....	110
4.4.2 Dimensions (calibrage).....	110
4.4.3 Dimensions (détail) .....	111
4.5 Résistance d'isolement.....	111
4.5.1 Préconditionnement .....	111
4.5.2 Conditions de mesure .....	111
4.5.3 Points d'essai .....	111
4.5.4 Méthodes d'essai .....	112
4.5.5 Compensation de température.....	112
4.5.6 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	112
4.6 Tension de tenue .....	114
4.6.1 Généralités .....	114
4.6.2 Circuit d'essai (pour l'essai entre sorties).....	114
4.6.3 Essai .....	115
4.6.4 Exigences.....	116

4.6.5	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	116
4.7	Capacité .....	117
4.7.1	Fréquence de mesure et tension de mesure .....	117
4.7.2	Équipement de mesure .....	117
4.7.3	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	117
4.8	Tangente de l'angle de perte et résistance-série équivalente (RSE) .....	117
4.8.1	Tangente de l'angle de perte .....	117
4.8.2	Résistance-série équivalente (RSE) .....	118
4.9	Courant de fuite .....	118
4.9.1	Préconditionnement .....	118
4.9.2	Méthode d'essai .....	118
4.9.3	Source d'alimentation .....	118
4.9.4	Exactitude de mesure .....	118
4.9.5	Circuit d'essai .....	118
4.9.6	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	119
4.10	Impédance .....	119
4.11	Inductance et fréquence de résonance propre .....	120
4.11.1	Fréquence de résonance propre ( $f_r$ ) .....	120
4.11.2	Inductance .....	123
4.11.3	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	123
4.12	Sortie de l'armature extérieure .....	123
4.13	Robustesse des sorties .....	124
4.13.1	Généralités .....	124
4.13.2	Essai $U_{a1}$ – Traction .....	124
4.13.3	Essai $U_b$ – Pliage (sur la moitié de l'échantillon) .....	125
4.13.4	Essai $U_c$ – Torsion (autre moitié de l'échantillon) .....	125
4.13.5	Essai $U_d$ – Couple .....	125
4.13.6	Examen visuel .....	125
4.14	Résistance à la chaleur de brasage .....	125
4.14.1	Préconditionnement et mesurage initial .....	125
4.14.2	Procédure d'essai .....	125
4.14.3	Reprise .....	126
4.14.4	Inspection finale, mesurage et exigences .....	126
4.15	Brasabilité .....	126
4.15.1	Généralités .....	126
4.15.2	Préconditionnement .....	126
4.15.3	Procédure d'essai .....	126
4.15.4	Inspection finale, mesurages et exigences .....	127
4.16	Variations rapides de température .....	127
4.16.1	Mesurage initial .....	127
4.16.2	Procédure d'essai .....	127
4.16.3	Inspection finale, mesurages et exigences .....	127
4.17	Vibrations .....	127
4.17.1	Mesurage initial .....	127
4.17.2	Procédure d'essai .....	127
4.17.3	Essai électrique (mesurage intermédiaire) .....	127
4.17.4	Inspection finale, mesurages et exigences .....	128
4.18	Secousses (chocs répétitifs) .....	128
4.18.1	Mesurage initial .....	128

4.18.2	Procédure d'essai .....	128
4.18.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	128
4.19	Chocs .....	128
4.19.1	Mesurage initial .....	128
4.19.2	Procédure d'essai .....	128
4.19.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	128
4.20	Étanchéité des boîtiers.....	128
4.21	Séquence climatique .....	129
4.21.1	Généralités .....	129
4.21.2	Mesurages initiaux .....	129
4.21.3	Chaleur sèche.....	129
4.21.4	Chaleur humide, cyclique, essai Db, premier cycle.....	129
4.21.5	Froid.....	129
4.21.6	Basse pression atmosphérique.....	129
4.21.7	Chaleur humide, cyclique, essai Db, cycles restants .....	130
4.21.8	Mesurages finaux.....	130
4.22	Chaleur humide, essai continu.....	130
4.22.1	Mesurage initial .....	130
4.22.2	Procédure d'essai .....	130
4.22.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	131
4.23	Endurance .....	131
4.23.1	Mesurages initiaux .....	131
4.23.2	Procédure d'essai .....	131
4.23.3	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	131
4.23.4	Tension d'essai.....	131
4.23.5	Positionnement dans la chambre d'essai .....	132
4.23.6	Reprise.....	132
4.23.7	Inspection finale, mesurages et exigences.....	133
4.24	Variation de la capacité avec la température.....	133
4.24.1	Méthode statique .....	133
4.24.2	Méthode dynamique.....	134
4.24.3	Méthodes de calcul .....	134
4.25	Stockage.....	135
4.25.1	Stockage à haute température.....	135
4.25.2	Stockage à basse température .....	135
4.26	Surtension .....	136
4.26.1	Mesurage initial .....	136
4.26.2	Procédure d'essai .....	136
4.26.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	137
4.26.4	Informations devant être données dans la spécification particulière applicable .....	137
4.27	Essais de charge et de décharge et essai de courant d'appel.....	137
4.27.1	Mesurage initial .....	137
4.27.2	Procédure d'essai .....	138
4.27.3	Charge et décharge .....	138
4.27.4	Courant d'appel .....	139
4.27.5	Inspection finale, mesurages et exigences.....	139
4.28	Décharge de pression (pour les condensateurs électrolytiques en aluminium) ....	139
4.28.1	Généralités .....	139

4.28.2	Essai en courant alternatif.....	139
4.28.3	Essai en courant continu .....	139
4.28.4	Essai pneumatique.....	139
4.28.5	Inspection finale, mesurages et exigences.....	139
4.29	Caractéristiques à haute et basse températures.....	140
4.29.1	Procédure d'essai .....	140
4.29.2	Exigences.....	140
4.30	Essai de stabilité thermique.....	140
4.31	Résistance au solvant des composants.....	140
4.31.1	Mesurages initiaux .....	140
4.31.2	Procédure d'essai .....	140
4.31.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	141
4.32	Résistance au solvant du marquage .....	141
4.32.1	Procédure d'essai .....	141
4.32.2	Inspection finale, mesurages et exigences.....	141
4.33	Montage (pour les condensateurs pour montage en surface uniquement) .....	141
4.33.1	Substrat.....	141
4.33.2	Brasage à la vague .....	141
4.33.3	Brasage par fusion.....	142
4.34	Essai de cisaillement.....	144
4.34.1	Procédure d'essai .....	144
4.34.2	Inspection finale, mesurages et exigences.....	144
4.35	Essai de pliage du substrat .....	144
4.35.1	Procédure d'essai .....	144
4.35.2	Reprise.....	145
4.35.3	Inspection et exigences finales.....	145
4.36	Absorption diélectrique.....	145
4.36.1	Procédure d'essai .....	145
4.36.2	Exigences.....	146
4.37	Essai continu de chaleur humide accéléré .....	146
4.37.1	Mesurages initiaux .....	146
4.37.2	Méthodes d'essai .....	146
4.37.3	Procédures d'essai.....	146
4.37.4	Inspection finale, mesurages et exigences.....	146
4.38	Inflammabilité passive .....	146
4.38.1	Procédure d'essai .....	146
4.38.2	Inspection finale, mesurages et exigences.....	147
4.39	Essai aux surintensités.....	147
4.39.1	Mesurages initiaux .....	147
4.39.2	Procédure d'essai .....	147
4.39.3	Exigences pour le circuit de charge .....	148
4.39.4	Éléments non conformes .....	148
4.40	Surtension transitoire (pour condensateurs électrolytiques en aluminium à électrolyte non solide) .....	148
4.40.1	Mesurage initial .....	148
4.40.2	Procédure d'essai .....	149
4.40.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	150
4.40.4	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	150
4.41	Essai sur le développement des trichites .....	150

4.41.1	Généralités .....	150
4.41.2	Préparation des éprouvettes.....	151
4.41.3	Mesurage initial .....	151
4.41.4	Procédures d'essai.....	151
4.41.5	Sévérités des essais .....	151
4.41.6	Inspection finale, mesurages et exigences.....	151
Annexe A (informative) Interprétation des plans d'échantillonnage et des procédures tels qu'ils sont décrits dans l'IEC 60410 et destinés à être utilisés dans les systèmes d'assurance de la qualité .....		152
Annexe B (informative) Règles pour la préparation des spécifications particulières pour des condensateurs et des résistances pour équipements électroniques, destinés à être utilisés dans les systèmes d'assurance de la qualité .....		153
B.1	Élaboration .....	153
B.2	Norme de référence .....	153
B.3	Diffusion .....	153
Annexe C (informative) Disposition de la première page d'une spécification PCP/CQC.....		154
Annexe D (informative) Exigences pour le rapport d'essai d'agrément de savoir-faire .....		155
D.1	Généralités .....	155
D.2	Exigences .....	155
D.3	Résumé des informations sur les essais (pour chaque CQC).....	155
D.4	Enregistrement de mesure.....	155
Annexe E (informative) Guide pour l'essai en impulsion des condensateurs .....		156
E.1	Présentation .....	156
E.2	Conditions typiques en impulsions pour les condensateurs .....	156
E.3	Influence de l'inductance sur les essais en impulsions .....	157
Annexe F (informative) Lignes directrices pour l'extension des essais d'endurance sur les condensateurs fixes .....		159
F.1	Présentation .....	159
F.2	Lignes directrices .....	159
Annexe G (normative) Essai continu de chaleur humide avec application de tension, pour les condensateurs à film métallisé uniquement .....		160
G.1	Présentation .....	160
G.2	Procédure d'essai .....	160
Annexe H (normative) Essai continu de chaleur humide accéléré, pour les condensateurs céramiques multicouches uniquement.....		161
H.1	Montage des condensateurs.....	161
H.2	Mesurage initial.....	161
H.3	Procédure d'essai .....	161
H.4	Reprise.....	161
H.5	Inspection finale, mesurages et exigences.....	161
Annexe Q (informative) Procédures d'assurance de la qualité .....		162
Q.1	Généralités .....	162
Q.1.1	Domaine d'application de la présente annexe .....	162
Q.1.2	Définitions de l'assurance de la qualité .....	163
Q.1.3	Reprise.....	164
Q.1.4	Autres méthodes d'essai .....	164
Q.1.5	Rapports certifiés d'essais des lots acceptés .....	164
Q.1.6	Paramètres non vérifiés .....	164
Q.1.7	Livraison différée .....	165

Q.1.8	Réparation.....	165
Q.1.9	Registre des agréments .....	165
Q.1.10	Fabrication hors des limites géographiques .....	165
Q.2	Procédures d'homologation (QA).....	165
Q.2.1	Aptitude à l'homologation .....	165
Q.2.2	Demande d'homologation.....	165
Q.2.3	Sous-traitance .....	165
Q.2.4	Procédure d'essai pour l'homologation initiale des produits.....	166
Q.2.5	Octroi de l'homologation.....	166
Q.2.6	Maintien de l'homologation.....	166
Q.2.7	Contrôle de conformité de la qualité .....	166
Q.3	Procédures d'agrément de savoir-faire .....	166
Q.3.1	Généralités .....	166
Q.3.2	Aptitude à l'agrément de savoir-faire .....	167
Q.3.3	Demande d'agrément de savoir-faire .....	167
Q.3.4	Sous-traitance .....	167
Q.3.5	Description du savoir-faire.....	167
Q.3.6	Démonstration et vérification de savoir-faire .....	167
Q.3.7	Octroi de l'agrément de savoir-faire .....	168
Q.3.8	Maintien de l'agrément de savoir-faire .....	168
Q.3.9	Contrôle de conformité de la qualité .....	168
Q.4	Procédure d'agrément de technologie.....	168
Q.4.1	Généralités .....	168
Q.4.2	Aptitude à l'agrément de technologie .....	169
Q.4.3	Demande d'agrément de technologie.....	169
Q.4.4	Sous-traitance .....	169
Q.4.5	Description de la technologie .....	169
Q.4.6	Démonstration et vérification de la technologie .....	169
Q.4.7	Octroi d'agrément de technologie .....	169
Q.4.8	Maintien d'agrément de technologie .....	169
Q.4.9	Contrôle de conformité de la qualité .....	169
Bibliographie	.....	171
Figure 1	– Puissance réactive en fonction de la fréquence.....	106
Figure 2	– Relation entre la plage des températures de catégorie et la tension appliquée .....	107
Figure 3	– Circuit d'essai de tension de tenue .....	114
Figure 4	– Schéma de principe du circuit de mesure de l'impédance .....	119
Figure 5	– Disposition de montage des condensateurs .....	121
Figure 6	– Disposition de montage des condensateurs .....	121
Figure 7	– Schéma typique d'un ondemètre-oscillateur à absorption .....	122
Figure 8	– Schéma de principe du circuit de mesure.....	123
Figure 9	– Circuit d'essai .....	124
Figure 10	– Circuit d'essai pour les condensateurs électrolytiques.....	132
Figure 11	– Circuit à relais .....	136
Figure 12	– Circuit à thyristors .....	136
Figure 13	– Forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur .....	137

Figure 14 – Forme d’onde de la tension et du courant.....	138
Figure 15 – Substrat approprié pour les essais mécaniques.....	143
Figure 16 – Substrat approprié pour les essais électriques .....	144
Figure 17 – Essai aux surintensités.....	148
Figure 18 – Circuit d’essai de la surtension transitoire .....	149
Figure 19 – Forme d’onde de la tension.....	150
Tableau 1 – Conditions d’arbitrage.....	110
Tableau 2 – Mesurage de la résistance d’isolement.....	111
Tableau 3 – Points de mesure.....	113
Tableau 4 – Force de traction.....	124
Tableau 5 – Couple.....	125
Tableau 6 – Nombre de cycles .....	130
Tableau 7 – Sévérités et exigences.....	147

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS  
DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

## Partie 1: Spécification générique

## AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60384-1 a été établie par le comité d'études 40 de l'IEC: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette cinquième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2008. Cette édition constitue une révision technique, incluant des révisions mineures des tableaux, des valeurs et des références.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- INTRODUCTION ajoutée;
- 4.41 Essai sur le développement des trichites ajouté;
- Annexe Q entièrement restructurée.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
40/2420/FDIS	40/2444/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60384, publiées sous le titre général *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTRODUCTION

Le système de spécifications pour des condensateurs fixes utilisés dans des équipements électroniques est structuré dans un système hiérarchique constitué des types suivants de spécifications.

### Spécification générique

La spécification générique couvre tous les sujets, principalement les sujets communs à la famille de condensateurs fixes utilisés dans des équipements électroniques, tels que la terminologie, les méthodes de mesure et les essais. Lorsque des conditions ou des paramètres relatifs aux exigences spécifiques à la sous-famille particulière ou au type particulier de condensateur fixe sont exigés, de telles exigences doivent être données par une des spécifications subordonnées.

Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, la référence numérique de la spécification générique est l'IEC 60384-1.

### Spécification intermédiaire

Les spécifications intermédiaires couvrent tous les sujets s'ajoutant à ceux indiqués dans la spécification générique et qui sont spécifiques à un sous-groupe défini de condensateurs fixes. Ces sujets sont normalement les valeurs préférentielles des dimensions et des caractéristiques, les méthodes d'essai supplémentaires et les exigences applicables aux méthodes d'essai données dans la spécification générique, les exigences relatives à l'échantillonnage et à la préparation des éprouvettes, les sévérités d'essai recommandées et les critères d'acceptation préférentiels. La spécification intermédiaire présente également la structure et le domaine d'application des programmes d'essai qui doivent être appliqués dans toutes les spécifications particulières subordonnées.

Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, les références numériques aux spécifications intermédiaires vont de l'IEC 60384-2 pour les condensateurs à film de polyester à actuellement l'IEC 60384-26 pour les condensateurs électrolytiques en aluminium à électrolyte solide en polymère conducteur. La variété de spécifications intermédiaires peut être adaptée aux différentes technologies de condensateurs fixes.

### Spécification particulière

Les spécifications particulières donnent, directement ou en faisant référence à d'autres spécifications, toutes les informations nécessaires pour décrire complètement un type et une plage donnés de condensateurs fixes, y compris les exigences relatives à toutes les valeurs des dimensions et des caractéristiques. Elles donnent également toutes les informations exigées pour l'assurance de la qualité du type et de la plage de condensateurs fixes couverts dans un système approprié d'assurance de la qualité, y compris les exigences relatives à toutes les sévérités d'essai et à tous les critères d'acceptation appliqués, et les programmes d'essai réalisés.

Les spécifications particulières peuvent être soit des spécifications du système IEC, soit une autre spécification liée à l'IEC, soit une spécification du fabricant ou de l'utilisateur. Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, les références numériques aux spécifications particulières sont par exemple l'IEC 60384-3-101, pour une spécification particulière se rapportant à la spécification intermédiaire IEC 60384-3 et à la spécification particulière cadre auxiliaire IEC 60384-3-1.

### Spécification particulière cadre

Dans le système hiérarchique de spécifications, une spécification intermédiaire est complétée par une ou plusieurs spécifications particulières cadres utilisées pour assurer une

présentation uniforme des spécifications particulières. La spécification particulière cadre fournit au rédacteur des spécifications un modèle de disposition à adopter et un modèle d'informations à fournir, ainsi que des lignes directrices pour la préparation de spécifications particulières en respectant les exigences des spécifications génériques ou intermédiaires supérieures. Les spécifications particulières cadres ne sont pas considérées comme des spécifications applicables parce qu'elles ne décrivent pas de composants particuliers.

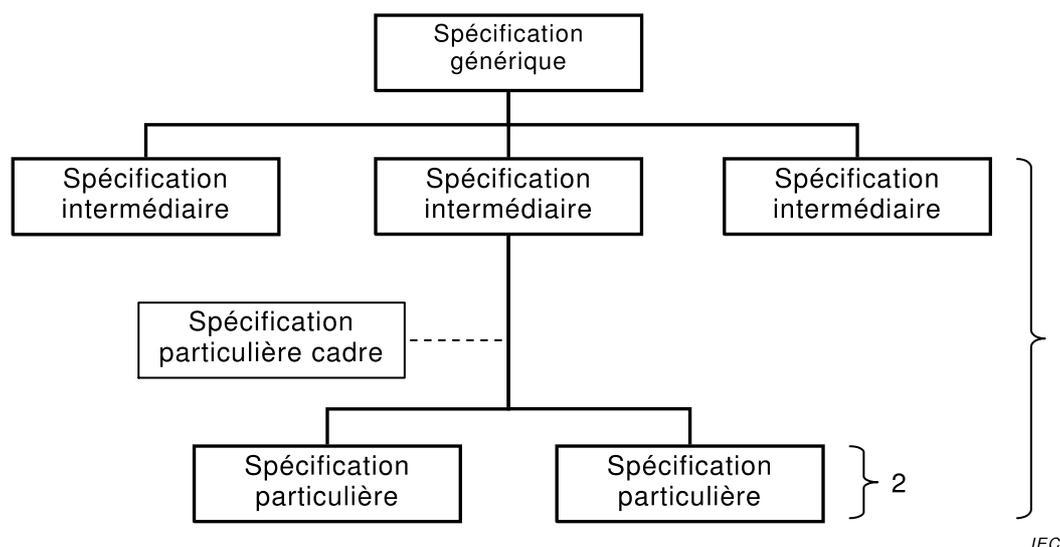
La présence d'un système de spécifications hiérarchiques établi, avec des spécifications particulières cadres, permet de préparer des spécifications particulières même en dehors du comité d'études de l'IEC concerné.

Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, les références numériques aux spécifications particulières cadres sont par exemple l'IEC 60384-3-1, pour une spécification particulière cadre se rapportant à la spécification intermédiaire IEC 60384-3.

### Spécification applicable

Dans ce système, le terme «spécification applicable» porte sur des spécifications subordonnées contenant des exigences spécifiques, le cas échéant.

N'importe quelle spécification générique ou intermédiaire peut utiliser un résumé et des références universelles à des spécifications subordonnées de n'importe quel niveau hiérarchique en utilisant l'expression «spécification applicable».



### Légende

- 1 Indique la plage de "Spécifications applicables" pour la spécification générique supérieure, le cas échéant.
- 2 Indique la plage de "Spécifications applicables" pour la spécification intermédiaire supérieure, le cas échéant.

# CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

## Partie 1: Spécification générique

### 1 Généralités

#### 1.1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60384 est une spécification générique qui s'applique aux condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.

Elle établit des définitions, des procédures de contrôle et des méthodes d'essai normalisées à utiliser dans les spécifications intermédiaires et particulières des composants électroniques, pour les systèmes d'assurance de la qualité ou pour tout autre usage.

#### 1.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Électrotechnique International*

IEC 60062, *Codes de marquage des résistances et des condensateurs*

IEC 60063, *Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs*

IEC 60068-1:2013, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

IEC 60068-2-1:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid*

IEC 60068-2-2:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche*

IEC 60068-2-6:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-13:1983, *Essais d'environnement – Partie 2-13: Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60068-2-17:1994, *Essais d'environnement – Partie 2-17: Essais – Essai Q: Étanchéité*

IEC 60068-2-20:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brasage des dispositifs à broches*

IEC 60068-2-21:2006, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de montage incorporés*

IEC 60068-2-27:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

IEC 60068-2-30:2005, *Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)*

IEC 60068-2-45:1980, *Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2-45: Essais – Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage*  
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-54:2006, *Essais d'environnement – Partie 2-54: Essais – Essai Ta: Essai de la soudabilité des composants électroniques à l'aide de la méthode de la balance de mouillage*

IEC 60068-2-58:2015, *Essais d'environnement – Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)*

IEC 60068-2-67:1995, *Essais d'environnement – Partie 2-67: Essais – Essai Cy: Essai continu de chaleur humide, essai accéléré applicable en premier lieu aux composants*

IEC 60068-2-69:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-69: Essais – Essai Te: Essai de brasabilité des composants électroniques pour les composants de montage en surface (CMS) par la méthode de la balance de mouillage*

IEC 60068-2-78:2012, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

IEC 60068-2-82:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-82: Essais – Essai XW1: Méthodes de vérification des trichites pour les composants électroniques et électriques*

IEC 60294, *Mesure des dimensions d'un composant cylindrique à sorties axiales*

IEC 60617, *Symboles graphiques pour schémas*

IEC 60695-11-5:2004, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60717, *Méthode pour la détermination de l'encombrement des condensateurs et résistances à sorties unilatérales*

IEC 61193-2, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages* (disponible en anglais seulement)

IEC 61249-2-7:2002, *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre*

ISO 3, *Nombres normaux – Séries de nombres normaux*

ISO 80000-1, *Grandeurs et unités – Partie 1: Généralités*

## 2 Données techniques

### 2.1 Symboles, unités et abréviations

#### 2.1.1 Généralités

Il convient que les unités, les symboles graphiques et les symboles littéraux proviennent, dans la mesure du possible, des publications suivantes:

- IEC 60027 (série);
- IEC 60050 (série);
- IEC 60617;
- ISO 80000-1.

Si d'autres rubriques sont exigées, il convient qu'elles soient établies conformément aux principes énoncés dans les publications référencées ci-dessus.

#### 2.1.2 Symboles littéraux

$C_N$	Capacité nominale
$DA$	Dielectric Absorption (absorption diélectrique)
$du/dt$	Capacité à supporter des impulsions
$f_r$	Fréquence de résonance propre
$I_{leak}$	Courant de fuite
$k_0$	Caractéristiques des impulsions maximales admissibles
$L$	Inductance propre
$R_{INS}$	Résistance d'isolement
$T_A$	Température de catégorie inférieure
$\tan \delta$	Tangente de l'angle de perte
$T_B$	Température de catégorie supérieure
$T_C$	Température de catégorie
$T_{op}$	Température de fonctionnement
$T_R$	Température assignée
$U_C$	Tension de catégorie
$U_{op}$	Tension de fonctionnement
$U_R$	Tension assignée
$U_{RS}$	Surtension
$Z$	Impédance

$\alpha$  Coefficient de température de la capacité

$\tau = C_N \times R_{INS}$  Constante de temps

### 2.1.3 Abréviations

CA Agrément de savoir-faire (*Capability Approval*)

CB Organisme de certification (*Certification Body*)

CQC Composants pour agrément de savoir-faire (*Capability Qualifying Components*)

DMR Responsable désigné (*Designated Management Representative*)

RSE Résistance-Série Équivalente

IPA Alcool isopropylique (*Isopropyl alcohol*)

PCP Plan de Contrôle de Processus

QA Homologation (*Qualifying Approval*)

CMS Composant pour Montage en Surface

TA Agrément de technologie (*Technology Approval*)

TADD Document de déclaration d'agrément de technologie (*Technology Approval Declaration Document*)

## 2.2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE Dans la version anglaise, les termes sont énumérés par ordre alphabétique.

### 2.2.1

condensateur pour courant alternatif

condensateur conçu essentiellement pour fonctionner sous des tensions alternatives

### 2.2.2

condensateur bipolaire

<condensateur électrolytique> condensateur prévu pour supporter une tension alternative et/ou une inversion de la polarité de la tension continue appliquée

### 2.2.3

catégorie d'inflammabilité passive

catégorie indiquant la durée maximale d'inflammation autorisée après une durée d'application de flamme spécifiée

### 2.2.4

plage des températures de catégorie

plage des températures ambiantes pour laquelle le condensateur a été conçu pour fonctionner de manière continue

Note 1 à l'article: La plage des températures est limitée par la température de catégorie inférieure et la température de catégorie supérieure (voir 2.2.10 et 2.2.41).

## 2.2.5

tension de catégorie

$U_C$

tension maximale pouvant être appliquée de manière continue à un condensateur utilisé à sa température de catégorie supérieure (2.2.41)

## 2.2.6

condensateur pour courant continu

condensateur conçu essentiellement pour fonctionner sous des tensions continues

Note 1 à l'article: Il peut ne pas convenir pour une utilisation sur des sources de courant alternatif.

## 2.2.7

famille

<composants électroniques> groupe de composants qui présentent principalement un attribut physique particulier et/ou réalisent une fonction définie

## 2.2.8

classe

terme servant à préciser des caractéristiques générales complémentaires concernant l'application projetée du composant

## 2.2.9

condensateur isolé

condensateur dont toutes les bornes d'une section peuvent être portées à un potentiel différent (mais non inférieur à la tension assignée) de celui de toute surface conductrice avec laquelle le boîtier est susceptible d'entrer en contact en utilisation normale

## 2.2.10

température de catégorie inférieure

température ambiante minimale pour laquelle un condensateur a été conçu en vue d'un fonctionnement permanent

## 2.2.11

température maximale de stockage

température ambiante maximale que le condensateur supporte sans dommage en conditions de non-fonctionnement

## 2.2.12

température maximale d'un condensateur

température du point le plus chaud de la surface externe

Note 1 à l'article: Les bornes sont considérées comme faisant partie de la surface externe.

## 2.2.13

température minimale de stockage

température ambiante minimale que le condensateur supporte sans dommage en conditions de non-fonctionnement

## 2.2.14

température minimale d'un condensateur

température du point le plus froid de la surface externe

Note 1 à l'article: Les bornes sont considérées comme faisant partie de la surface externe.

## 2.2.15

capacité nominale

$C_N$

valeur de capacité pour laquelle a été conçu le condensateur et qui est habituellement marquée sur celui-ci

#### 2.2.16

inflammabilité passive

aptitude d'un condensateur à brûler avec une flamme par suite de l'application d'une source de chaleur externe

#### 2.2.17

condensateur polarisé

<condensateur électrolytique> condensateur conçu pour être utilisé sous une tension unidirectionnelle reliée conformément à la polarité indiquée

#### 2.2.18

condensateur pour impulsions

condensateur pour utilisation avec des impulsions de courant ou de tension

Note 1 à l'article: Les définitions de l'IEC 60469 s'appliquent.

#### 2.2.19

circuit équivalent en impulsion d'un condensateur

circuit équivalent d'un condensateur composé d'un condensateur idéal en série avec l'inductance parasite et la résistance série équivalente (RSE)

Note 1 à l'article: Pour le fonctionnement en impulsion, la résistance série équivalente sera similaire, mais non identique à la RSE mesurée sous une tension sinusoïdale. La RSE en impulsions dépend des fréquences harmoniques contenues dans l'impulsion et de la variation des pertes selon la fréquence.

#### 2.2.20

charge assignée en alternatif

charge alternative sinusoïdale maximale qui peut être appliquée en permanence aux bornes d'un condensateur à toute température comprise entre la température de catégorie inférieure (2.2.10) et la température assignée (2.2.24)

#### 2.2.21

charge assignée en impulsions

charge maximale en impulsions qui peut être appliquée aux bornes d'un condensateur à une certaine fréquence de répétition des impulsions à toute température comprise entre la température de catégorie inférieure (2.2.10) et la température assignée (2.2.24)

#### 2.2.22

courant ondulé assigné

valeur efficace du courant alternatif maximal admissible d'une fréquence spécifiée, sous lequel le condensateur peut fonctionner de façon permanente à une température spécifiée

Note 1 à l'article: Dans la mesure où le courant ondulé générera une tension ondulée à travers le condensateur, il convient que la somme de la tension continue et de la valeur de crête de la tension alternative appliquée au condensateur ne dépasse pas la tension assignée ou, selon le cas, la tension corrigée en fonction de la température.

#### 2.2.23

tension ondulée assignée

valeur efficace de la tension alternative maximale admissible d'une fréquence spécifiée superposée à la tension continue à laquelle le condensateur peut fonctionner de façon permanente à une température spécifiée

Note 1 à l'article: Il convient que la somme de la tension continue et de la valeur de crête de la tension alternative appliquées au condensateur ne dépasse pas la tension assignée ou, selon le cas, la tension corrigée en fonction de la température.

#### 2.2.24

température assignée

température ambiante maximale à laquelle la tension assignée peut être appliquée de manière continue

2.2.25  
tension assignée

$U_R$

2.2.25.1  
tension continue assignée  
tension continue maximale pouvant être appliquée en permanence à un condensateur utilisé à la température assignée (2.2.24)

Note 1 à l'article: La tension continue maximale est la somme de la tension continue et de la valeur de crête de la tension alternative ou de la valeur de crête de la tension d'impulsion appliquées au condensateur.

2.2.25.2  
tension alternative assignée  
tension alternative efficace maximale pouvant être appliquée en permanence à un condensateur utilisé à la température assignée (2.2.24) et à une fréquence donnée

2.2.25.3  
tension assignée en impulsions  
valeur de crête de la tension d'impulsion dans une forme d'onde d'impulsion donnée, pouvant être appliquée en permanence à un condensateur utilisé à la température assignée (2.2.24)

2.2.26  
tension inverse  
<condensateur polarisé> tension appliquée aux bornes du condensateur dans le sens inverse de polarité

Note 1 à l'article: La tension inverse s'applique aux condensateurs polarisés uniquement.

2.2.27  
autocicatrisation  
processus par lequel les propriétés électriques d'un condensateur sont, après une perforation locale du diélectrique, rapidement et essentiellement rétablies aux valeurs existant avant la perforation

2.2.28  
modèle  
subdivision d'un type (2.2.39), généralement basée sur des facteurs dimensionnels, qui peut inclure plusieurs variantes, généralement d'ordre mécanique

2.2.29  
sous-famille  
<composants électroniques> groupe de composants d'une famille (2.2.7), fabriqués par des méthodes technologiques similaires

2.2.30  
condensateur pour montage en surface  
condensateur fixe dont les petites dimensions et la nature ou la forme des bornes rendent approprié son montage dans des circuits hybrides et en surface des cartes imprimées

2.2.31  
rapport de surtension  
quotient de la tension instantanée maximale qui peut être appliquée aux bornes du condensateur, pour une durée spécifiée, à toute température à l'intérieur de la plage des températures de catégorie (2.2.4) par, selon le cas, la tension assignée (2.2.25) ou la tension corrigée en fonction de la température (2.2.36)

### 2.2.32

tangente de l'angle de pertes

$\tan \delta$

rapport de la perte de puissance du condensateur à la puissance réactive du condensateur, lorsqu'une tension sinusoïdale de fréquence spécifiée est appliquée à ses bornes

### 2.2.33

caractéristiques capacité/température

variation maximale de capacité qui se produit sur une plage donnée de températures à l'intérieur de la plage des températures de catégorie (2.2.4) du condensateur

Note 1 à l'article: Cette caractéristique s'applique principalement aux condensateurs dont les variations de capacité en fonction de la température, variations linéaires ou non linéaires, ne peuvent pas être exprimées avec précision et certitude.

Note 2 à l'article: Cette caractéristique s'exprime normalement en pourcentage de la valeur de capacité à la température de référence de 20 °C.

### 2.2.34

coefficient de température de la capacité

$\alpha$

rapport de la variation de capacité, mesurée aux extrémités d'une plage spécifiée de températures, à la variation de température la provoquant

Note 1 à l'article: Cette propriété s'applique aux condensateurs dont les variations de capacité en fonction de la température sont linéaires ou approximativement linéaires, et peut être énoncée avec une certaine précision.

Note 2 à l'article: Ce coefficient s'exprime normalement en millièmes par Kelvin ( $10^{-6}/K$ ).

### 2.2.35

dérive de capacité après cycle thermique

variation irréversible maximale de capacité observée à la température ambiante pendant ou après l'exécution d'un nombre spécifié de cycles de température

Note 1 à l'article: Cette propriété s'applique aux condensateurs dont les variations de capacité en fonction de la température sont linéaires ou approximativement linéaires, et peut être énoncée avec une certaine précision.

Note 2 à l'article: Cette dérive s'exprime généralement en pourcentage de la valeur de capacité à la température de référence, laquelle est normalement de 20 °C.

### 2.2.36

tension corrigée en fonction de la température

tension maximale pouvant être appliquée de façon permanente aux bornes d'un condensateur à toute température comprise entre la température assignée (2.2.24) et la température de catégorie supérieure (2.2.41)

Note 1 à l'article: Se reporter à 2.3.6.

### 2.2.37

échauffement

élévation de la température du condensateur par rapport à la température ambiante résultant des pertes internes dues au fonctionnement sous tension alternative, en impulsions ou dans des conditions de charge/décharge

### 2.2.38

constante de temps

$\tau$

produit de la résistance d'isolement par la capacité

Note 1 à l'article: La constante de temps s'exprime normalement en secondes.

### 2.2.39

#### type

ensemble de composants de conception et de techniques de fabrication identiques, permettant de les prendre en compte soit en vue de procéder à une homologation, soit dans le cadre d'un contrôle de la conformité de la qualité

Note 1 à l'article: Ces composants font généralement l'objet d'une seule spécification particulière.

Note 2 à l'article: Des composants décrits dans plusieurs spécifications particulières peuvent, dans certains cas, être considérés comme appartenant à un même type.

### 2.2.40

#### condensateur non isolé

condensateur dont au moins une des bornes d'une section ne peut pas être portée à un potentiel différent (mais non inférieur à la tension assignée) de celui de toute surface conductrice avec laquelle le boîtier est susceptible d'entrer en contact en utilisation normale

### 2.2.41

#### température de catégorie supérieure

température ambiante maximale pour laquelle un condensateur a été conçu pour fonctionner de manière continue

### 2.2.42

#### dommage visible

dommage visible susceptible de réduire l'aptitude du condensateur à l'emploi pour lequel il a été prévu

## 2.3 Valeurs préférentielles et exigences techniques supplémentaires

### 2.3.1 Généralités

Chaque spécification intermédiaire doit spécifier les valeurs préférentielles appropriées à la sous-famille; pour la capacité nominale, voir aussi 2.3.2.

### 2.3.2 Valeurs préférentielles de la capacité nominale

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale doivent être prises dans les séries spécifiées dans l'IEC 60063.

### 2.3.3 Valeurs préférentielles de la tension assignée

Les valeurs préférentielles de la tension assignée sont les valeurs de la série R10 de l'ISO 3: 1,0 – 1,25 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,15 – 4,0 – 5,0 – 6,3 – 8,0 et leurs multiples décimaux ( $\times 10^n$ ,  $n$ : nombre entier).

### 2.3.4 Charge assignée en alternatif

La charge assignée en alternatif peut s'exprimer comme étant:

- une tension alternative assignée aux basses fréquences;
- un courant alternatif assigné aux fréquences élevées;
- une puissance réactive assignée aux fréquences intermédiaires (var).

Ceci est présenté à la Figure 1.

Pour un type particulier de condensateur, il peut être nécessaire de spécifier une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

Les condensateurs couverts par le domaine d'application de la présente norme ont normalement une puissance réactive inférieure à 500 var à une fréquence comprise entre

50 Hz et 60 Hz. Les fréquences basses peuvent être 50 Hz à 60 Hz, 100 Hz à 120 Hz ou 400 Hz. Les tensions efficaces peuvent atteindre 600 V à une fréquence comprise entre 50 Hz et 60 Hz. Cependant, il peut être exigé que des condensateurs pour filtres, pour circuits d'émetteur ou de convertisseur fonctionnent dans une large plage de fréquences sous une puissance allant jusqu'à 10 kvar aux plus hautes fréquences avec des tensions efficaces jusqu'à 1 000 V.

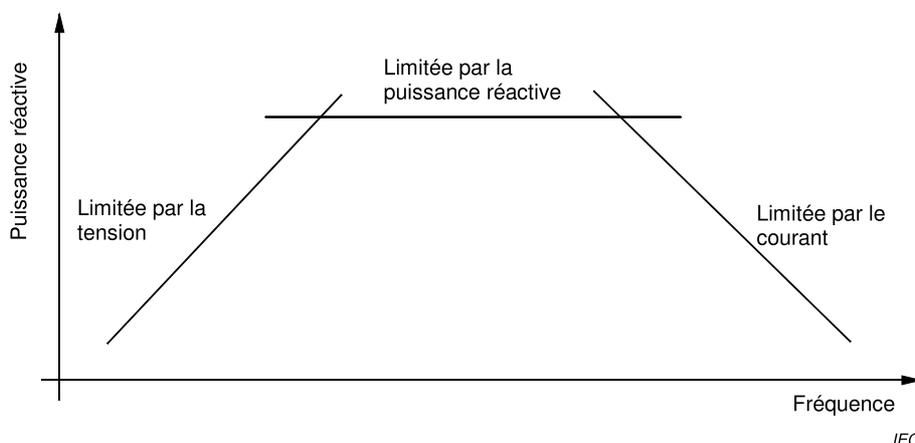


Figure 1 – Puissance réactive en fonction de la fréquence

### 2.3.5 Charge assignée en impulsions

La charge assignée en impulsions peut s'exprimer par les paramètres a) et b) et un ou plusieurs des autres paramètres ci-après :

- a) courant de crête par  $\mu\text{F}$  ou  $du/dt$  ( $\text{V}/\mu\text{s}$ );
- b) durées relatives des périodes de charge et de décharge;
- c) courant;
- d) tension de crête;
- e) tension inverse de crête;
- f) fréquence de répétition des impulsions;
- g) puissance active maximale.

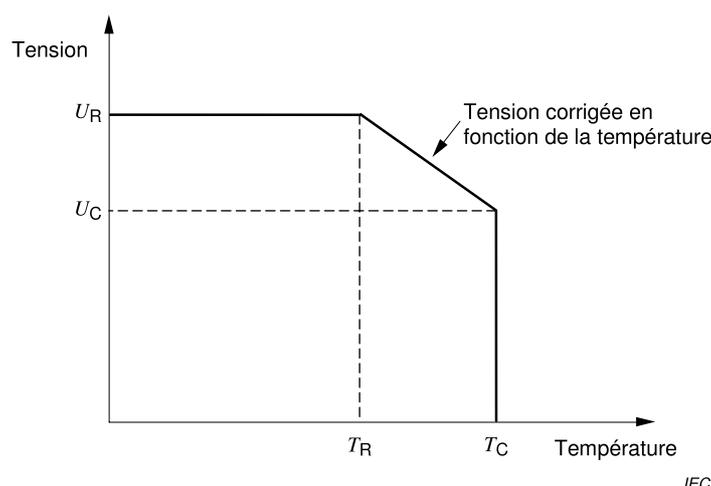
Ces paramètres sont fixés pour des impulsions périodiques.

Dans le cas d'impulsions intermittentes, il convient de spécifier le cycle de service. Dans le cas d'impulsions aléatoires, il convient de fixer le nombre total d'impulsions attendues pendant une période donnée.

Il convient de calculer le courant efficace en impulsions conformément au 3.2.17.5 de l'IEC 60469:2013. Dans le cas d'impulsions intermittentes ou aléatoires, il convient de choisir l'intervalle de temps de façon qu'il corresponde à l'échauffement maximal.

### 2.3.6 Tension corrigée en fonction de la température

Il convient que les informations sur la dépendance entre tension et température à des températures comprises entre la température assignée et la température de catégorie supérieure soient données, le cas échéant, dans la spécification applicable (voir Figure 2).



#### Légende

$U_R$  est la tension assignée

$U_C$  est la tension de catégorie

$T_R$  est la température assignée

$T_C$  est la température de catégorie

Figure 2 – Relation entre la plage des températures de catégorie et la tension appliquée

## 2.4 Marquage

### 2.4.1 Généralités

La spécification intermédiaire doit indiquer les critères d'identification et les autres informations devant être portées sur le condensateur et/ou l'emballage.

L'ordre de priorité du marquage des petits condensateurs doit être spécifié.

### 2.4.2 Codage

Lorsqu'un code est utilisé pour le marquage de la valeur de la capacité, de la tolérance ou de la date de fabrication, le code employé doit être choisi parmi ceux donnés dans l'IEC 60062.

## 3 Procédures d'assurance de la qualité

Voir l'Annexe Q.

## 4 Essais et procédures de mesure

Informations générales sur les essais et procédures de mesure	Para- graphe
Généralités	4.1
Conditions atmosphériques normalisées	4.2
Séchage	4.3
Stockage	4.25
Montage (pour les condensateurs pour montage en surface uniquement)	4.33
Essais et mesurages électriques	
Résistance d'isolement	4.5
Tension de tenue	4.6
Capacité	4.7
Tangente de l'angle de perte et résistance-série équivalente (RSE)	4.8
Courant de fuite	4.9
Impédance	4.10
Inductance et fréquence de résonance propre	4.11
Variation de la capacité avec la température	4.24
Surtension	4.26
Essai aux surintensités	4.39
Essais de charge et décharge et de courant d'appel	4.27
Absorption diélectrique	4.36
Surtension transitoire (pour condensateurs électrolytiques en aluminium à électrolyte non solide)	4.40
Essais et mesurages mécaniques	
Examen visuel et contrôle des dimensions	4.4
Sortie de l'armature extérieure	4.12
Robustesse des sorties	4.13
Vibrations	4.17
Secousses (chocs répétitifs)	4.18
Chocs	4.19
Étanchéité des boîtiers	4.20
Essai de cisaillement	4.34
Essai de pliage du substrat	4.35
Essais d'environnement et climatiques	
Variations rapides de température	4.16
Séquence climatique	4.21
Chaleur humide, essai continu	4.22
Endurance	4.23
Caractéristiques à haute et basse températures	4.29
Essai de stabilité thermique	4.30
Essai continu de chaleur humide accéléré	4.37
Essais relatifs à l'assemblage des composants	
Résistance à la chaleur de brasage	4.14
Brasabilité	4.15
Résistance au solvant des composants	4.31
Résistance au solvant du marquage	4.32
Essai sur le développement des trichites	4.41
Essai relatif à la sécurité	
Décharge de pression (pour les condensateurs électrolytiques en aluminium)	4.28
Inflammabilité passive	4.38

## 4.1 Généralités

La spécification intermédiaire et/ou la spécification particulière cadre doivent indiquer les essais à effectuer, les mesurages à effectuer avant et après chaque essai ou chaque sous-groupe d'essais et l'ordre dans lequel ces essais doivent être effectués. Les étapes de chaque essai doivent être effectuées dans l'ordre indiqué. Les conditions de mesure doivent être les mêmes pour les mesurages initiaux et finaux.

Si les spécifications nationales d'un système d'assurance de la qualité incluent des méthodes différentes de celles indiquées dans les spécifications ci-dessus, elles doivent être décrites de façon détaillée.

Les limites données dans toutes les spécifications sont des limites absolues. Le principe prévoyant la prise en compte de l'incertitude de mesure doit être appliqué.

## 4.2 Conditions atmosphériques normalisées

### 4.2.1 Conditions atmosphériques normalisées d'essai

Sauf spécification contraire, tous les essais et mesurages doivent être effectués dans les conditions atmosphériques normalisées d'essai fixées au 4.3 de l'IEC 60068-1:2013.

- température: 15 °C à 35 °C;
- humidité relative: 25 % à 75 %;
- pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa.

Avant les mesurages, le condensateur doit être stocké à la température de mesure pendant un temps suffisant pour lui permettre d'atteindre cette température en tout point. La période spécifiée pour la reprise à la fin d'un essai est normalement suffisante.

Lorsque des mesurages sont effectués à une température différente de la température spécifiée, les résultats doivent, si nécessaire, être corrigés pour la température spécifiée. La température ambiante pendant les mesurages doit être indiquée dans le rapport d'essai. En cas de conflit, les mesurages doivent être répétés en utilisant une des températures d'arbitrage (conformément à 4.2.3) et d'autres conditions précisées dans la présente norme.

Lorsque des essais sont effectués en séquence, les mesurages finaux d'un essai peuvent être pris comme mesurages initiaux de l'essai suivant.

Pendant les mesurages, le condensateur ne doit pas être exposé aux courants d'air, au rayonnement solaire direct ou à d'autres influences susceptibles d'introduire des erreurs.

### 4.2.2 Conditions de reprise

Sauf spécification contraire, la reprise doit s'effectuer dans les conditions atmosphériques normalisées d'essai (4.2.1).

S'il est nécessaire de procéder à la reprise dans des conditions bien contrôlées, les conditions de reprise contrôlées du 4.4.2 de l'IEC 60068-1:2013 doivent être utilisées.

Sauf indication contraire donnée dans la spécification applicable, une durée de 1 h à 2 h doit être utilisée.

La définition de la reprise est telle que donnée au 3.4 de l'IEC 60068-1:2013, et elle est davantage restreinte pour les condensateurs, comme suit:

Lorsqu'une période de reprise est spécifiée comme étant, par exemple, de 1 h à 2 h, ceci signifie que le mesurage (ou autre action ultérieure) sur un lot de condensateurs peut débuter après 1 h et doit être terminé avant 2 h à partir du début de la période de reprise.

La méthode préférentielle pour spécifier une période de reprise se présente sous la forme "x h à y h".

#### 4.2.3 Conditions d'arbitrage

Pour les besoins d'arbitrage, une des conditions atmosphériques normalisées pour les essais d'arbitrage du 4.2 de l'IEC 60068-1:2013, présentées dans le Tableau 1 ci-dessous, doit être choisie.

Tableau 1 – Conditions d'arbitrage

Température	Humidité relative	Pression atmosphérique
°C	%	kPa
20 ± 1	63 à 67	86 à 106
23 ± 1	48 à 52	86 à 106
25 ± 1	48 à 52	86 à 106
27 ± 1	63 à 67	86 à 106

#### 4.2.4 Conditions de référence

Pour les références, les conditions atmosphériques normalisées de référence du 4.1 de l'IEC 60068-1:2013 s'appliquent:

- température: 20 °C;
- pression atmosphérique: 101,3 kPa.

#### 4.3 Séchage

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le condensateur doit être conditionné pendant  $96 \text{ h} \pm 4 \text{ h}$  par un chauffage dans un four à circulation d'air porté à une température de  $55 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$  et dont l'humidité relative ne dépasse pas 20 %.

Le condensateur doit ensuite être mis à refroidir dans un dessiccateur contenant un dessiccant approprié, tel que de l'alumine activée ou du gel de silice, et doit y être maintenu depuis la sortie du four jusqu'au début des essais spécifiés.

#### 4.4 Examen visuel et contrôle des dimensions

##### 4.4.1 Examen visuel

L'examen visuel doit montrer que l'état de la pièce, l'exécution et la finition sont satisfaisants (voir 2.2.42).

Le marquage doit être lisible à l'examen visuel et doit être conforme aux exigences de la spécification particulière.

##### 4.4.2 Dimensions (calibrage)

Les dimensions indiquées dans la spécification particulière, appropriées au calibrage, doivent être vérifiées, et elles doivent être conformes aux valeurs précisées dans la spécification particulière.

Lorsque cela est applicable, les mesurages doivent être effectués conformément à l'IEC 60294 ou à l'IEC 60717.

#### 4.4.3 Dimensions (détail)

Toutes les dimensions précisées dans la spécification particulière doivent être vérifiées et doivent être conformes aux valeurs indiquées.

#### 4.5 Résistance d'isolement

##### 4.5.1 Préconditionnement

Avant d'effectuer ce mesurage, les condensateurs doivent être complètement déchargés.

##### 4.5.2 Conditions de mesure

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la résistance d'isolement doit être mesurée sous la tension spécifiée dans le Tableau 2.

La résistance d'isolement doit être mesurée après que la tension a été appliquée pendant  $60 \text{ s} \pm 5 \text{ s}$ , sauf indication contraire dans la spécification particulière.

Tableau 2 – Mesurage de la résistance d'isolement

Caractéristiques assignées de tension du condensateur V	Tension de mesure V
$U_R$ ou $U_c < 10$	$U_R$ ou $U_c \pm 10 \%$
$10 \leq U_R$ ou $U_c < 100$	$10 \pm 1^a$
$100 \leq U_R$ ou $U_c < 500$	$100 \pm 15$
$500 \leq U_R$ ou $U_c$	$500 \pm 50$
<sup>a</sup> Lorsqu'il peut être démontré que la tension n'a pas d'influence sur le résultat de la mesure, ou qu'une relation connue existe, les mesurages peuvent être effectués à des tensions pouvant atteindre, selon le cas, la tension assignée ou la tension de catégorie. En cas de litige, la tension de 10 V doit être utilisée, sauf indication contraire dans la spécification intermédiaire.	

$U_R$  est la tension assignée utilisée pour définir la tension de mesure à utiliser dans des conditions atmosphériques normalisées d'essai.

$U_C$  est la tension de catégorie utilisée pour définir la tension de mesure à utiliser lorsque l'essai est effectué à la température de catégorie supérieure.

##### 4.5.3 Points d'essai

La résistance d'isolement doit être mesurée entre les points de mesure définis au Tableau 3, indiqués dans la spécification applicable.

L'essai A, entre sorties, s'applique à tous les condensateurs, isolés et non isolés.

L'essai B, isolation interne, s'applique aux condensateurs isolés en boîtier métallique non isolé et aux condensateurs multiples isolés et non isolés.

L'essai C, isolation externe, s'applique aux condensateurs isolés en boîtier non métallique ou en boîtier métallique isolé. Pour cet essai, la tension de mesure doit être appliquée en utilisant l'une des trois méthodes suivantes, comme cela est indiqué dans la spécification applicable.

#### 4.5.4 Méthodes d'essai

##### 4.5.4.1 Méthode de la feuille métallique

Une feuille métallique doit être enroulée étroitement autour du corps du condensateur.

Pour les condensateurs à sorties axiales, cette feuille doit dépasser d'au moins 5 mm à chaque extrémité, à condition qu'un espace minimal de 1 mm puisse être maintenu entre la feuille métallique et les sorties. Si cet espace minimal ne peut être assuré, la dimension de la feuille doit être réduite d'autant qu'il sera nécessaire pour ménager un espace de 1 mm.

Pour les condensateurs à sorties unilatérales, une distance minimale de 1 mm doit être maintenue entre le bord de la feuille et chaque sortie.

##### 4.5.4.2 Méthode pour les condensateurs comportant des dispositifs de montage

Le condensateur doit être monté de façon normale sur une plaque métallique dépassant d'au moins 12,7 mm, dans toutes les directions, la face de montage du condensateur.

##### 4.5.4.3 Méthode du bloc métallique en V

Le condensateur doit être calé dans le fond d'un bloc métallique en V ouvert à 90° de dimensions telles que le corps du condensateur ne dépasse pas les extrémités du bloc.

La force appliquée pour caler le condensateur doit être telle qu'elle garantisse un contact adéquat entre le condensateur et le bloc.

Le condensateur doit être placé conformément aux dispositions suivantes:

- a) condensateurs cylindriques: le condensateur doit être placé dans le bloc de telle sorte que la sortie la plus éloignée de l'axe du condensateur soit au plus près de l'une des faces du bloc;
- b) condensateurs rectangulaires: le condensateur doit être placé dans le bloc de telle sorte que la sortie la plus proche du bord du condensateur soit au plus près de l'une des faces du bloc.

Pour les condensateurs cylindriques et rectangulaires à sorties axiales, tout décentrement éventuel des sorties au point où elles sortent du corps du condensateur doit être ignoré.

#### 4.5.5 Compensation de température

Lorsque cela est indiqué dans la spécification particulière, la température à laquelle le mesurage est réalisé doit être notée. Si cette température diffère de 20 °C, une correction doit être apportée à la valeur mesurée en multipliant la valeur par le facteur de correction approprié indiqué dans la spécification intermédiaire.

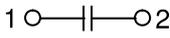
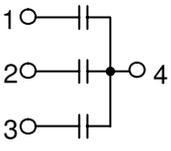
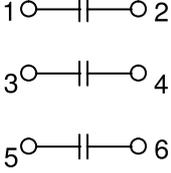
#### 4.5.6 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- a) les points de mesure et la tension de mesure correspondant à chacun de ces points;
- b) la méthode d'application de la tension (l'une de celles décrites en 4.5.4);
- c) le temps d'électrification, s'il est différent de 1 min;

- d) toute précaution spéciale à prendre pendant les mesurages;
- e) tous les facteurs de correction exigés pour les mesurages à l'intérieur de la plage des températures couverte par les conditions atmosphériques normalisées d'essai;
- f) la température de mesure, si elle est différente des conditions atmosphériques normalisées d'essai;
- g) la valeur minimale de la résistance d'isolement pour les différents points de mesure (voir le Tableau 3).

Tableau 3 – Points de mesure

Essai	Applicabilité:	1: Condensateurs simples  par exemple 	2: Condensateurs multiples dont tous les éléments ont une sortie commune  par exemple 	3: Condensateurs multiples dont les éléments n'ont pas de sortie commune  par exemple 
A. Entre sorties <sup>a</sup>	Tous condensateurs	1a: Entre sorties (1-2)	2a: Entre la sortie commune et chacune des autres sorties (1-4, 2-4, 3-4)	3a: Entre les sorties de chaque élément (1-2, 3-4, 5-6)
B. Isolation interne	Condensateurs simples et multiples isolés en boîtier métallique non isolé (1b, 2b, 3b)	1b: Entre les sorties reliées entre elles et le boîtier [(1 à 2)- boîtier]	2b: Entre toutes les sorties reliées entre elles et le boîtier [(1 à 4)- boîtier]	3b: Entre toutes les sorties reliées entre elles et le boîtier [(1 à 6)- boîtier]
	Condensateurs multiples isolés et non isolés (2c et 3c)		2c: Entre la sortie non commune de chaque élément et toutes les autres sorties reliées entre elles par exemple [2-(1, 3, 4)]	3c: Entre les sorties de chacun des éléments pris deux à deux, les deux sorties de chaque élément étant reliées entre elles par exemple [(1 à 2)-(3 à 6)]
C. Isolation externe	Condensateurs isolés en boîtier non métallique ou en boîtier métallique isolé	1c: Entre les deux sorties reliées entre elles et, selon le cas, la feuille métallique, la plaque métallique ou le bloc métallique en V  [(1 à 2)- gabarit métallique]	2d:  [(1 à 4)- gabarit métallique]	3d:  [(1 à 6)- gabarit métallique]
			Entre toutes les sorties reliées entre elles et, selon le cas: la feuille métallique, la plaque métallique ou le bloc métallique en V	
<sup>a</sup> Lorsqu'un condensateur a plus de deux sorties, les points de mesure sont les deux sorties isolées l'une de l'autre par l'élément diélectrique du condensateur. Par exemple, pour un condensateur de traversée coaxiale, il convient que les points de mesure soient l'une des sorties reliées au conducteur central et au boîtier métallique coaxial ou à la face de montage.				

## 4.6 Tension de tenue

### 4.6.1 Généralités

L'essai spécifié ci-après est un essai en courant continu. Lorsqu'un essai en courant alternatif est appliqué, le circuit d'essai doit être indiqué dans la spécification applicable.

### 4.6.2 Circuit d'essai (pour l'essai entre sorties)

Les éléments du circuit d'essai doivent être tels que les conditions concernant les courants de charge et de décharge et la constante de temps à la charge, indiqués dans la spécification applicable, soient maintenues.

La Figure 3 spécifie les caractéristiques d'un circuit d'essai approprié.

La résistance du voltmètre ne doit pas être inférieure à 10 000  $\Omega/V$ .

La résistance  $R_1$  comprend la résistance interne de la source de tension.

Les résistances  $R_1$  et  $R_2$  doivent avoir une valeur suffisante pour limiter le courant de charge et de décharge à la valeur indiquée dans la spécification applicable.

La capacité du condensateur  $C_1$  doit être au moins dix fois plus grande que la capacité du condensateur en essai.

Le cas échéant, la constante de temps  $R_1 \times (C_X + C_1)$  doit être inférieure ou égale à la valeur indiquée dans la spécification applicable.

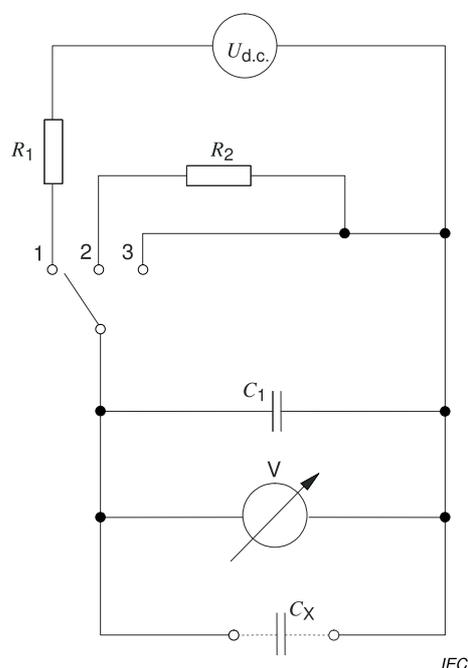


Figure 3 – Circuit d'essai de tension de tenue

Le condensateur  $C_1$  peut être omis pour l'essai de certains types de condensateurs. Il convient que cela soit fixé dans la spécification intermédiaire.

### 4.6.3 Essai

#### 4.6.3.1 Généralités

L'essai comprend, selon le cas, une ou plusieurs parties, conformément au Tableau 3 et aux exigences de la spécification applicable.

L'application répétée de l'essai de tension de tenue peut endommager le condensateur de façon irréversible, et il convient de l'éviter dans la mesure du possible.

#### 4.6.3.2 Essai A – Entre sorties

##### 4.6.3.2.1 Points d'essai

La tension d'essai est appliquée aux points 1a, 2a, 3a du Tableau 3, selon les exigences de la spécification applicable.

##### 4.6.3.2.2 Procédure

Le commutateur étant placé en position 2, relier les deux bornes représentées à la Figure 3 à une source de tension continue réglable de puissance suffisante et réglée à la valeur de la tension d'essai exigée.

Relier le condensateur à soumettre aux essais ( $C_X$ ) au circuit d'essai, comme indiqué sur la Figure 3.

Placer le commutateur en position 1 de façon à charger les condensateurs  $C_1$  et  $C_X$  à travers  $R_1$ .

Le commutateur reste dans cette position pendant le temps spécifié après que la tension d'essai a été atteinte.

Décharger les condensateurs  $C_1$  et  $C_X$  à travers  $R_2$  en plaçant le commutateur en position 2. Dès que le voltmètre est revenu à zéro, mettre les condensateurs en court-circuit en plaçant le commutateur en position 3 et déconnecter le condensateur  $C_X$ .

#### 4.6.3.3 Essai B – Isolation interne

##### 4.6.3.3.1 Points d'essai

La tension d'essai est appliquée aux points 1b, 2b, 2c, 3b, 3c du Tableau 3, selon les exigences de la spécification applicable.

##### 4.6.3.3.2 Procédure

La tension d'essai spécifiée est appliquée instantanément à travers la résistance interne de l'alimentation pendant le temps indiqué dans la spécification applicable. Pour le point 2c, utiliser le circuit d'essai et la procédure indiquée pour l'essai entre sorties (4.6.2 et 4.6.3.2).

#### 4.6.3.4 Essai C – Isolation externe (applicable uniquement aux condensateurs isolés dans un boîtier non métallique ou dans un boîtier métallique isolé)

##### 4.6.3.4.1 Points d'essai

La tension d'essai est appliquée aux points 1c, 2d ou 3d en utilisant, pour l'application de la tension, l'une des trois méthodes suivantes, selon les exigences de la spécification applicable.

##### 4.6.3.4.2 Méthode de la feuille métallique

Une feuille métallique doit être enroulée étroitement autour du corps du condensateur.

Pour les condensateurs à sorties axiales, cette feuille doit dépasser d'au moins 5 mm à chaque extrémité, à condition qu'un espace minimal de 1 mm/kV puisse être maintenu entre la feuille métallique et les sorties. Si cet espace ne peut être maintenu, le dépassement de la feuille doit être réduit autant qu'il est nécessaire pour établir l'espace de 1 mm/kV de tension d'essai.

Pour les condensateurs à sorties unilatérales, une distance minimale de 1 mm/kV doit être maintenue entre le bord de la feuille et chaque sortie.

En aucun cas, la distance entre la feuille et les sorties ne doit être inférieure à 1 mm.

#### 4.6.3.4.3 Méthode pour les condensateurs comportant des dispositifs de montage

Le condensateur doit être monté de façon normale sur une plaque métallique dépassant d'au moins 12,7 mm, dans toutes les directions, la face de montage du condensateur.

#### 4.6.3.4.4 Méthode du bloc métallique en V

Le condensateur doit être calé dans le fond d'un bloc métallique en V ouvert à 90° de dimensions telles que le corps du condensateur ne dépasse pas les extrémités du bloc.

La force appliquée pour caler le condensateur doit être telle qu'elle assure un contact adéquat entre le condensateur et le bloc.

Le condensateur doit être placé conformément aux dispositions suivantes:

- a) condensateurs cylindriques: le condensateur doit être placé dans le bloc de telle sorte que la sortie la plus éloignée de l'axe du condensateur soit au plus près de l'une des faces du bloc;
- b) condensateurs rectangulaires: le condensateur doit être placé dans le bloc de telle sorte que la sortie la plus proche du bord du condensateur soit au plus près de l'une des faces du bloc.

Pour les condensateurs cylindriques et rectangulaires à sorties axiales, tout décentrement éventuel de la sortie au point où elle sort du corps du condensateur doit être ignoré.

#### 4.6.3.4.5 Procédure

La tension d'essai spécifiée est appliquée instantanément à travers la résistance interne de la source d'alimentation et pendant le temps indiqué dans la spécification applicable.

#### 4.6.4 Exigences

Pour chacun des points d'essai spécifiés, il ne doit y avoir aucun signe de claquage ni de contournement pendant la période d'essai.

#### 4.6.5 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- a) les points d'essai (voir Tableau 3) et la tension d'essai correspondant à chacun de ces points;
- b) pour l'essai d'isolation externe (essai C), la méthode d'application de la tension d'essai (l'une de celles décrites en 4.6.3.4);
- c) la durée d'application de la tension;
- d) le courant maximal de charge et de décharge;
- e) le cas échéant, la valeur maximale de la constante de temps à la charge ( $R_1 \times (C_1 + C_X)$ ).

## 4.7 Capacité

### 4.7.1 Fréquence de mesure et tension de mesure

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la capacité doit être mesurée à l'une des fréquences suivantes:

- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| – condensateurs électrolytiques: |  | 100 Hz à 120 Hz  |
| – autres condensateurs:          | $C_N \leq 1 \text{ nF}$ :                          | 100 kHz, 1 MHz ou 10 MHz<br>(la référence doit être 1 MHz) |
|                                  | $1 \text{ nF} < C_N \leq 10 \text{ }\mu\text{F}$ : | 1 kHz ou 10 kHz<br>(la référence doit être 1 kHz)          |
|                                  | $C_N > 10 \text{ }\mu\text{F}$ :                   | 50 Hz (60 Hz) ou 100 Hz (120 Hz)                           |

La tolérance sur toutes les fréquences dans le cadre des mesurages ne doit pas dépasser  $\pm 20 \%$ .

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la tension de mesure ne doit pas être supérieure à 3 % d' $U_R$  ou 5 V, selon la plus faible des deux valeurs.

### 4.7.2 Équipement de mesure

L'exactitude de l'équipement de mesure doit être telle que l'erreur n'excède pas:

- pour les mesures absolues de capacité: 10 % de la tolérance de capacité ou 2 % de la mesure absolue, la plus petite de ces deux valeurs étant applicable;
- pour les mesures de variation de capacité: 10 % de la variation maximale de capacité spécifiée.

Dans aucun des deux cas a) et b) ci-dessus, il n'est nécessaire que l'exactitude soit meilleure que l'erreur absolue minimale de mesure (par exemple 0,5 pF) indiquée dans la spécification applicable.

### 4.7.3 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- la température de mesure si elle diffère des conditions atmosphériques normalisées d'essai;
- les fréquences de mesure et la plage de capacité auxquelles elles s'appliquent, si elles sont différentes de celles qui sont spécifiées en 4.7.1;
- l'erreur absolue de mesure, lorsque cela est applicable (par exemple 0,5 pF);
- la tension de mesure, si elle diffère de celle qui est spécifiée en 4.7.1;
- le cas échéant, la tension de polarisation appliquée.

## 4.8 Tangente de l'angle de perte et résistance-série équivalente (RSE)

### 4.8.1 Tangente de l'angle de perte

#### 4.8.1.1 Fréquence de mesure

La tangente de l'angle de perte doit être mesurée dans les mêmes conditions que celles indiquées pour le mesurage de la capacité à une ou plusieurs fréquences prises dans la liste de 4.7.1 et précisées dans la spécification applicable.

#### 4.8.1.2 Exactitude de mesure

Sauf indication contraire dans la spécification intermédiaire, la méthode de mesure doit être telle que l'erreur ne dépasse pas 10 % de la valeur spécifiée ou 0,000 3, selon la plus grande des deux valeurs.

#### 4.8.2 Résistance-série équivalente (RSE)

##### 4.8.2.1 Fréquence de mesure

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la résistance-série équivalente doit être mesurée à l'une des fréquences suivantes:

50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz et 10 MHz.

##### 4.8.2.2 Exactitude de mesure

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, l'exactitude de l'équipement de mesure doit être telle que l'erreur ne dépasse pas 10 % de l'exigence.

##### 4.8.2.3 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer

- a) la fréquence de mesure;
- b) l'erreur absolue de mesure;
- c) la tension de mesure, si différente de celle spécifiée en 4.7.1;
- d) la tension de polarisation appliquée, si applicable;
- e) la température à laquelle les mesurages doivent être effectués, si différente de celle des conditions atmosphériques normalisées d'essai.

#### 4.9 Courant de fuite

##### 4.9.1 Préconditionnement

Avant d'effectuer ce mesurage, les condensateurs doivent être complètement déchargés.

##### 4.9.2 Méthode d'essai

Le courant de fuite doit être mesuré, sauf indication contraire dans la spécification applicable, sous la tension continue ( $U_R$  ou  $U_C$ ) appropriée à la température de l'essai, après une période d'électrisation ne dépassant pas 5 min. Il n'est pas nécessaire d'appliquer la tension pendant la totalité des 5 min si le courant de fuite spécifié est atteint dans un temps plus court.

##### 4.9.3 Source d'alimentation

Dans le cadre d'un essai, une source d'alimentation stable telle qu'une alimentation stabilisée doit être utilisée.

##### 4.9.4 Exactitude de mesure

L'erreur de mesure ne doit pas être supérieure à  $\pm 5$  % ou 0,1  $\mu\text{A}$ , selon la plus grande des deux valeurs.

##### 4.9.5 Circuit d'essai

Lorsque la spécification applicable le précise, une résistance de protection de 1 000  $\Omega$  doit être placée en série avec le condensateur pour limiter le courant de charge.

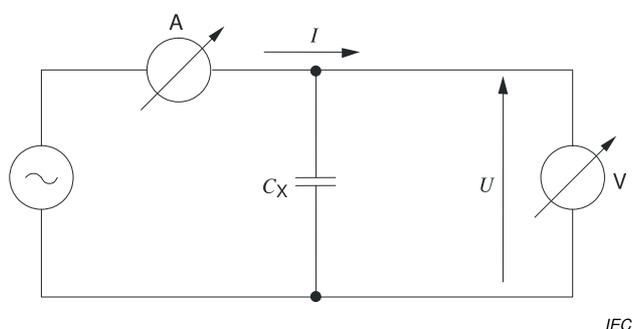
#### 4.9.6 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- la limite du courant de fuite à la température de référence de 20 °C, et à d'autres températures spécifiées;
- si nécessaire, le facteur de correction, lorsque les mesurages sont effectués à une température située dans la plage des températures correspondant aux conditions atmosphériques normalisées d'essai, mais différente de 20 °C;
- le temps d'électrisation, s'il diffère de 5 min;
- si une résistance de protection de 1 000 Ω doit ou ne doit pas être placée en série avec le condensateur pour limiter le courant de charge, comme cela est défini en 4.9.5.

#### 4.10 Impédance

L'impédance doit être mesurée par la méthode utilisant un voltmètre et un ampèremètre, conformément au circuit de la Figure 4, ou circuit équivalent.



#### Légende

$C_X$	capacité de l'éprouvette
$U$	tension de mesure
$I$	courant de mesure
A	ampèremètre
V	voltmètre

Figure 4 – Schéma de principe du circuit de mesure de l'impédance

L'impédance  $Z_X$  du condensateur  $C_X$  est donnée par  $Z_X = \frac{U}{I}$ .

La fréquence de la tension de mesure doit être de préférence choisie parmi les valeurs suivantes:

50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz et 10 MHz.

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, l'exactitude de l'équipement de mesure doit être telle que l'erreur ne dépasse pas 10 % de l'exigence.

Aux fréquences supérieures à 120 Hz, des précautions sont nécessaires pour éviter des erreurs survenant du fait de courants vagabonds. Il convient que le courant traversant le condensateur soit limité, de telle sorte que le résultat de mesure ne soit pas modifié de façon significative par l'échauffement du condensateur.

La spécification applicable doit indiquer:

- a) la fréquence de mesure;
- b) la ou les températures auxquelles les mesurages doivent être effectués;
- c) les limites de l'impédance ou du rapport des impédances mesuré à des températures différentes.

#### 4.11 Inductance et fréquence de résonance propre

##### 4.11.1 Fréquence de résonance propre ( $f_r$ )

###### 4.11.1.1 Généralités

Pour ce mesurage, trois méthodes sont décrites. La première méthode est d'application générale, les autres méthodes peuvent convenir particulièrement pour le mesurage de certains types de condensateurs de faible capacité.

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, l'exactitude de l'équipement de mesure doit être telle que l'erreur ne dépasse pas 10 % de l'exigence.

###### 4.11.1.2 Méthode 1

La plus basse fréquence à laquelle l'impédance passe par un minimum doit être déterminée en utilisant la méthode de mesure de l'impédance de 4.10 et une source de fréquence variable. Cette fréquence est la fréquence de résonance propre.

Lorsqu'il est difficile de déterminer de façon précise la fréquence à laquelle l'impédance passe par un minimum, un phasemètre peut être utilisé pour comparer la phase de la tension aux bornes du condensateur avec la phase de la tension aux bornes d'une résistance faiblement inductive placée en série avec le condensateur. La fréquence de résonance est alors la fréquence à laquelle il n'y a pas de différence de phase. Un Q-mètre peut être utilisé pour cet usage.

###### 4.11.1.3 Méthode 2

###### 4.11.1.3.1 Généralités

Pour cette méthode de mesure, un ondemètre-oscillateur à absorption (ondemètre à absorption) doit être utilisé.

###### 4.11.1.3.2 Montage des condensateurs munis de sorties pour utilisation générale

Quatre condensateurs de valeurs presque égales et de configuration semblable doivent être brasés en série à angle droit pour former une boucle fermée. Les fils doivent avoir la longueur spécifiée et aucun autre câblage ni aucune autre connexion ne doivent être employés (voir Figure 5). Cette boucle doit être couplée de façon aussi lâche que possible à un ondemètre-oscillateur à absorption et la fréquence de résonance doit ensuite être déterminée.

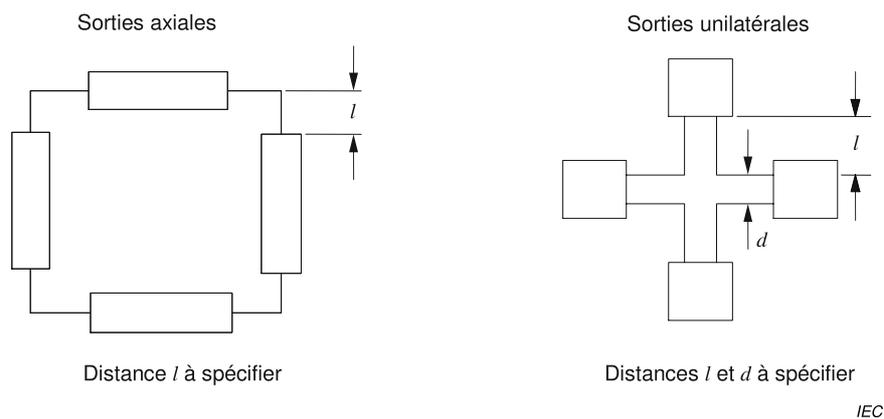


Figure 5 – Disposition de montage des condensateurs

#### 4.11.1.3.3 Montage des condensateurs munis de sorties pour utilisation sur circuit imprimé

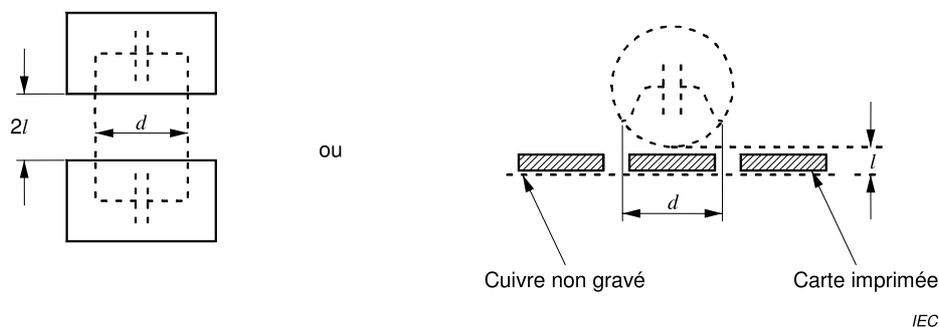
Pour déterminer la fréquence de résonance dans les conditions de montage du condensateur sur un circuit imprimé et lorsque la configuration du boîtier et/ou des sorties n'autorise pas la formation correcte d'une boucle de quatre condensateurs, la boucle doit être constituée de deux condensateurs (presque) identiques ayant des sorties droites de longueur spécifiée (voir Figure 6).

Le second condensateur peut être remplacé par son image dans une plaque conductrice servant de miroir, de la façon suivante:

Un support de circuit imprimé dont le cuivre n'est pas gravé et dont les bords ont une dimension au moins trois fois supérieure à la dimension maximale du condensateur, est percé en son centre pour que le condensateur puisse être monté normalement.

La spécification applicable doit préciser les détails du montage. Le condensateur est brasé de telle sorte qu'il soit court-circuité par la feuille de cuivre. Le condensateur est ensuite couplé à la bobine d'exploration de l'ondemètre et le mesurage est effectué comme en 4.11.1.3.5.

Pour les condensateurs en boîtier métallique, il peut être nécessaire d'utiliser des dispositions spéciales pour le couplage. Il convient que ces dispositions soient précisées dans la spécification applicable.



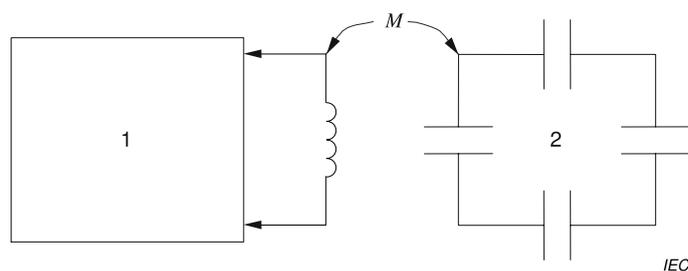
Distances  $l$  et  $d$  à spécifier, où  $l$  doit être mesurée à partir du plan d'appui.

Figure 6 – Disposition de montage des condensateurs

#### 4.11.1.3.4 Description de la méthode

L'ondemètre-oscillateur à absorption est un oscillateur L-C à fréquence variable dont l'inductance est constituée d'une bobine d'exploration extérieure. Lorsque la bobine d'exploration est couplée à un autre circuit résonant, la puissance est absorbée, provoquant une variation de la tension moyenne de grille (grille de transistor à effet de champ). Cette tension qui est contrôlée baisse donc brutalement (creux de tension) à la fréquence de résonance du circuit couplé. Ce circuit couplé est constitué de quatre condensateurs montés comme décrit en 4.11.1.3.2 et connectés en série pour réduire à sa valeur minimale l'inductance mutuelle.

Un schéma typique représentant l'utilisation d'un ondemètre-oscillateur à absorption est donné à la Figure 7.



#### Légende

- 1 ondemètre-oscillateur à absorption (ondemètre à absorption)
- 2 circuit résonant couplé
- $M$  facteur de couplage

Figure 7 – Schéma typique d'un ondemètre-oscillateur à absorption

#### 4.11.1.3.5 Utilisation de l'ondemètre-oscillateur à absorption

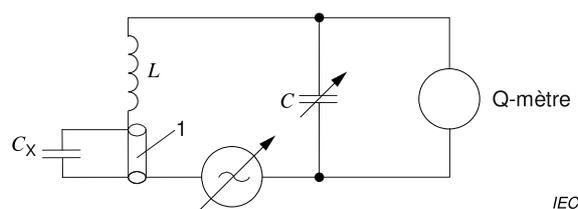
La bobine d'exploration de l'ondemètre étant proche des condensateurs en mesure, la fréquence de résonance est atteinte progressivement en partant d'une fréquence plus basse. Il convient de vérifier toute baisse brutale en éloignant l'ondemètre des condensateurs (en réduisant la puissance absorbée), afin de s'assurer que cette baisse brutale n'est pas due à un effet propre à l'ondemètre. Il convient de mesurer la fréquence de résonance avec un couplage aussi faible que possible pour éviter la dérive de l'oscillateur.

#### 4.11.1.3.6 Exigences

La fréquence de résonance ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la spécification applicable.

#### 4.11.1.4 Méthode 3

Cette méthode convient particulièrement aux condensateurs de faible capacité et de fréquence de résonance propre comprise dans la plage de fonctionnement du Q-mètre. En utilisant un Q-mètre et le circuit indiqué à la Figure 8, la fréquence la plus basse à laquelle la même fréquence de résonance est obtenue doit être déterminée, que la barrette de court-circuit du condensateur soit en place ou non. Il peut être indiqué que cette fréquence est égale à la fréquence de résonance propre du condensateur.



## Légende

1	barrette de court-circuit
$C_X$	condensateur en essai
$C$	condensateur variable
$L$	inductance
Q	Q-mètre

Figure 8 – Schéma de principe du circuit de mesure

## 4.11.2 Inductance

L'inductance en série  $L_X$  d'un condensateur est calculée à partir de la fréquence de résonance propre mesurée du condensateur  $f_r$ , en utilisant la formule suivante:

$$L_X = \frac{1}{4\pi^2 \times f_r^2 \times C_X}$$

où  $C_X$  est la capacité du condensateur mesurée conformément à 4.7 et aux exigences de la spécification intermédiaire applicable.

## 4.11.3 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- la méthode préférentielle;
- la longueur des fils du condensateur devant être employée pour le mesurage;
- tout dispositif spécial de montage;
- les limites de l'inductance en série ou de la fréquence de résonance propre.

## 4.12 Sortie de l'armature extérieure

L'indication correcte de la sortie reliée à l'armature métallique extérieure doit être vérifiée par une méthode ne détériorant pas le condensateur.

Une méthode convenable est donnée à la Figure 9.

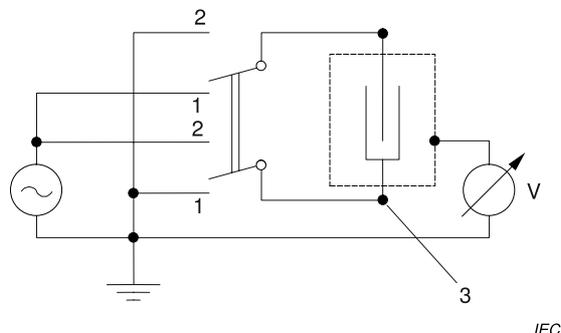
La fréquence du générateur peut être comprise entre 50 Hz et quelques milliers de Hertz et doit être choisie de telle sorte que le mesurage ait un résultat net, la valeur la plus appropriée dépendant du type de condensateur en essai.

La tension doit être de l'ordre de 10 V.

Le voltmètre doit avoir une impédance d'entrée de 1 M $\Omega$  ou plus.

La capacité parasite du câblage doit être faible.

Lorsque le commutateur est en position 1, la déviation du voltmètre doit être notablement plus faible que celle produite lorsque le commutateur est en position 2.



Légende

- 1, 2 bornes de commutation
- 3 sorties de l'armature extérieure
- V voltmètre

Figure 9 – Circuit d'essai

4.13 Robustesse des sorties

4.13.1 Généralités

Les condensateurs doivent être soumis aux essais  $U_{a1}$ ,  $U_b$ ,  $U_c$  et  $U_d$  de l'IEC 60068-2-21 selon le cas.

4.13.2 Essai  $U_{a1}$  – Traction

La force appliquée doit être:

- pour les sorties autres que des fils: 20 N;
- pour les fils de sortie: voir Tableau 4.

Tableau 4 – Force de traction

Section nominale ( $S$ ) <sup>a</sup> mm <sup>2</sup>	Diamètre correspondant ( $d$ ) pour les fils de section circulaire mm	Force avec une tolérance de $\pm 10\%$ N
$S \leq 0,05$	$d \leq 0,25$	1
$0,05 < S \leq 0,1$	$0,25 < d \leq 0,35$	2,5
$0,1 < S \leq 0,2$	$0,35 < d \leq 0,5$	5
$0,2 < S \leq 0,5$	$0,5 < d \leq 0,8$	10
$0,5 < S \leq 1,2$	$0,8 < d \leq 1,25$	20
$1,2 < S$	$1,25 < d$	40

<sup>a</sup> Pour les fils de section circulaire, méplats ou broches: la section nominale est égale à la valeur calculée à partir de la ou des dimensions nominales données dans la spécification applicable. Pour les fils à âme divisée, la section nominale est obtenue en prenant la somme des sections des différents brins du conducteur indiqué dans la spécification applicable.

#### 4.13.3 Essai Ub – Pliage (sur la moitié de l'échantillon)

Méthode 1: deux pliages doivent être successivement effectués dans chaque direction. Cet essai ne doit pas être appliqué aux sorties décrites comme rigides dans la spécification particulière.

#### 4.13.4 Essai Uc – Torsion (autre moitié de l'échantillon)

La méthode 1, sévérité 2 (deux rotations successives de 180°) doit être utilisée.

Cet essai ne doit pas être appliqué aux sorties décrites comme rigides dans la spécification particulière et aux composants à sorties unilatérales prévus pour être utilisés sur un câblage imprimé.

#### 4.13.5 Essai Ud – Couple

Cet essai doit être appliqué aux condensateurs pour des bornes à vis ou à goujons filetés, et aux dispositifs de montage incorporés. Le couple et la sévérité doivent être choisis dans le Tableau 5.

Tableau 5 – Couple

Sévérité	Couple Nm								
	Diamètre nominal du filetage mm								
	2,6	3	3,5	4	5	6	8	10	12
1	0,4	0,5	0,8	1,2	2,0	2,5	5	7	12
2	0,2	0,25	0,4	0,6	1,0	1,25	2,5	3,5	6

#### 4.13.6 Examen visuel

Après chacun de ces essais, les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté.

#### 4.14 Résistance à la chaleur de brasage

##### 4.14.1 Préconditionnement et mesurage initial

Lorsque la spécification applicable le précise, les condensateurs doivent être séchés en utilisant la méthode décrite au 4.3.

Les condensateurs doivent être mesurés comme cela est indiqué dans la spécification applicable.

##### 4.14.2 Procédure d'essai

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, un des essais suivants doit être appliqué de la façon indiquée dans la spécification applicable.

Les conditions d'essai doivent être définies dans la spécification applicable.

- a) Pour tous les condensateurs, à l'exception de ceux relevant des points b) et c) ci-après: IEC 60068-2-20, Essai Tb, méthode 1 (bain de brasage)
- b) Pour les condensateurs décrits dans la spécification particulière comme non conçus pour être utilisés sur des cartes imprimées, mais avec des connexions destinées au brasage:
  - 1) IEC 60068-2-20, Essai Tb, méthode 1 (bain de brasage),
  - 2) IEC 60068-2-20, Essai Tb, méthode 2 (fer à braser).

- c) Pour les condensateurs pour montage en surface  
IEC 60068-2-58, méthode du bain de brasage ou de la refusion.

#### 4.14.3 Reprise

La durée de reprise ne doit pas être, sauf indication contraire dans la spécification particulière, inférieure à 1 h ni supérieure à 2 h, à l'exception des condensateurs pour montage en surface, pour lesquels la durée de reprise doit être  $24 \text{ h} \pm 2 \text{ h}$ .

#### 4.14.4 Inspection finale, mesurage et exigences

Pour tous les condensateurs, à l'exception des condensateurs pour montage en surface, ce qui suit doit s'appliquer:

- lorsque l'essai a été effectué, les condensateurs doivent être soumis à l'examen visuel;
- aucun dommage ne doit être constaté et le marquage doit être lisible;
- les condensateurs doivent alors être mesurés comme indiqué dans la spécification applicable.

Les condensateurs pour montage en surface doivent être mesurés et examinés visuellement et doivent satisfaire aux exigences précisées dans la spécification applicable.

#### 4.15 Brasabilité

##### 4.15.1 Généralités

Cet essai ne doit pas être appliqué aux sorties décrites dans la spécification particulière comme non conçues pour être brasées.

##### 4.15.2 Préconditionnement

La spécification applicable doit préciser si le vieillissement doit être appliqué. Si un vieillissement accéléré est exigé, une des procédures de vieillissement données dans l'IEC 60068-2-20 doit être appliquée.

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, l'essai doit être effectué avec un flux non activé.

##### 4.15.3 Procédure d'essai

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, un des essais suivants doit être appliqué de la façon indiquée dans la spécification applicable.

Les conditions d'essai doivent être définies dans la spécification applicable.

- a) Pour tous les condensateurs, à l'exception de ceux relevant des points b) et c) ci-après:
- 1) IEC 60068-2-20, Essai Ta, méthode 1 (bain de brasage)  
Profondeur d'immersion (par rapport au plan d'appui ou au corps du composant):  
 $2,0 \text{ mm} \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,5 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ , en utilisant un écran isolant du point de vue thermique de  $1,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$  d'épaisseur;
  - 2) IEC 60068-2-20, Essai Ta, méthode 2 (fer à braser)
  - 3) IEC 60068-2-54, méthode de la balance de mouillage en bain de brasage  
NOTE L'IEC 60068-2-54 est applicable uniquement si elle est précisée dans la spécification particulière ou en cas d'accord entre le fabricant et le client.
- b) Pour les condensateurs décrits dans la spécification particulière comme non conçus pour être utilisés sur des cartes imprimées, mais avec des connexions destinées au brasage:
- 1) IEC 60068-2-20, Essai Ta, méthode 1 (bain de brasage)

Profondeur d'immersion (par rapport au plan d'appui ou au corps du composant):  
3,5 mm  $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$  mm.

2) IEC 60068-2-20, Essai Ta, méthode 2 (fer à braser).

c) Pour les condensateurs pour montage en surface

1) IEC 60068-2-58, méthode par refusion ou du bain de brasage

2) IEC 60068-2-69, méthode de la balance de mouillage en bain de brasage ou de la balance de mouillage à la goutte de brasure.

NOTE L'IEC 60068-2-69 est applicable uniquement si elle est précisée dans la spécification particulière ou en cas d'accord entre le fabricant et le client.

#### 4.15.4 Inspection finale, mesurages et exigences

Les sorties doivent être examinées pour contrôler le bon état de l'étamage mis en évidence par l'écoulement de la brasure avec un bon mouillage des sorties.

Les condensateurs doivent répondre aux exigences indiquées dans la spécification applicable.

#### 4.16 Variations rapides de température

##### 4.16.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.16.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis aux conditions de l'essai Na de l'IEC 60068-2-14, en utilisant le degré de sévérité indiqué dans la spécification applicable.

##### 4.16.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Après reprise, les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté.

Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable.

#### 4.17 Vibrations

##### 4.17.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.17.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Fc de l'IEC 60068-2-6, en utilisant la méthode de montage et le degré de sévérité indiqués dans la spécification applicable.

##### 4.17.3 Essai électrique (mesurage intermédiaire)

Lorsque cela est précisé dans la spécification particulière, un mesurage électrique doit être réalisé au cours des 30 dernières minutes de l'essai de vibration dans chacune des directions du mouvement, pour détecter les contacts intermittents, les courts-circuits ou les circuits ouverts.

La méthode de mesure doit être précisée dans la spécification particulière.

La durée du mesurage doit être égale à celle d'un balayage d'une extrémité à l'autre de la plage de fréquences.

#### 4.17.4 Inspection finale, mesurages et exigences

Après l'essai, les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté. Si des condensateurs sont soumis aux essais comme spécifié en 4.17.3, les exigences doivent être indiquées dans la spécification particulière.

Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable.

#### 4.18 Secousses (chocs répétitifs)

##### 4.18.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.18.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Ea (chocs répétitifs) de l'IEC 60068-2-27, en utilisant la méthode de montage et le degré de sévérité indiqués dans la spécification applicable.

Les conditions préférentielles sont:

- forme des impulsions: demi-sinusoïdale;
- nombre de chocs dans chaque direction: au minimum 100;
- accélération maximale: à choisir parmi les sévérités recommandées.

##### 4.18.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Après l'essai, les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté.

Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable.

#### 4.19 Chocs

##### 4.19.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.19.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Ea (chocs non répétitifs) de l'IEC 60068-2-27, en utilisant la méthode de montage et le degré de sévérité indiqués dans la spécification applicable.

##### 4.19.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Après l'essai, les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté.

Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable.

#### 4.20 Étanchéité des boîtiers

Les condensateurs doivent être soumis à la procédure de la méthode appropriée de l'essai Q de l'IEC 60068-2-17 comme indiqué dans la spécification applicable.

## 4.21 Séquence climatique

### 4.21.1 Généralités

Au cours de la séquence climatique, un intervalle ne dépassant pas trois jours est admis entre deux essais, à l'exception près que l'essai de froid doit être appliqué immédiatement après la période de reprise spécifiée pour le premier cycle de l'essai cyclique de chaleur humide, essai Db de l'IEC 60068-2-30.

### 4.21.2 Mesurages initiaux

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

### 4.21.3 Chaleur sèche

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Bb de l'IEC 60068-2-2 pendant 16 h, en utilisant le degré de sévérité de la température de catégorie supérieure précisée dans la spécification particulière.

Les éprouvettes d'essai peuvent être introduites dans la chambre à n'importe quelle température, de la température du laboratoire à la température de catégorie supérieure.

Les condensateurs étant encore à la température élevée spécifiée et à la fin de la période de haute température, les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

À la fin du conditionnement spécifié, les condensateurs doivent être retirés de la chambre et soumis pendant au moins 4 h aux conditions atmosphériques normalisées d'essai.

### 4.21.4 Chaleur humide, cyclique, essai Db, premier cycle

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Db de l'IEC 60068-2-30 pendant un cycle de 24 h, en utilisant une température de 55 °C (sévérité b).

La variante 2 doit être utilisée, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

Après reprise, les condensateurs doivent être soumis immédiatement à l'essai de froid.

### 4.21.5 Froid

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Ab de l'IEC 60068-2-1 pendant 2 h, en utilisant le degré de sévérité de la température de catégorie inférieure indiquée dans la spécification applicable.

Les éprouvettes d'essai peuvent être introduites dans la chambre à n'importe quelle température, de la température du laboratoire à la température de catégorie inférieure.

Les condensateurs étant encore à la température basse spécifiée et à la fin du séjour à basse température, les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

À la fin du conditionnement spécifié, les condensateurs doivent être retirés de la chambre et soumis pendant au moins 4 h aux conditions atmosphériques normalisées d'essai.

### 4.21.6 Basse pression atmosphérique

Les condensateurs doivent être soumis aux conditions de l'essai M de l'IEC 60068-2-13, en utilisant le degré de sévérité approprié indiqué dans la spécification applicable. Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la durée de l'essai doit être de 10 min.

La spécification applicable doit préciser:

- a) la durée de l'essai, si elle est différente de 10 min;
- b) la température;
- c) le degré de sévérité.

Les condensateurs étant à la basse pression spécifiée, la tension assignée doit leur être appliquée pendant les 60 dernières secondes de la période d'essai, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

Durant et après l'essai, il ne doit pas y avoir de signe de claquage permanent, de contournement, de déformation nuisible du boîtier ou de trace d'imprégnation.

#### 4.21.7 Chaleur humide, cyclique, essai Db, cycles restants

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Db de l'IEC 60068-2-30, pendant le nombre de cycles de 24 h indiqué dans le Tableau 6, dans les mêmes conditions que le premier cycle.

Tableau 6 – Nombre de cycles

Catégories climatiques	Nombre de cycles
-/-/56	5
-/-/21	1
-/-/10	1
-/-/04	Aucun

#### 4.21.8 Mesurages finaux

Après la reprise spécifiée, les mesurages doivent être effectués conformément aux exigences de la spécification applicable.

#### 4.22 Chaleur humide, essai continu

##### 4.22.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.22.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Cab de l'IEC 60068-2-78, en utilisant le degré de sévérité correspondant à leur catégorie climatique, indiquée dans la spécification particulière. La température et l'humidité de l'essai doivent être  $(40 \pm 2)$  °C et  $(93 \pm 3)$  % HR, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

Lorsque cela est indiqué dans la spécification particulière cadre, la spécification particulière peut indiquer l'application d'une tension de polarisation pendant toute la durée du conditionnement en chaleur humide. Pour les condensateurs à film métallisé, il convient de réaliser cet essai conformément à l'Annexe G.

A l'exception des condensateurs électrolytiques, moins de 15 min après le retrait de la chambre d'essai, les condensateurs doivent être soumis à l'essai de tension de tenue de 4.6, essai A seulement, en utilisant comme tension d'essai la tension assignée, sauf indication contraire dans la spécification particulière.

#### 4.22.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Après reprise, les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté. Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable.

Dans le cas des essais de condensateurs à film métallisé, si cela est indiqué dans la spécification particulière cadre, l'écart admissible de la valeur C moyenne du groupe d'essais avec et sans tension continue doit être décrit dans la spécification particulière applicable.

#### 4.23 Endurance

##### 4.23.1 Mesurages initiaux

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.23.2 Procédure d'essai

Les essais de l'IEC 60068-2-2 s'appliquent comme suit:

- a) essais en courant continu – essai Bb;
- b) essais en courant alternatif – essai Bb ou Bd, selon le cas;
- c) essais en impulsions – essai Bb ou Bd, selon le cas.

Les éprouvettes d'essai peuvent être introduites dans la chambre à n'importe quelle température, de la température du laboratoire à la température de catégorie supérieure, mais la tension ne doit pas être appliquée au condensateur avant qu'il ait atteint la température de la chambre.

##### 4.23.3 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- a) la durée de l'essai (par exemple le nombre d'heures ou le nombre d'impulsions);
- b) la température de l'essai (par exemple la température ambiante, la température assignée ou la température de catégorie supérieure);
- c) la tension et/ou le courant à appliquer (voir aussi 4.23.4).

Lorsque les condensateurs doivent satisfaire à des exigences complémentaires pour la protection contre les dangers de choc électrique, les conditions d'essais complémentaires pour l'essai d'endurance (par exemple application d'impulsions de tension) doivent être indiquées dans la spécification applicable.

##### 4.23.4 Tension d'essai

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la tension à appliquer pendant l'essai doit être choisie parmi celles qui sont indiquées ci-dessous:

- a) essais en courant continu

L'essai doit être effectué sous une tension liée à la tension continue assignée par un facteur multiplicatif, jusqu'à la température assignée. La température de l'essai et la valeur du facteur multiplicatif doivent être indiquées dans la spécification applicable. Pour les essais à la température de catégorie supérieure, le facteur de réduction pour la tension doit être également donné.

- b) essais en tension alternative sinusoïdale

L'essai doit être effectué à une fréquence comprise entre 50 Hz et 60 Hz, sous une tension liée à la tension assignée en alternatif (voir 2.3.4 a)) par un facteur multiplicatif, jusqu'à la température assignée ou jusqu'à la température de catégorie supérieure avec

un facteur de réduction pour la tension. La température de l'essai et la valeur du facteur multiplicatif ou du facteur de réduction, pour la tension, doivent être indiquées dans la spécification applicable.

c) essais en courant alternatif sinusoïdal

Cet essai doit être effectué avec un courant appliqué conformément à 2.3.4 b). La température de l'essai, la valeur du courant et sa fréquence doivent être indiquées dans la spécification applicable.

Par commodité, l'essai peut être effectué avec une tension de fréquence spécifiée appliquée à un groupe de condensateurs en parallèle ou en série-parallèle.

d) essais en courant alternatif sinusoïdal (puissance réactive)

Cet essai doit être effectué avec une puissance réactive, conformément à 2.3.4 c). La température de l'essai, la valeur de la puissance réactive et la fréquence doivent être indiquées dans la spécification applicable.

Par commodité, l'essai peut être effectué avec une tension de fréquence spécifiée appliquée à un groupe de condensateurs en parallèle ou en série-parallèle.

Un essai de stabilité thermique (voir 4.30) peut remplacer cet essai. L'essai à effectuer doit être indiqué dans la spécification particulière.

e) essais en impulsions

Cet essai doit être effectué avec des impulsions appliquées conformément à 2.3.5, comme indiqué dans la spécification applicable. Des lignes directrices pour la conduite des essais en impulsions sont données à l'Annexe E.

f) essais en courant alternatif sinusoïdal ou en impulsions avec courant continu superposé

Les essais b) à e) peuvent être effectués avec un courant continu superposé, comme exigé par la spécification applicable (voir aussi 2.2.23).

Le schéma de la Figure 10 est un exemple de circuit d'essai convenant aux condensateurs électrolytiques.

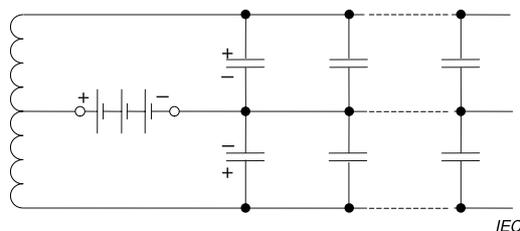


Figure 10 – Circuit d'essai pour les condensateurs électrolytiques

4.23.5 Positionnement dans la chambre d'essai

Les condensateurs doivent être placés dans la chambre d'essai de telle sorte que

- a) pour les condensateurs dissipant de la chaleur, aucun condensateur ne se trouve à moins de 25 mm d'un autre condensateur,
- b) pour les condensateurs ne dissipant pas de chaleur, aucun condensateur ne se trouve à moins de 5 mm d'un autre condensateur.

4.23.6 Reprise

Après la période spécifiée, les condensateurs doivent pouvoir refroidir dans les conditions atmosphériques normalisées d'essai, et lorsque la spécification applicable l'indique, un temps de reprise doit être prévu.

#### 4.23.7 Inspection finale, mesurages et exigences

Les condensateurs doivent alors être examinés visuellement.

Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable. Un condensateur doit être considéré comme défectueux lorsqu'il n'a pas satisfait, pendant ou à la fin de l'essai, aux exigences de la spécification applicable.

#### 4.24 Variation de la capacité avec la température

##### 4.24.1 Méthode statique

##### 4.24.1.1 Mesurage initial

Les mesurages de la capacité doivent être effectués dans les conditions indiquées dans la spécification applicable.

##### 4.24.1.2 Procédure d'essai

Le condensateur doit être maintenu successivement à chacune des températures suivantes:

- a)  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ;
- b) température de catégorie inférieure  $\pm 3\text{ °C}$ ;
- c) températures intermédiaires, si cela est exigé par la spécification particulière;
- d)  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ;
- e) températures intermédiaires, si cela est exigé par la spécification particulière;
- f) température de catégorie supérieure  $\pm 2\text{ °C}$ ;
- g)  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ .

Si cela est exigé pour un type particulier de condensateur, la spécification applicable doit indiquer si le choc thermique doit être évité ou si une vitesse maximale de variation de la température doit être spécifiée.

Il convient de fixer les conditions de mesure, pendant ou après le cycle de température, la description du cycle de température et le nombre de cycles.

##### 4.24.1.3 Méthode de mesure

Les mesurages de la capacité doivent être effectués à chacune des températures spécifiées ci-dessus, une fois que le condensateur a atteint une stabilité thermique.

L'état de stabilité thermique est considéré comme atteint lorsque deux mesures de capacité effectuées à un intervalle d'au moins 5 min ne diffèrent pas d'une valeur supérieure à l'erreur pouvant être attribuée à l'appareil de mesure.

Le mesurage des températures réelles doit être effectué avec une précision compatible avec les exigences de la spécification particulière.

Des précautions doivent être prises, au cours des mesurages, afin d'éviter la condensation ou la formation de givre sur la surface des condensateurs.

##### 4.24.1.4 Procédure réduite

Dans le cas d'essais de conformité de la qualité lot par lot, la spécification particulière peut préciser une procédure réduite, par exemple les mesurages d), f) et g) de 4.24.1.2 correspondant à la plage des températures comprises entre  $20\text{ °C}$  et la température de catégorie supérieure.

#### 4.24.2 Méthode dynamique

En variante à la méthode statique de 4.24.1, une méthode dynamique utilisant une table traçante peut être employée. Les condensateurs doivent être soumis à une variation lente de température.

Un dispositif thermosensible doit être incorporé dans un condensateur fictif qui doit être placé dans le condensateur en essai, de manière telle que la température enregistrée corresponde à la température interne du condensateur en essai. La capacité doit être mesurée en utilisant un pont, ou un comparateur, automatique.

La sortie du pont ou du comparateur doit être reliée à l'entrée "Y" de la table traçante.

La sortie du dispositif thermosensible doit être reliée à l'entrée "X" de la table traçante.

La température doit varier assez lentement pour obtenir une courbe régulière et sans boucle aux températures de catégorie inférieure ou supérieure. La température doit varier successivement de 20 °C à la température de catégorie inférieure, puis de là jusqu'à la température de catégorie supérieure, et enfin redescendre à 20 °C. Deux cycles doivent être effectués.

Cette méthode peut n'être utilisée que dans le cas où il peut être démontré que ses résultats sont identiques à ceux de la méthode utilisant des températures stabilisées.

En cas de litige, la méthode statique doit être utilisée.

#### 4.24.3 Méthodes de calcul

##### 4.24.3.1 Généralités

Les éléments suivants s'appliquent:

$C_0$  est la capacité mesurée au point d) de 4.24.1.2;

$T_0$  est la température mesurée au point d) de 4.24.1.2;

$C_i$  est la capacité mesurée à la température d'essai, autre qu'aux points a), d) et g) de 4.24.1.2;

$T_i$  est la température d'essai mesurée.

##### 4.24.3.2 Caractéristiques capacité/température

La variation de capacité en fonction de la température doit être calculée pour toutes les valeurs de  $C_i$ , comme suit:

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{C_i - C_0}{C_0}$$

La variation de capacité s'exprime normalement en pourcentage.

##### 4.24.3.3 Coefficient de température de la capacité et dérive de capacité après cycle thermique

Le coefficient de température de la capacité et la dérive de capacité après cycle thermique doivent être calculés comme suit:

###### a) Coefficient de température de la capacité ( $\alpha$ )

Le coefficient de température de la capacité ( $\alpha$ ) doit être calculé pour toutes les valeurs de  $C_i$ , comme suit:

$$\alpha_i = \frac{C_i - C_0}{C_0(T_i - T_0)} \times 10^6$$

Le coefficient de température s'exprime normalement en millionièmes par Kelvin ( $10^{-6}/K$ ).

#### b) Dérive de capacité après cycle thermique

La dérive de capacité après cycle thermique doit être calculée pour les points de mesure a), d) et g) de 4.24.1.2, de la manière suivante:

$$\delta_{da} = \frac{C_0 - C_a}{C_0}$$

$$\delta_{gd} = \frac{C_g - C_0}{C_0}$$

$$\delta_{ga} = \frac{C_g - C_a}{C_0}$$

comme exigé dans la spécification applicable. La plus grande de ces valeurs est la "dérive de capacité après cycle thermique".

La dérive de capacité s'exprime normalement en pourcentage.

### 4.25 Stockage

#### 4.25.1 Stockage à haute température

##### 4.25.1.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

##### 4.25.1.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Bb de l'IEC 60068-2-2, en utilisant les sévérités suivantes:

- température: température de catégorie supérieure;
- durée: 96 h  $\pm$  4 h.

Les éprouvettes d'essai peuvent être introduites dans la chambre à n'importe quelle température, de la température du laboratoire à la température de catégorie supérieure.

##### 4.25.1.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Après une reprise d'au moins 16 h, les mesurages doivent être effectués comme cela est indiqué dans la spécification applicable.

#### 4.25.2 Stockage à basse température

##### 4.25.2.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

4.25.2.2 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Ab de l'IEC 60068-2-1. Les condensateurs doivent être placés à -40 °C pendant une durée de 4 h après que la stabilité thermique a été atteinte, ou pendant 16 h, selon la plus courte des deux durées.

Les éprouvettes d'essai peuvent être introduites dans la chambre à n'importe quelle température, de la température du laboratoire à -40 °C.

4.25.2.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Après une reprise d'au moins 16 h, les mesurages doivent être effectués comme cela est indiqué dans la spécification applicable.

4.26 Surtension

4.26.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués doivent être effectués conformément à la spécification applicable.

4.26.2 Procédure d'essai

Des circuits d'essai convenables sont présentés à la Figure 11 et à la Figure 12.

NOTE Le circuit utilisant des thyristors a l'avantage d'autoriser des fréquences de répétition élevées et est exempt des troubles occasionnés par des contacts encrassés ou par le rebondissement des contacts.

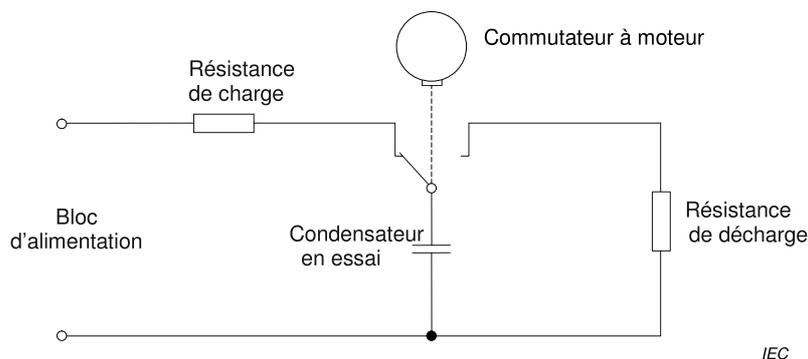


Figure 11 – Circuit à relais

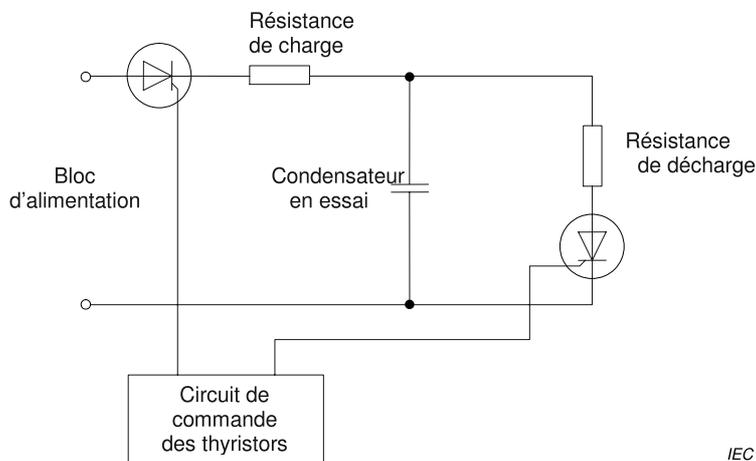


Figure 12 – Circuit à thyristors

La forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur en essai doit être approximativement comme présentée à la Figure 13.

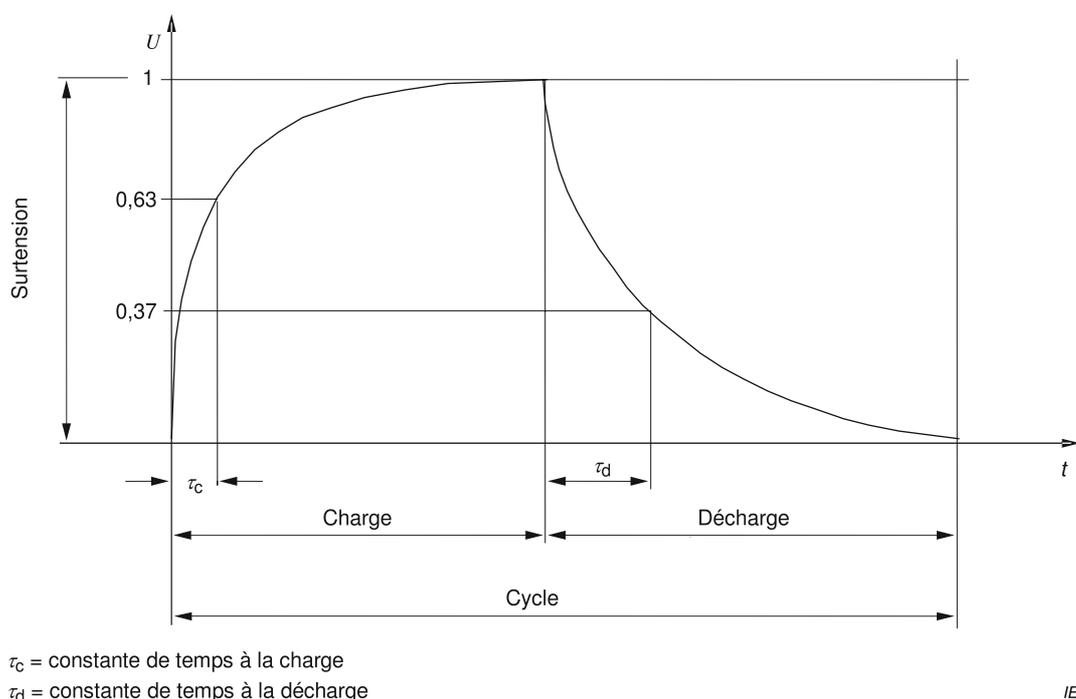


Figure 13 – Forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur

#### 4.26.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Les mesurages indiqués doivent être effectués conformément à la spécification applicable.

#### 4.26.4 Informations devant être données dans la spécification particulière applicable

Les informations suivantes doivent être fournies dans la spécification applicable:

- a) constante de temps à la charge résultant de la résistance interne de l'alimentation, de la résistance du circuit de charge et de la capacité du condensateur en essai;
- b) constante de temps à la décharge résultant de la résistance du circuit de décharge et de la capacité du condensateur en essai;
- c) rapport de surtension à la tension assignée ou de catégorie (selon le cas);  
Il convient de spécifier le nombre de fois par heure que cette tension peut être appliquée.
- d) nombre de cycles de l'essai;
- e) durée de la période de charge;
- f) durée de la période de décharge;
- g) fréquence de répétition (cycles par seconde);
- h) température, si différente des conditions atmosphériques normalisées d'essai.

#### 4.27 Essais de charge et de décharge et essai de courant d'appel

##### 4.27.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués doivent être effectués conformément à la spécification applicable.

#### 4.27.2 Procédure d'essai

Des circuits d'essai convenables sont donnés en 4.26.2, à la Figure 11 et à la Figure 12.

Les formes d'ondes de la tension aux bornes du condensateur en essai et du courant le traversant sont approximativement comme présentées à la Figure 14.

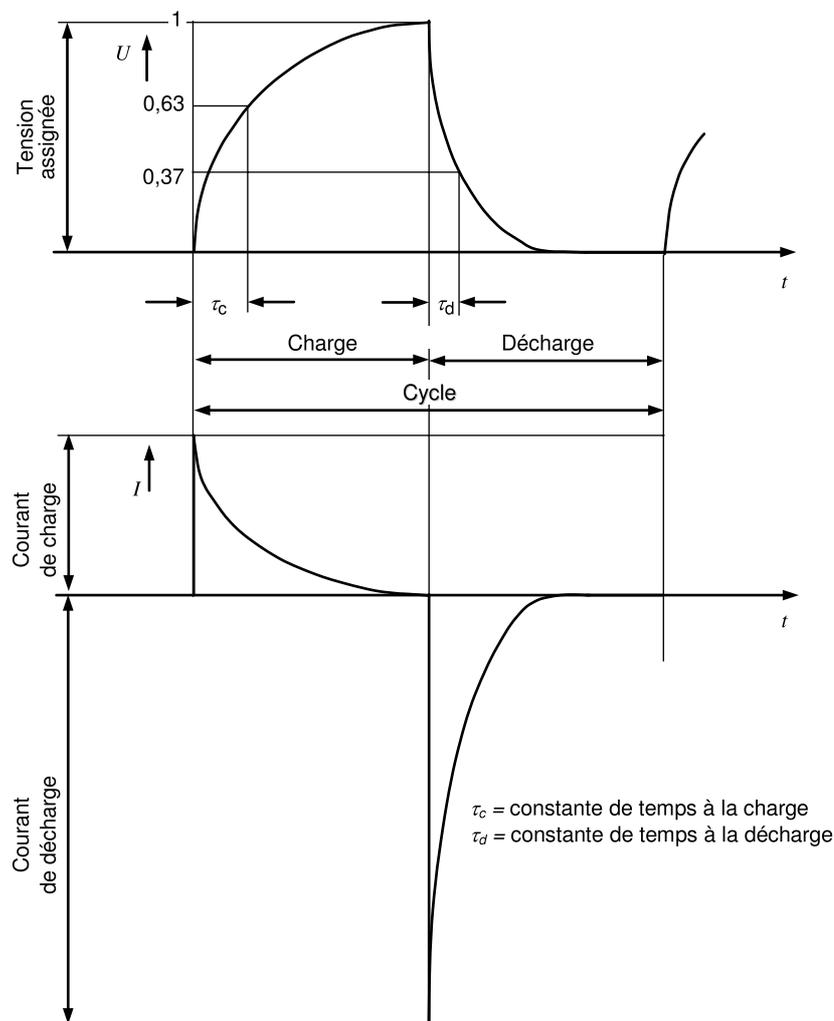


Figure 14 – Forme d'onde de la tension et du courant

#### 4.27.3 Charge et décharge

Les informations suivantes doivent être fournies dans la spécification applicable:

- constante de temps à la charge résultant de la résistance interne de l'alimentation, de la résistance du circuit de charge et de la capacité du condensateur en essai;
- constante de temps à la décharge résultant de la résistance du circuit de décharge et de la capacité du condensateur en essai;
- tension devant être appliquée pendant la période de charge, si différente de la tension assignée;
- nombre de cycles de l'essai;
- durée de la période de charge;

- f) durée de la période de décharge;
- g) fréquence de répétition (cycles par seconde);
- h) température, si différente des conditions atmosphériques normalisées d'essai.

#### 4.27.4 Courant d'appel

Les informations suivantes doivent être fournies dans la spécification applicable:

- a) valeur crête du courant de charge;
- b) tension devant être appliquée pendant la période de charge, si différente de la tension assignée;
- c) nombre de cycles de l'essai;
- d) durée de la période de charge en millisecondes;
- e) durée de la période de décharge;
- f) fréquence de répétition;
- g) température, si différente des conditions atmosphériques normalisées d'essai.

#### 4.27.5 Inspection finale, mesurages et exigences

Les mesurages indiqués doivent être effectués conformément à la spécification applicable.

### 4.28 Décharge de pression (pour les condensateurs électrolytiques en aluminium)

#### 4.28.1 Généralités

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, l'un des essais indiqués ci-dessous doit être effectué afin de vérifier le fonctionnement du dispositif de décharge de pression des condensateurs.

#### 4.28.2 Essai en courant alternatif

Tension appliquée: tension alternative de valeur efficace ne dépassant pas 0,7 fois la tension continue assignée.

Fréquence de la tension appliquée: 50 Hz ou 60 Hz.

Résistance en série:  $R = 0,5$  fois l'impédance du condensateur à la fréquence d'essai.

#### 4.28.3 Essai en courant continu

Tension appliquée: tension continue appliquée en sens inverse, d'amplitude suffisante pour produire un courant de 1 A à 10 A.

#### 4.28.4 Essai pneumatique

Pression pneumatique appliquée: la pression du gaz introduit de l'extérieur doit être augmentée de façon continue à raison de 20 kPa/s.

#### 4.28.5 Inspection finale, mesurages et exigences

Les mesurages indiqués doivent être effectués conformément à la spécification applicable.

## 4.29 Caractéristiques à haute et basse températures

### 4.29.1 Procédure d'essai

Les condensateurs doivent être soumis aux procédures des essais de chaleur sèche et de froid (respectivement 4.21.3 et 4.21.5) en utilisant les détails suivants.

Le degré de sévérité pour ces essais doit être le même que pour les essais de chaleur sèche et de froid. Des essais à des températures intermédiaires peuvent être précisés dans la spécification applicable.

Les mesurages doivent être effectués à chacune des températures spécifiées une fois que le condensateur a atteint une stabilité thermique.

L'état de stabilité thermique est considéré atteint lorsque deux mesures d'une caractéristique effectuées à un intervalle d'au moins 5 min ne diffèrent pas d'une valeur supérieure à l'erreur pouvant être attribuée à l'appareil de mesure.

### 4.29.2 Exigences

Les condensateurs ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans la spécification applicable.

## 4.30 Essai de stabilité thermique

Un essai de stabilité thermique peut remplacer l'essai d'endurance, conformément à 4.23.4 d). L'essai devant être effectué doit être indiqué dans la spécification particulière.

Le condensateur doit être alimenté sous une puissance liée à la puissance réactive assignée par un facteur multiplicatif spécifié à la température assignée et pendant une période indiquée dans la spécification applicable.

Une vérification de la stabilité thermique doit être effectuée en mesurant l'échauffement en fonction du temps pendant la dernière partie de la période spécifiée. L'échauffement doit rester à l'intérieur de limites spécifiées.

Le mesurage de l'échauffement peut être effectué par thermocouple, thermistance, thermomètre infrarouge, photographie infrarouge, etc. Il convient de prendre soin de s'assurer que l'erreur de mesure ne dépasse pas  $\pm 1$  °C et que les erreurs dues à la conduction de chaleur le long des connexions de mesure soient maintenues à un minimum.

La spécification applicable doit spécifier le point où les mesurages doivent être effectués et la méthode de montage (voir 6.4 de l'IEC 60068-2-2:2007).

## 4.31 Résistance au solvant des composants

### 4.31.1 Mesurages initiaux

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent être effectués.

### 4.31.2 Procédure d'essai

Les composants doivent être soumis à l'essai XA de l'IEC 60068-2-45, en utilisant les détails suivants:

- a) solvant devant être utilisé: IPA (IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993, 3.1.2);
- b) température du solvant:  $23$  °C  $\pm$  5 °C, sauf indication contraire dans la spécification particulière;

- c) conditionnement: méthode 2 (sans frottement);
- d) temps de reprise: 48 h, sauf indication contraire dans la spécification particulière.

#### 4.31.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Les mesurages indiqués dans la spécification applicable doivent alors être effectués et les exigences spécifiées satisfaites.

#### 4.32 Résistance au solvant du marquage

##### 4.32.1 Procédure d'essai

Les composants doivent être soumis à l'essai XA de l'IEC 60068-2-45, en utilisant les détails suivants:

- a) solvant devant être utilisé: IPA (IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993, 3.1.2);
- b) température du solvant:  $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ ;
- c) conditionnement: méthode 1 (avec frottement);
- d) matériau de polissage: ouate;
- e) temps de reprise: sans objet, sauf indication contraire dans la spécification particulière.

##### 4.32.2 Inspection finale, mesurages et exigences

Après l'essai, le marquage doit être lisible.

#### 4.33 Montage (pour les condensateurs pour montage en surface uniquement)

##### 4.33.1 Substrat

Les condensateurs pour montage en surface doivent être montés sur un substrat approprié, la méthode de montage dépendant de la construction du condensateur. Le matériau du substrat doit être normalement une carte imprimée feuilletée en tissu de verre époxyde (comme défini dans l'IEC 61249-2-7) d'épaisseur  $1,6\text{ mm} \pm 0,20\text{ mm}$  ou  $0,8\text{ mm} \pm 0,10\text{ mm}$ , ou un substrat d'alumine de 90 % à 98 % d'épaisseur  $0,635\text{ mm} \pm 0,05\text{ mm}$  ou plus. Il ne doit pas affecter le résultat des essais ou des mesurages. La spécification particulière doit indiquer le matériau devant être utilisé pour les mesurages électriques.

Le substrat doit comporter des zones de report métallisées convenablement espacées pour permettre le montage des condensateurs pour montage en surface et leur raccordement électrique. Les détails doivent être indiqués dans la spécification particulière.

Des exemples de substrats destinés aux essais électriques et mécaniques sont donnés respectivement à la Figure 15 et à la Figure 16.

Si une autre méthode de montage est utilisée, il convient de décrire clairement la méthode dans la spécification particulière.

##### 4.33.2 Brasage à la vague

Lorsque la spécification particulière indique un brasage à la vague, une colle appropriée, dont les propriétés peuvent être données dans la spécification particulière, doit être utilisée pour fixer le composant sur le substrat avant le brasage.

De petits points de colle doivent être appliqués entre les conducteurs du substrat à l'aide d'un dispositif approprié garantissant que les résultats sont reproductibles.

Les condensateurs pour montage en surface doivent être placés sur les points de colle à l'aide d'une petite pince. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de colle sur les conducteurs, les condensateurs pour montage en surface ne doivent plus être déplacés.

Le substrat avec les condensateurs pour montage en surface doit être chauffé dans un four à 100 °C pendant 15 min.

Le substrat doit être brasé dans un appareil de brasure à la vague. L'appareil doit être ajusté pour que sa température de préchauffage soit comprise entre 80 °C et 100 °C, comporter un bain de brasage à 260 °C ± 5 °C et présenter un temps de brasage de 5 s ± 0,5 s.

Le substrat doit être nettoyé pendant 3 min dans un solvant approprié (voir 3.1.2 de l'IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993).

#### 4.33.3 Brasage par fusion

Quand la spécification particulière indique un brasage par fusion, la procédure de montage suivante s'applique.

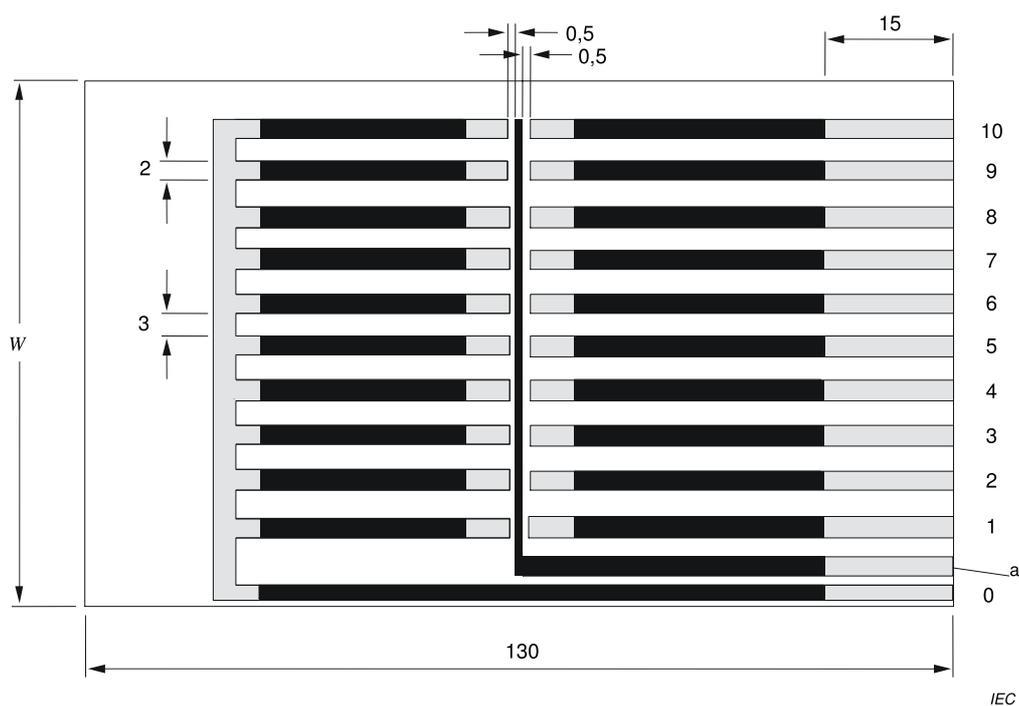
- a) La brasure utilisée sous forme de pâte ou de préforme doit être un eutectique Sn/Pb comportant au moins 2 % d'argent avec un flux tel qu'indiqué dans l'IEC 60068-2-20. D'autres brasures telles que 60/40 ou 63/37 peuvent être utilisées lorsque la constitution des condensateurs chipses comporte une couche barrière. La brasure sans plomb utilisée sous forme de pâte ou de préforme doit être Sn96,5Ag3,0Cu0,5 ou une brasure dérivée avec un flux tel qu'indiqué dans l'IEC 60068-2-58, ou tel que défini dans la spécification applicable.
- b) Le condensateur pour montage en surface doit être ensuite placé sur les zones de report métallisées du substrat d'essai, de sorte qu'il y ait contact entre le condensateur pour montage en surface et les zones métallisées du substrat.
- c) Le substrat doit alors être placé dans ou sur un système de chauffage approprié (brasure fondue, plaque chaude, étuve tunnel, etc.). La température de l'unité doit être maintenue entre 215 °C et 260 °C, jusqu'à ce que la brasure fonde et fusionne une nouvelle fois pour former une liaison par brasure homogène, mais pendant moins de 10 s.

Il convient de retirer le flux à l'aide d'un solvant approprié (voir 3.1.2 de l'IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993). Il convient de procéder de façon à éviter toute contamination. Il convient de veiller à maintenir une propreté suffisante dans les chambres d'essai et pendant les mesurages après essais.

La spécification particulière peut exiger une plage de températures plus restreinte.

Si une brasure en phase vapeur est appliquée, la même méthode peut être utilisée avec des températures adaptées.

Un substrat approprié pour les essais mécaniques est présenté à la Figure 15. Noter que ce substrat peut ne pas convenir pour les mesurages de l'impédance. Un substrat approprié pour les essais électriques est présenté à la Figure 16.



## Légende

- Zones brasables
- Zones non brasables (couvertes par un vernis-laque non brasable)

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres. Tolérances: moyennes.

Matériau: tissu de verre époxyde

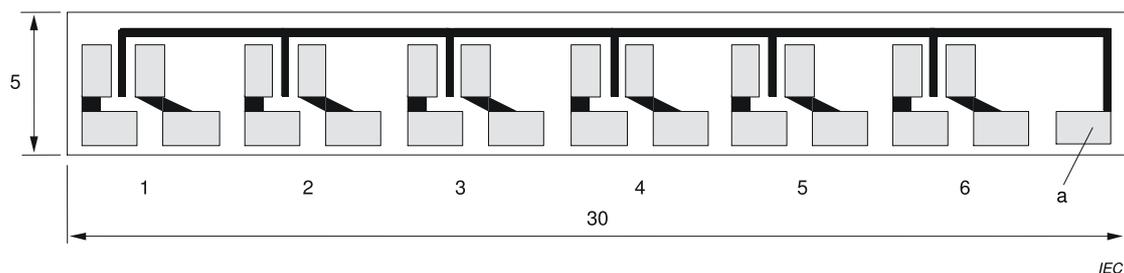
Épaisseur:  $1,6 \text{ mm} \pm 0,20 \text{ mm}$ , ou  $0,8 \text{ mm} \pm 0,10 \text{ mm}$

Il convient de choisir les dimensions non indiquées en fonction de la conception et de la taille des éprouvettes à soumettre aux essais.

La dimension  $W$  dépend de la conception de l'équipement d'essai.

<sup>a</sup> Ce conducteur peut être omis ou utilisé comme électrode de garde.

Figure 15 – Substrat approprié pour les essais mécaniques



#### Légende

- Zones brasables
- Zones non brasables (couvertes par un vernis-laque non brasable)

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres. Tolérances: moyennes.

Matériau: substrat en alumine 90 % à 98 %

Épaisseur: 0,635 mm ± 0,05 mm, ou plus

Il convient de choisir les dimensions non indiquées en fonction de la conception et de la taille des éprouvettes à soumettre aux essais.

La dimension  $W$  dépend de la conception de l'équipement d'essai.

<sup>a</sup> Ce conducteur peut être omis ou utilisé comme électrode de garde.

Figure 16 – Substrat approprié pour les essais électriques

### 4.34 Essai de cisaillement

#### 4.34.1 Procédure d'essai

Les condensateurs pour montage en surface doivent être montés comme décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai U.

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Ue3 de l'IEC 60068-2-21, dans les conditions suivantes.

Une force doit être appliquée au corps du condensateur pour montage en surface de façon progressive, sans chocs, et doit être maintenue pendant  $10 \text{ s} \pm 1 \text{ s}$ . Sauf indication contraire dans la spécification applicable, une force doit être choisie parmi l'une des valeurs suivantes: 1 N, 2 N, 5 N ou 10 N.

#### 4.34.2 Inspection finale, mesurages et exigences

Les condensateurs pour montage en surface, montés sur leur substrat, doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté.

### 4.35 Essai de pliage du substrat

#### 4.35.1 Procédure d'essai

Le condensateur pour montage en surface doit être monté sur une carte imprimée en tissu de verre époxyde, comme décrit en 4.33.

- a) La valeur de la capacité du condensateur pour montage en surface doit être mesurée comme spécifié en 4.7 et dans la spécification intermédiaire applicable.
- b) Le condensateur doit être soumis à l'essai Ue de l'IEC 60068-2-21 en appliquant les conditions indiquées dans la spécification applicable pour la déflexion  $D$  et le nombre de pliages.

- c) La valeur de la capacité des condensateurs pour montage en surface doit être mesurée comme spécifié en a) lorsque la carte imprimée est en position pliée. La variation de capacité ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la spécification applicable.

#### 4.35.2 Reprise

La carte imprimée doit pouvoir reprendre depuis la position pliée, puis être retirée du gabarit d'essai.

#### 4.35.3 Inspection et exigences finales

Les condensateurs pour montage en surface doivent être examinés visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

### 4.36 Absorption diélectrique

#### 4.36.1 Procédure d'essai

Le condensateur en essai doit être placé dans une cage de Faraday pour réduire l'effet des champs électriques.

Pour le mesurage de la tension, un électromètre ou un autre instrument approprié ayant une résistance d'entrée minimale de 10 000 MΩ doit être utilisé.

La résistance de tous les gabarits, de tous les commutateurs, etc., utilisés ne doit pas affecter la résistance d'entrée du système de mesure.

Le condensateur doit ensuite être chargé à la tension continue assignée pendant 60 min ± 1 min. Le courant de surtension initial ne doit pas être supérieur à 50 mA.

À la fin de cette période, le condensateur doit être isolé de l'alimentation et doit être déchargé à travers une résistance de 5 Ω ± 5 % pendant 10 s ± 1 s, sans que le  $du/dt$  spécifié ne soit dépassé.

La résistance de décharge doit être isolée du condensateur à la fin des 10 s de décharge. La tension résiduelle ou regagnée aux bornes du condensateur (tension de rétablissement) doit être mesurée.

NOTE La tension de rétablissement est la tension maximale apparaissant aux sorties du condensateur durant une période de 15 min.

L'absorption diélectrique doit être calculée avec la formule suivante:

$$DA = \frac{U_1}{U_2} \times 100 \times \frac{C_X + C_0}{C_X}$$

où

$DA$  est le pourcentage d'absorption diélectrique;

$U_1$  est la tension de rétablissement;

$U_2$  est la tension de charge;

$C_X$  est la capacité du condensateur en essai;

$C_0$  est la capacité d'entrée du système de mesure.

Si  $C_0$  est inférieure à 10 % de  $C_X$ , la formule ci-dessus peut être simplifiée selon:

$$DA = \frac{U_1}{U_2} \times 100$$

#### 4.36.2 Exigences

L'absorption diélectrique calculée ne doit pas être supérieure à la limite indiquée dans la spécification particulière.

#### 4.37 Essai continu de chaleur humide accéléré

NOTE Cet essai est également connu sous le nom d'essai d'humidité en charge ou essai 85/85.

##### 4.37.1 Mesurages initiaux

Les condensateurs doivent être mesurés comme cela est indiqué dans la spécification applicable.

##### 4.37.2 Méthodes d'essai

Les condensateurs doivent être soumis à l'essai Cy de l'IEC 60068-2-67.

Durées préférentielles de l'essai: 168 h, 504 h ou 1 000 h.

##### 4.37.3 Procédures d'essai

Conditions d'essai: tension assignée appliquée, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

Pour les condensateurs à film métallisé, il convient de réaliser cet essai conformément à l'Annexe G, et conformément à l'Annexe H pour les condensateurs en céramique multicouches.

À l'exception des condensateurs électrolytiques, moins de 15 min après le retrait de la chambre d'essai, les condensateurs doivent être soumis à l'essai de tension de tenue de 4.6, essai A seulement, en utilisant comme tension d'essai la tension assignée, sauf indication contraire dans la spécification particulière.

##### 4.37.4 Inspection finale, mesurages et exigences

Après reprise (4 h à 24 h), les condensateurs doivent être examinés visuellement. Aucun dommage visible ne doit être constaté. Les mesurages doivent ensuite être effectués conformément aux indications de la spécification applicable.

Dans le cas des essais de condensateurs à film métallisé, si cela est indiqué dans la spécification particulière cadre, l'écart admissible de la valeur C moyenne du groupe d'essais avec et sans tension continue doit être décrit dans la spécification particulière applicable.

#### 4.38 Inflammabilité passive

##### 4.38.1 Procédure d'essai

L'essai doit être réalisé conformément à l'IEC 60695-11-5;

Le condensateur en essai doit être maintenu dans la flamme dans la position qui favorise le plus l'inflammation (si cette position n'est pas précisée dans la spécification particulière, elle doit être déterminée par un essai préalable). Chaque éprouvette doit être exposée seulement une fois à la flamme.

La plus petite dimension, une dimension moyenne (dans le cas de plus de quatre dimensions de boîtier), et la plus grande des dimensions de boîtier doivent être soumises aux essais. Pour chaque dimension de boîtier, trois éprouvettes de la capacité maximale et trois éprouvettes de la capacité minimale doivent être soumises aux essais, soit six éprouvettes par dimension de boîtier.

Le temps d'exposition à la flamme et le temps de combustion sont donnés au Tableau 7. Le cas échéant, la spécification particulière doit indiquer la catégorie d'inflammabilité passive.

#### 4.38.2 Inspection finale, mesurages et exigences

Le temps de combustion pour chacune des éprouvettes ne doit pas être supérieur au temps spécifié dans le Tableau 7.

Des gouttelettes enflammées ou des parties incandescentes ne doivent pas enflammer le papier de soie en tombant.

Tableau 7 – Sévérités et exigences

Catégorie d'inflammabilité	Sévérités Temps d'exposition à la flamme, en secondes, pour des plages de volumes de condensateur				Temps maximal de combustion s
	Volume $\leq 250 \text{ mm}^3$	Volume $>250 \text{ mm}^3 \leq 500 \text{ mm}^3$	Volume $>500 \text{ mm}^3 \leq 1\,750 \text{ mm}^3$	Volume $>1\,750 \text{ mm}^3$	
A	15	30	60	120	3
B	10	20	30	60	10
C	5	10	20	30	30

#### 4.39 Essai aux surintensités

##### 4.39.1 Mesurages initiaux

Non exigé.

##### 4.39.2 Procédure d'essai

L'essai doit être réalisé à une température de  $(23 \pm 3) \text{ }^\circ\text{C}$ .

Le circuit d'essai est présenté à la Figure 17. La commutation peut être mécanique ou électronique, mais il est préférable qu'elle soit électronique. Le commutateur étant en position A, le condensateur en essai est chargé pendant 1 s à partir d'un condensateur électrolytique de faible impédance ayant une valeur de capacité d'au moins  $20\,000 \mu\text{F}$ , à la tension assignée du condensateur en essai ( $U_R \pm 2 \%$ ) à partir d'une alimentation stabilisée capable de fournir 10 A. L'impédance du circuit à travers lequel le condensateur en essai est chargé doit satisfaire aux exigences de 4.39.3. Après un temps de charge de 1 s, le condensateur en essai doit être déchargé pendant 1 s avec le commutateur en position B à travers un circuit dont la résistance est supérieure à  $0,05 \Omega$ , mais inférieure à  $0,2 \Omega$ .

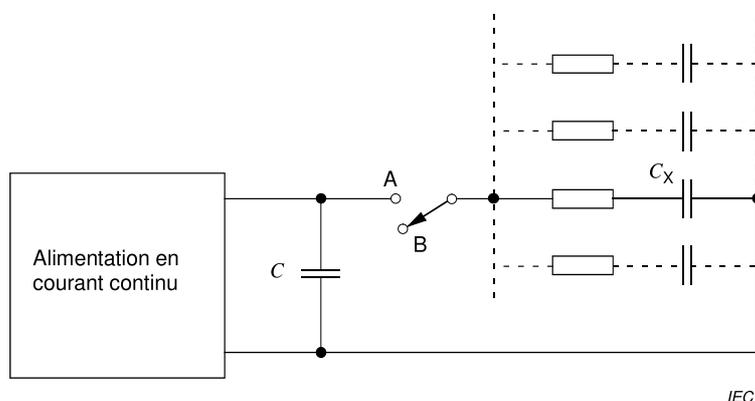
La tension appliquée au condensateur en essai doit être surveillée. Les quatre charges et décharges suivantes du condensateur en essai doivent être réalisées dans les mêmes conditions.

Les condensateurs peuvent être soumis aux essais en parallèle si

- a) la valeur totale de leur capacité est inférieure à 2 % de la capacité du condensateur réservoir; et

- b) toutes les conditions spécifiées ci-dessus sont respectées pour chaque condensateur en essai.

Le fusible peut être un fil conçu pour fonctionner entre 0,5 A et 2,0 A ou un circuit électronique conçu pour agir dans la même plage de courant.



Légende

- $C_x$  condensateur en essai
- C condensateur électrolytique de faible impédance de capacité supérieure ou égale à 20 000  $\mu\text{F}$
- A, B positions de commutation

Figure 17 – Essai aux surintensités

4.39.3 Exigences pour le circuit de charge

La procédure d'essai de 4.39.2 doit être réalisée avec un condensateur de  $47 \mu\text{F} \pm 10 \%$ , 35 V en position d'essai, ou dans une position d'essai quelconque, si des dispositions sont prises pour l'essai des condensateurs en parallèle. Le contrôle de la tension aux bornes du condensateur en essai doit démontrer que la tension de crête aux bornes du condensateur pendant la charge est  $U_R +5/2 \%$ , et que 90 % de la tension de crête mesurée est obtenue en un temps inférieur ou égal à 60  $\mu\text{s}$  après la fermeture du commutateur et sans surtensions transitoires indésirables dues aux rebondissements des contacts ou à l'inductance du circuit. Lorsque ces dispositions pour l'essai des condensateurs en parallèle sont prises, cette exigence doit être vérifiée pour chaque condensateur en essai.

Il est peu probable que cette exigence soit satisfaite, sauf si la résistance en courant continu du circuit de charge y compris les fils, fusibles, fixations et la résistance en série du condensateur réservoir est inférieure à 0,5  $\Omega$ .

4.39.4 Éléments non conformes

Un condensateur doit être considéré comme un élément non conforme si le fusible grille ou si le circuit électronique agit à toute charge ou décharge du condensateur.

4.40 Surtension transitoire (pour condensateurs électrolytiques en aluminium à électrolyte non solide)

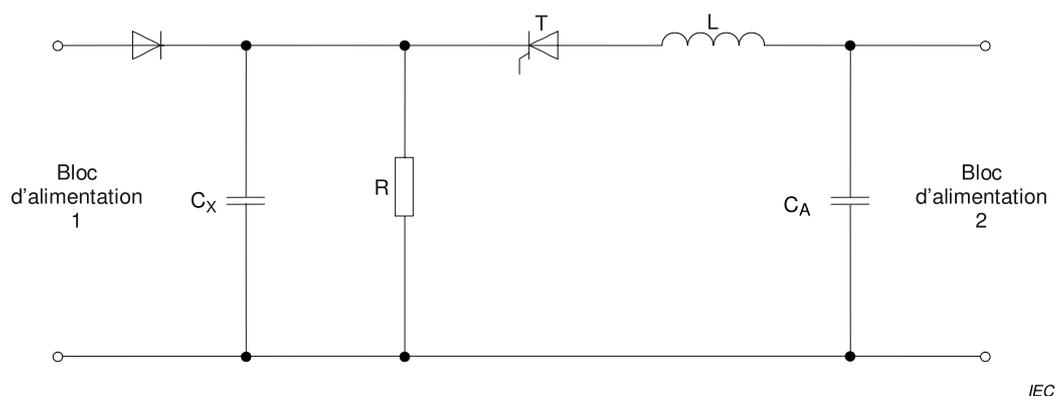
4.40.1 Mesurage initial

Les mesurages indiqués dans la spécification particulière doivent être effectués.

## 4.40.2 Procédure d'essai

Le ou les condensateurs doivent alors être conditionnés à la température d'essai pour avoir une tension  $U_R \pm 1\%$  fournie par une alimentation stabilisée. À la fin de cette période, l'essai peut commencer, mais pas plus tard que 48 h après le conditionnement.

Un exemple de circuit d'essai est présenté à la Figure 18.



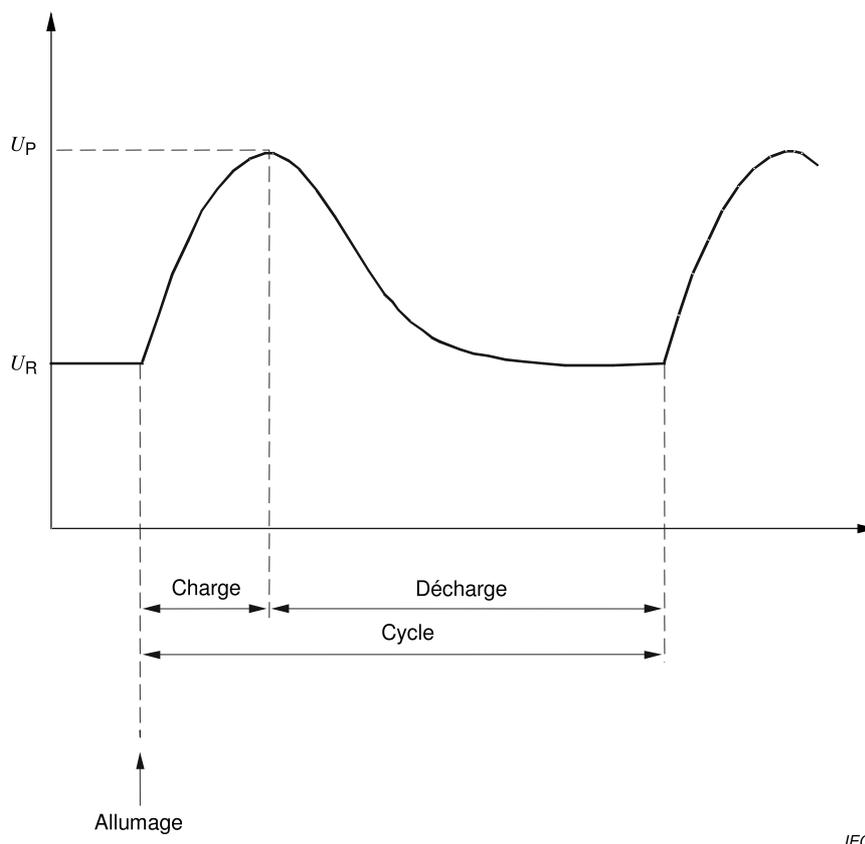
## Légende

- $C_X$  condensateur en essai
- $C_A$  condensateur réservoir pour donner un temps de charge maximal
- R résistance pour donner un temps de charge maximal
- L inductance pour donner un temps de charge maximal
- T thyristor

Figure 18 – Circuit d'essai de la surtension transitoire

Le condensateur en essai  $C_X$  est chargé à partir du bloc d'alimentation 1 et le condensateur réservoir auxiliaire  $C_A$  est chargé à une tension supérieure à la tension d'essai  $U_P$  à partir du bloc d'alimentation 2. En allumant le thyristor T, le condensateur réservoir  $C_A$  est déchargé à travers l'inductance L pour charger le condensateur en essai  $C_X$  à la tension  $U_P$ . En éteignant le thyristor, le condensateur en essai  $C_X$  est déchargé à travers la résistance R de la tension  $U_P$  jusqu'à la tension  $U_R$ .

La forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur en essai doit être approximativement comme présentée à la Figure 19.



IEC

Légende

$U_P$  tension de crête transitoire

$U_R$  tension assignée

Figure 19 – Forme d'onde de la tension

#### 4.40.3 Inspection finale, mesurages et exigences

Les mesurages indiqués doivent être effectués conformément à la spécification applicable.

#### 4.40.4 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable

La spécification applicable doit indiquer:

- a) la durée de la période de conditionnement;
- b) la valeur de crête de la tension transitoire  $U_P$ ;
- c) les valeurs de  $C_A$ , de  $L$  et de  $R$  pour donner un temps de charge maximal de 15 ms;
- d) la durée de chaque cycle d'essai;
- e) le nombre de cycles d'essai;
- f) la température, si différente des conditions atmosphériques normalisées d'essai.

#### 4.41 Essai sur le développement des trichites

##### 4.41.1 Généralités

Si cela est indiqué dans la spécification applicable, l'essai sur le développement des trichites doit être basé sur les recommandations de l'IEC 60068-2-82.

La spécification applicable doit indiquer un gabarit de fixation approprié pour le support de l'éprouvette pendant cet essai.

#### 4.41.2 Préparation des éprouvettes

La préparation des éprouvettes doit être conforme à l'Article 5 de l'IEC 60068-2-82:2007.

Les condensateurs destinés à être brasés doivent subir un préconditionnement par traitement thermique conformément au 5.5 de l'IEC 60068-2-82:2007.

Les condensateurs à sortie doivent subir un préconditionnement de mise en forme des sorties conformément au 5.6 de l'IEC 60068-2-82:2007.

#### 4.41.3 Mesurage initial

L'aspect des condensateurs doit être examiné conformément au 7.2 de l'IEC 60068-2-82:2007.

#### 4.41.4 Procédures d'essai

L'essai ambiant, l'essai de chaleur humide et l'essai de cycles de températures doivent être appliqués selon les indications de l'Article 6 de l'IEC 60068-2-82:2007.

#### 4.41.5 Sévérités des essais

Les sévérités présentées dans le Tableau 6 de l'IEC 60068-2-82:2007 doivent être appliquées en fonction de la composition des matériaux des composants.

La discrimination suivante doit être appliquée au choix de la sévérité de l'essai de cycles de températures:

- a) la sévérité N,  $-55\text{ °C} / 125\text{ °C}$  doit être appliquée aux condensateurs de température de catégorie inférieure (LCT) inférieure ou égale à  $-55\text{ °C}$  et de température de catégorie supérieure (UCT) supérieure ou égale à  $125\text{ °C}$ ;
- b) la sévérité K,  $-40\text{ °C} / 85\text{ °C}$  doit être appliquée aux condensateurs de température de catégorie inférieure (LCT) supérieure à  $-55\text{ °C}$  et/ou de température de catégorie supérieure (UCT) inférieure à  $125\text{ °C}$ .

#### 4.41.6 Inspection finale, mesurages et exigences

L'aspect des condensateurs doit être examinée conformément à l'Annexe A de l'IEC 60068-2-82:2007.

Les trichites ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans la spécification particulière.

## Annexe A (informative)

### Interprétation des plans d'échantillonnage et des procédures tels qu'ils sont décrits dans l'IEC 60410 et destinés à être utilisés dans les systèmes d'assurance de la qualité

Lorsque l'IEC 60410 est utilisée pour le contrôle par attributs dans le cadre de la présente norme, ses articles et paragraphes indiqués ci-après doivent être interprétés de la manière suivante.

- 1 L'autorité responsable est l'organisme national habilité chargé de mettre en œuvre les règles de base ainsi que les règles relatives aux procédures.
- 1.5 L'unité de produit est le composant électronique défini dans une spécification particulière.
- 2 Seules les définitions suivantes de cet article sont exigées:
  - un "défaut" est une non-conformité de l'unité du produit aux exigences spécifiées;
  - un "défectueux" est une unité de produit qui présente une ou plusieurs non-conformités.
- 3.1 Le degré de non-conformité du produit doit être exprimé en pourcentage de défectueux.
- 3.3 Sans objet.
- 4.5 L'autorité responsable est le comité d'études de l'IEC établissant la spécification particulière cadre faisant partie de la spécification générique ou intermédiaire.
- 5.4 L'autorité responsable est le responsable désigné, agissant en conformité avec les procédures indiquées dans le document décrivant le service chargé du contrôle du fabricant approuvé, et qui sont approuvées par l'organisme de certification.
- 6.2 L'autorité responsable est le responsable désigné.
- 6.3 Sans objet.
- 6.4 L'autorité responsable est le responsable désigné.
- 8.1 Le contrôle normal doit toujours être utilisé au début du contrôle.
- 8.3.3 d) L'autorité responsable est le responsable désigné.
- 8.4 L'autorité responsable est l'organisme national de surveillance.
- 9.2 L'autorité responsable est le comité d'études de l'IEC établissant la spécification particulière cadre faisant partie de la spécification intermédiaire ou générique.
- 9.4 (Quatrième phrase uniquement) Sans objet.  
(Cinquième phrase uniquement) L'autorité responsable est le responsable désigné.
- 10.2 Sans objet.

## Annexe B (informative)

### Règles pour la préparation des spécifications particulières pour des condensateurs et des résistances pour équipements électroniques, destinés à être utilisés dans les systèmes d'assurance de la qualité

#### B.1 Élaboration

Si elle est exigée, l'élaboration d'une spécification particulière complète ne doit commencer que lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies.

- a) La spécification générique a été approuvée.
- b) La spécification intermédiaire, s'il y a lieu, a été diffusée pour approbation comme projet final de norme internationale (FDIS).
- c) La spécification particulière cadre associée a été diffusée pour approbation comme FDIS.
- d) Il est prouvé que trois comités nationaux au moins ont formellement approuvé, comme normes nationales propres, des spécifications couvrant un composant de performances étroitement similaires.

Si un comité national affirme formellement qu'il est fait dans son pays un usage important ou significatif d'un composant décrit par toute autre norme nationale, cette affirmation peut être considérée comme remplissant l'exigence précédente.

#### B.2 Norme de référence

Les spécifications particulières doivent utiliser les valeurs, caractéristiques assignées, caractéristiques et sévérités pour les essais d'environnement, etc. qui sont données comme normales ou préférentielles dans les spécifications génériques ou intermédiaires appropriées.

#### B.3 Diffusion

Il convient que la spécification particulière ne soit pas diffusée comme FDIS tant que la spécification intermédiaire et la spécification particulière cadre n'ont pas été approuvées pour publication.

Annexe C  
(informative)

Disposition de la première page d'une spécification PCP/CQC

Nom du fabricant

Lieu

Numéro d'agrément de savoir-faire

Numéro de spécification PCP/CQC;

Édition

Numéro de référence du manuel d'agrément de savoir-faire

Date

Description du PCP/CQC

Objet du PCP/CQC

Référence des schémas

Identité des pièces

## Annexe D (informative)

### Exigences pour le rapport d'essai d'agrément de savoir-faire

#### D.1 Généralités

L'agrément de savoir-faire est décrit à l'Annexe Q.1.1.b).

Le rapport d'essai doit comprendre les renseignements donnés dans les Articles D.2, D.3 et D.4.

#### D.2 Exigences

Le rapport d'essai doit être daté et fournir les informations générales suivantes:

- nom et adresse du fabricant;
- lieu de fabrication, si différent de l'adresse ci-dessus;
- numéros des spécifications intermédiaires et génériques, édition et date d'amendement;
- numéro d'édition et date de la description du savoir-faire;
- référence à la spécification PCP/CQC;
- référence au programme d'essai pour l'agrément de savoir-faire, selon le cas;
- une liste des équipements d'essai utilisés avec les incertitudes de mesure appropriées.

#### D.3 Résumé des informations sur les essais (pour chaque CQC)

Le rapport d'essai doit fournir un résumé des informations suivantes:

- essais;
- nombre d'éprouvettes soumises aux essais;
- nombre d'éléments non conformes autorisés;
- nombre d'éléments non conformes trouvés.

#### D.4 Enregistrement de mesure

Les résultats de mesure sont enregistrés avant et après les différents essais mécaniques, d'environnement et d'endurance pour lesquels des limites après les essais ou des mesurages finaux sont spécifiés.

## Annexe E (informative)

### Guide pour l'essai en impulsion des condensateurs

#### E.1 Présentation

Les méthodes d'essai existantes couvertes par la présente norme conviennent aux condensateurs fonctionnant dans des circuits électriques dans lesquels la tension appliquée est de façon prédominante une tension continue. Il existe maintenant un nombre croissant d'applications dans lesquelles la tension appliquée a la forme d'une impulsion avec ou sans inversion de la polarité. Ces impulsions peuvent être appliquées de façon permanente, intermittente ou aléatoire.

La présente annexe spécifie les facteurs affectant les caractéristiques assignées en impulsions et la manière dont ces caractéristiques assignées peuvent être vérifiées par des essais d'endurance appropriés. Les paramètres d'une impulsion sont définis. Les différentes combinaisons de ces paramètres peuvent induire différentes causes de défaillance, par exemple:

Type	Cause de défaillance	Essai
Électrolytique	Surtension dépassée	Surtension
	Tension inverse dépassée	Tension inverse
	Surchauffe ( $I^2R$ )	Alternatif ou en impulsions
Diélectriques métallisés	Courant de crête	Charge/décharge (intermittent)
	$du/dt$	Impulsion
	Surchauffe ( $I^2R$ )	Alternatif ou en impulsions
	Ionisation	Alternatif
Tous les autres	$du/dt$	Impulsion
	Surchauffe ( $I^2R$ )	Alternatif ou en impulsions
	Tension de crête dépassée	Surtension
	Ionisation	Alternatif

#### E.2 Conditions typiques en impulsions pour les condensateurs

Les valeurs énumérées ci-dessous pour des applications typiques montrent que des spécifications d'essai exigeant 100 000 ou 1 million d'impulsions correspondent à des durées de fonctionnement de seulement 5 s à 50 s.

Il n'est pas possible de réaliser un circuit reproduisant toutes les conditions exigées.

Il est cependant probable qu'il soit possible de réaliser des circuits reproduisant différents groupes de conditions. Il n'apparaît pas possible pour l'instant de spécifier des conditions d'essai accéléré simulant, par exemple, une durée de fonctionnement de 5 ans.

a) Exemples pour des applications en télévision

- Correction de S

Tension de crête typique: 25 V, 50 V, 180 V

Courants de crête typiques: 5 A à 15 A

$du/dt$ : environ 5 V/ $\mu$ s

Fréquence: 15 kHz à 20 kHz

Puissance réactive: jusqu'à 250 var

- Accord ligne

Tension de crête typique: jusqu'à 1 500 V

Courant de crête typique: 5 A

$du/dt$ : 180 V/ $\mu$ s

- Condensateurs multiplicateurs de tension

Tension de crête typique: tension continue de 10 kV avec ondulation

Courant de crête typique: 0,1 A

$du/dt$ : jusqu'à 1 000 V/ $\mu$ s

b) Exemples pour l'électronique de puissance

Tensions de crête typiques: 60 V à 100 V

Courants de crête typiques: 40 A à 100 A

$du/dt$ : 1 V/ $\mu$ s à 20 V/ $\mu$ s

Fréquences: 50 Hz à 20 kHz

Puissance réactive: jusqu'à 500 var

c) Exemple pour des convertisseurs continu-continu

Tension de crête typique: 30 V

Courant de crête typique: 6 A

$du/dt$ : 600 V/ $\mu$ s

Fréquence: jusqu'à 20 kHz

d) Exemples pour des alimentations à découpage

Tensions de crête typiques: 15 V à 400 V

Courants de crête typiques: 2 A à 10 A

Fréquences: 100 Hz à 40 kHz

e) Exemples pour lasers et sources de lumière en impulsions

Tensions de crête typiques: 1 kV à 3 kV

Courant de crête typique: 1 000 A

$du/dt$ : environ 500 V/ $\mu$ s

Fréquences: 1 kHz à 5 kHz

### E.3 Influence de l'inductance sur les essais en impulsions

Les méthodes d'essai en impulsions proposées sont probablement basées sur des circuits d'essai impliquant la charge et la décharge répétitives de condensateurs dans des circuits résistifs. Il en résulte les caractéristiques exponentielles conventionnelles de courant et de tension.

Dans beaucoup d'applications, cependant, les effets inductifs sont d'une importance considérable et ont une influence primordiale sur l'aptitude du condensateur à l'application.

Ceci est particulièrement important lorsqu'il y a de fortes valeurs de  $du/dt$ . Dans les conditions d'amortissement critique ( $R^2 = 4 \times L/C$ ), l'effet est une légère modification de la courbe de charge ou de décharge qui a peu d'effet sur la sévérité de l'essai.

Cependant, si  $R^2 < 4 \times L/C$ , il peut y avoir dépassement avec ou sans oscillations amorties.

Il peut en résulter une surcharge et une augmentation de la puissance dissipée.

## Annexe F (informative)

### Lignes directrices pour l'extension des essais d'endurance sur les condensateurs fixes

#### F.1 Présentation

La répétition régulière des essais d'endurance dans le cadre du contrôle de conformité de la qualité dans un système de qualité offre l'opportunité, non seulement de recueillir leurs résultats pour les rapports certifiés d'essais (RCE), mais encore de les accumuler, si possible, pour l'évaluation de données de fiabilité. Comme la durée habituelle des essais d'endurance sur les condensateurs est de 1 000 h ou 2 000 h, les parties intéressées peuvent souhaiter prolonger ces essais afin d'évaluer le comportement à long terme des composants concernés et d'améliorer la base d'évaluation de leur fiabilité. Dans ce qui suit, des lignes directrices sont données pour l'exécution et l'évaluation de tels essais d'endurance prolongés.

#### F.2 Lignes directrices

Les lignes directrices suivantes s'appliquent.

- a) Il convient de préférence d'adopter les mêmes conditions d'essai que pour l'essai d'endurance normalisé. Si, pour une raison ou pour une autre, des conditions d'essai différentes sont choisies, il convient de les indiquer avec précision.
- b) Il convient que les caractéristiques à mesurer pour les mesurages finaux soient les mêmes que pour l'essai d'endurance normalisé.
- c) La durée préférentielle pour un tel essai d'endurance prolongé est de 8 000 h.
- d) L'essai prolongé n'est destiné qu'à fournir des renseignements sur le comportement à long terme et la fiabilité. Les valeurs mesurées sont en conséquence notées pour analyse par variable ou toute autre évaluation de la fiabilité sans liaison avec les critères de défaillance spécifiés.
- e) Des mesurages intermédiaires (entre 2 000 h et 8 000 h) peuvent être effectués.
- f) Si les parties concernées en conviennent, les résultats de l'essai peuvent être inclus dans le rapport certifié d'essais des lots acceptés.
- g) La "traduction" des résultats d'essais accumulés en données de fiabilité est normalement de la responsabilité du fabricant. Si quelqu'un d'autre désire utiliser ces résultats d'essais accumulés pour sa propre évaluation de fiabilité, un facteur d'accélération appropriée aux composants concernés doit être pris en compte.

## Annexe G (normative)

### Essai continu de chaleur humide avec application de tension, pour les condensateurs à film métallisé uniquement

#### G.1 Présentation

Pour la détection de la sensibilité à la corrosion de la métallisation du film diélectrique, un essai supplémentaire continu de chaleur humide en appliquant une tension doit être réalisé.

L'écart par rapport aux valeurs moyennes de capacité du groupe d'essais avec et sans tension indique une corrosion possible de la métallisation.

#### G.2 Procédure d'essai

L'essai continu de chaleur humide doit être réalisé en appliquant une tension alternative ou continue, en fonction de la tension assignée spécifiée des condensateurs.

L'essai continu de chaleur humide en appliquant une tension doit être réalisé sur un groupe d'essais supplémentaire. Les éprouvettes pour les deux groupes d'essais avec et sans tension ne peuvent être préparées que par le fabricant des composants, qui veille à ce que les éprouvettes pour les deux groupes soient produites avec des matériaux identiques et selon des procédés de production identiques. Le nombre d'éprouvettes pour un groupe d'essais supplémentaire avec la tension est le même que le nombre d'éprouvettes pour le groupe d'essais sans tension.

## Annexe H (normative)

### Essai continu de chaleur humide accéléré, pour les condensateurs céramiques multicouches uniquement

#### H.1 Montage des condensateurs

Les condensateurs doivent être montés de telle sorte que chaque condensateur soit connecté en série avec une résistance. Une moitié des condensateurs doit être connectée en série avec des résistances de  $100 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$  et l'autre moitié en série avec des résistances de  $6,8 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$ .

#### H.2 Mesurage initial

La résistance d'isolement des condensateurs montés selon l'Article H.1 doit être mesurée avec une tension de  $1,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$  appliquée aux bornes du condensateur et de la résistance en série.

La résistance d'isolement doit satisfaire aux exigences données dans la spécification applicable.

#### H.3 Procédure d'essai

Les condensateurs avec les résistances associées doivent être soumis à un conditionnement de  $(85 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$  et à une humidité relative de  $(85 \pm 3) \%$  pendant une durée devant être indiquée dans la spécification applicable. Une tension de  $(1,5 \pm 0,1) \text{ V}$  doit être appliquée aux condensateurs connectés à une résistance de  $100 \text{ k}\Omega$  et une tension de  $(50 \pm 0,1) \text{ V}$  ou la tension  $U_R$  (la plus faible des deux valeurs) doit être appliquée aux condensateurs connectés à une résistance de  $6,8 \text{ k}\Omega$ . Dans les deux cas, la tension doit être appliquée à la combinaison condensateur/résistance.

Des précautions doivent être prises pour éviter la condensation d'eau sur les condensateurs ou sur les substrats. La condensation peut apparaître en cas d'ouverture de la porte pendant l'essai avant d'avoir diminué le taux d'humidité.

#### H.4 Reprise

La tension appliquée doit être coupée et les condensateurs et les résistances doivent être retirés de la chambre d'essai pour permettre une reprise de 4 h à 24 h dans les conditions atmosphériques normalisées d'essai.

#### H.5 Inspection finale, mesurages et exigences

La résistance d'isolement des condensateurs montés conformément à l'Article H.1 doit être mesurée selon l'Article H.2 ci-dessus.

La résistance d'isolement doit être supérieure à 0,1 fois la limite initiale.

## Annexe Q (informative)

### Procédures d'assurance de la qualité

#### Q.1 Généralités

##### Q.1.1 Domaine d'application de la présente annexe

La présente spécification générique et les spécifications particulières et intermédiaires associées peuvent être utilisées pour les besoins d'un système global d'assurance de la qualité. Les types d'agrément suivants sont prévus.

- a) L'homologation (QA), applicable à un composant identifié ou à une plage de composants basés sur des processus de production et de conception semblables, pour lesquels une spécification particulière existe. Une telle spécification particulière doit être basée sur la présente spécification générique et sur une spécification intermédiaire applicable et doit donner des dispositions pour une homologation.

Une homologation est accordée à un fabricant selon les dispositions de l'Article Q.2, quand il a été établi que les composants satisfont aux exigences de la spécification particulière.

Les programmes d'essai indiqués dans la spécification particulière pour l'homologation initiale des produits et pour les contrôles de conformité de la qualité des produits s'appliquent directement au composant ou à la plage de composants à homologuer.

- b) L'agrément de savoir-faire (CA) est applicable à un procédé de fabrication de composants identifiés et à un ensemble de règles de conception pour lesquels une spécification intermédiaire applicable existe. Une telle spécification intermédiaire doit être basée sur la présente spécification générique et doit donner des dispositions pour un agrément de savoir-faire.

Un agrément de savoir-faire est accordé à un fabricant selon les dispositions de l'Article Q.3, lorsque l'aptitude du fabricant en matière de procédés de fabrication et de méthodes de contrôle de la qualité couvrant une technologie de composants spécifique satisfaisant aux exigences des spécifications applicables a été établie.

Différentes spécifications particulières sont utilisées pour un agrément de savoir-faire. Au moins une spécification particulière est publiée pour les composants pour agrément de savoir-faire (CQC), identifiant l'objectif du composant et indiquant les essais et les exigences appropriés. D'autres spécifications particulières sont publiées pour les composants livrables et peuvent ainsi couvrir des composants d'un catalogue normalisé ou des composants spécifiques à un client.

- c) Un agrément de technologie (TA) est approprié lorsque l'ensemble du processus technologique (conception, réalisation de processus, fabrication de produits, essai et expédition) couvre les aspects de qualification communs à tous les composants déterminés par la technologie. Il intègre les principes et les techniques les plus récents en matière de management de la qualité et prévoit l'utilisation des méthodes et d'outils statistiques, une amélioration continue et une flexibilité des procédures.

L'agrément de technologie est applicable à une activité de fabrication de composants électroniques identifiée pour laquelle un programme d'agrément de technologie (TAS: Technology Approval Schedule) existe.

Un agrément de technologie est accordé à un fabricant selon les dispositions de l'Article Q.4, lorsqu'il a été démontré que le système de management de la qualité établi pour son activité de fabrication de composants électroniques est conforme au contenu de son document de déclaration d'agrément de technologie (TADD) et satisfait aux exigences du programme d'agrément de technologie (TAS).

L'identification d'une activité de fabrication de composants électroniques doit être basée sur un ou plusieurs composants ou sur une ou plusieurs plages de composants fabriqués selon des processus de production et de conception semblables, pour lesquels une ou plusieurs spécifications particulières existent. De telles spécifications particulières doivent être basées sur la présente spécification générique et sur des spécifications intermédiaires applicables et doivent donner des dispositions appropriées pour un agrément de technologie. Des références à telles spécifications particulières appliquées doivent être indiquées dans l'agrément de technologie.

Une condition préalable pour l'obtention de n'importe lequel de ces agréments est qu'un fabricant ait obtenu l'agrément de fabricant selon les dispositions de l'organisme de certification applicable.

## Q.1.2 Définitions de l'assurance de la qualité

### Q.1.2.1 Étape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication doit être indiquée dans la spécification intermédiaire.

Exemples d'étapes initiales de fabrication:

- Pour les condensateurs à film:  
l'enroulement de l'élément de condensateur ou une opération équivalente.
- Pour les condensateurs en céramique:  
le premier allumage commun de l'ensemble diélectrique-électrode.
- Pour les condensateurs électrolytiques:  
l'évaluation par le fabricant de condensateurs de la feuille d'anode formée.

### Q.1.2.2 Composants de structure semblable

Le groupement de composants de structure semblable pour les essais d'homologation initiale des produits ou pour les essais de conformité de la qualité des produits dans le cadre de l'homologation, de l'agrément de savoir-faire ou de l'agrément de technologie doit être indiqué dans la spécification intermédiaire applicable.

### Q.1.2.3 Niveau d'assurance

Un niveau d'assurance indique la sévérité des programmes d'essai, les plans d'échantillonnage et le nombre d'éléments non conformes admissibles dans chaque groupe d'essai. Les niveaux d'assurance EZ et DZ satisfont aux exigences de l'approche zéro défaut et adaptent les procédures d'évaluation et les niveaux aux pratiques industrielles actuelles, par exemple en définissant le nombre de non-conformités autorisées (nombre d'acceptation) à zéro. Les spécifications intermédiaires doivent préciser les exigences relatives aux programmes d'essai utilisés dans toutes les spécifications particulières associées.

NOTE 1 Des niveaux d'assurance existent déjà, par exemple avec différents nombres de non-conformités admissibles par essai. Toutefois, seuls les niveaux d'assurance EZ et DZ sont utilisés dans des spécifications récentes.

Les niveaux de contrôle et les plans d'échantillonnage pour les niveaux d'assurance EZ et DZ doivent être choisis parmi ceux donnés dans l'IEC 61193-2, à l'exception des éléments du programme d'essai qui sont basés sur des effectifs d'échantillons fixes, indépendamment de la taille du lot contrôlé.

NOTE 2 L'évaluation d'un niveau de qualité égal ou proche de zéro défaut par échantillonnage seulement entraînerait une trop forte augmentation des efforts de contrôle. Par conséquent, les plans d'échantillonnage basés sur un critère d'acceptation de zéro défaut peuvent seulement s'appliquer au contrôle des produits fabriqués dans le cadre d'un contrôle de processus approprié avec l'objectif d'un niveau de qualité sans défaut avant le contrôle par échantillonnage.

#### Q.1.2.4 Détermination du niveau de taux de défaillance (le cas échéant)

La détermination du niveau de taux de défaillance et de la certification doit être décrite dans la spécification applicable.

#### Q.1.3 Reprise

Une reprise est la rectification d'une erreur de traitement par les mêmes moyens que ceux utilisés dans le processus en cours, ou par un processus de reprise explicitement autorisé avant l'acceptation du composant.

Une reprise ne doit pas être effectuée si la spécification particulière ou intermédiaire applicable l'interdit.

Des procédures de reprise applicables doivent être autorisées par la spécification particulière ou intermédiaire applicable et elles doivent être décrites en détail dans la documentation applicable produite par le fabricant. Toute reprise doit être supervisée par le responsable désigné (DMR) avant la formation du lot de contrôle destiné à être contrôlé conformément aux exigences de la spécification particulière.

#### Q.1.4 Autres méthodes d'essai

Les méthodes d'essai et de mesure données par la spécification applicable sont destinées à unifier des procédures d'essai et de mesure. Elles ne sont pas nécessairement les seules méthodes pouvant être utilisées sauf lorsqu'elles sont désignées spécifiquement comme des méthodes de référence ou d'arbitrage.

Un fabricant homologué doit démontrer à l'organisme de certification (CB) que n'importe quelle autre méthode qu'il l'utilise donne des résultats équivalents à ceux obtenus par la méthode spécifiée.

En cas de litige, la méthode spécifiée est prioritaire sur toute autre méthode.

#### Q.1.5 Rapports certifiés d'essais des lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés d'essais sont indiqués dans la spécification applicable et sont requis par un client, ils doivent au moins donner les informations suivantes.

- a) Les informations sur les attributs (c'est-à-dire le nombre de composants soumis aux essais et le nombre de composants non conformes) pour des essais dans les sous-groupes couverts par une inspection périodique sans faire référence au paramètre à l'origine du rejet.
- b) Les informations variables (c'est-à-dire la moyenne et la plage de variation de capacité et le nombre de composants soumis aux essais) pour les essais périodiques spécifiés dans la spécification intermédiaire applicable.

NOTE Dans le cadre de l'agrément de savoir-faire, les rapports certifiés d'essais se rapportent uniquement aux essais effectués sur les composants pour agrément de savoir-faire.

#### Q.1.6 Paramètres non vérifiés

Seuls les paramètres d'un composant indiqués dans la spécification particulière et qui ont été soumis aux essais doivent être considérés comme étant dans les limites spécifiées. Il ne peut être posé pour hypothèse qu'un paramètre non spécifié ne change pas d'un composant à l'autre.

Une nouvelle spécification plus étendue doit être utilisée si le contrôle d'un autre paramètre est exigé. Cette autre méthode d'essai doit alors être décrite en détail avec la spécification des plans d'échantillonnage, des niveaux de contrôle et des exigences, et elle doit être appliquée dans un programme d'essai approprié.

### Q.1.7 Livraison différée

Des composants sont considérés comme conformes aux exigences indiquées pendant une période de deux ans après la fabrication et l'acceptation des lots, lorsqu'ils sont stockés dans des conditions appropriées, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

La brasabilité et les caractéristiques électriques des composants conservés pendant une durée supérieure à cette période de conservation doivent être de nouveau examinées avant la livraison des composants conformément aux indications de la spécification applicable. L'échantillonnage et la procédure appliqués au nouvel examen doivent être approuvés par l'organisme de certification (CB).

Les composants sont qualifiés pour une autre période de conservation, si toutes les exigences appropriées ont été satisfaites dans le nouvel examen.

### Q.1.8 Réparation

Une réparation consiste à rendre utilisable un composant approuvé qui a été endommagé ou est devenu défectueux après son acceptation.

Les composants qui ont été réparés ne doivent pas être acceptés par n'importe quel système spécifié d'assurance de la qualité.

### Q.1.9 Registre des agréments

Les agréments doivent être basés sur une spécification particulière publiée et conforme à la présente spécification générique et à une spécification intermédiaire applicable.

Les agréments obtenus doivent être consignés dans un registre des agréments approprié et publié, par exemple dans la section "online certificates" (certificats en ligne) du site web [www.iecqc.org](http://www.iecqc.org). De telles informations doivent contenir tous les détails nécessaires sur l'agrément, y compris les spécifications appliquées et le domaine d'application de l'agrément, par exemple la désignation, la ou les variantes et la ou les plages de composants approuvés.

### Q.1.10 Fabrication hors des limites géographiques

Voir les exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

## Q.2 Procédures d'homologation (QA)

### Q.2.1 Aptitude à l'homologation

Une homologation peut être accordée à un fabricant possédant un agrément de fabricant.

Un composant peut se voir accorder une homologation si le procédé de fabrication, y compris l'étape initiale de fabrication spécifiée, est directement supervisé par le responsable désigné (DMR) approprié.

### Q.2.2 Demande d'homologation

Le fabricant doit se conformer au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

### Q.2.3 Sous-traitance

La spécification applicable peut limiter la sous-traitance conformément au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

Si la sous-traitance de l'étape initiale de fabrication et/ou des étapes suivantes est utilisée, elle doit être conforme au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.2.4 Procédure d'essai pour l'homologation initiale des produits

La spécification particulière doit indiquer le programme d'essai et les exigences des essais d'homologation initiale des produits.

L'échantillonnage et la formation des lots de contrôle doivent être indiqués dans la spécification intermédiaire ou dans la spécification particulière. Le plan d'échantillonnage des essais d'homologation initiale des produits est basé sur la procédure avec un effectif d'échantillons fixe, avec le nombre d'éprouvettes non conformes admissibles réglé à zéro (par exemple, le niveau d'assurance EZ).

L'éprouvette pour un lot de contrôle doit être prélevée au hasard pendant un court intervalle de temps d'une période de contrôle, et ne pas présenter de modification majeure du procédé de fabrication.

#### Q.2.5 Octroi de l'homologation

Une homologation doit être accordée quand les procédures sont observées de façon satisfaisante conformément au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.2.6 Maintien de l'homologation

Une homologation doit être maintenue par des contrôles réguliers de conformité de la qualité afin de démontrer la conformité aux exigences de la conformité de la qualité indiquée dans la spécification particulière.

#### Q.2.7 Contrôle de conformité de la qualité

Le programme d'essai et les exigences du contrôle de conformité de la qualité des produits doivent être indiqués dans la spécification particulière.

L'échantillonnage et la formation des lots de contrôle doivent être indiqués dans la spécification intermédiaire ou dans la spécification particulière. Les niveaux de contrôle et les plans d'échantillonnage doivent être choisis parmi ceux donnés dans l'IEC 61193-2, pour la partie relative au programme de contrôle de conformité de la qualité des produits basé sur des effectifs d'échantillons variables, comme c'est le cas dans les essais lot par lot. Le plan d'échantillonnage des essais périodiques de contrôle de conformité de la qualité des produits est basé sur la procédure avec des effectifs d'échantillons fixes. Le nombre d'éprouvettes non conformes admissibles pour chaque groupe d'essais des deux programmes d'essai est réglé à zéro (par exemple, le niveau d'assurance EZ).

L'éprouvette pour un lot de contrôle doit être prélevée au hasard pendant un court intervalle de temps d'une période de contrôle, et ne pas présenter de modification majeure du procédé de fabrication.

L'utilisation de la règle de modification de contrôle pour un contrôle réduit dans le groupe C du programme d'essai est autorisée dans tous les sous-groupes excepté pour l'endurance, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

### Q.3 Procédures d'agrément de savoir-faire

#### Q.3.1 Généralités

L'agrément de savoir-faire couvre un procédé de fabrication et des méthodes de contrôle de la qualité (y compris les aspects de conception, selon le cas) pour une technologie de

composants spécifiques avec un domaine d'application et des limites des capacités de fabrication utilisées clairement définis.

Le savoir-faire doit être démontré sur les composants pour agrément de savoir-faire (CQC), qui servent d'éprouvettes pour les essais de qualification initiale et pour les contrôles de conformité de la qualité suivants. Une spécification particulière doit être établie pour un composant pour agrément de savoir-faire. Une telle spécification particulière est basée sur la présente spécification générique et sur une spécification intermédiaire, donnant les dispositions pour un agrément de savoir-faire.

Un plan de contrôle de processus (PCP) détaillé doit être utilisé pour effectuer les contrôles pendant le procédé de fabrication des composants à accepter.

Des spécifications particulières spécifiques doivent être établies pour les composants du catalogue normalisé et pour les composants spécifiques à un client devant être acceptés dans le cadre de l'agrément de savoir-faire. Ces spécifications doivent être basées sur la présente spécification générique et sur la même spécification intermédiaire soutenant la spécification particulière pour le composant pour agrément de savoir-faire.

#### Q.3.2 Aptitude à l'agrément de savoir-faire

Le fabricant doit satisfaire aux exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

Un fabricant de composants peut se voir accorder un agrément de savoir-faire si le procédé de fabrication, y compris l'étape initiale de fabrication indiquée, est directement supervisé par le responsable désigné (DMR) approprié.

#### Q.3.3 Demande d'agrément de savoir-faire

Le fabricant doit satisfaire aux exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant) et aux exigences de la spécification intermédiaire applicable.

#### Q.3.4 Sous-traitance

La spécification applicable peut limiter la sous-traitance conformément aux règles du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

Si la sous-traitance de l'étape initiale de fabrication et/ou des étapes suivantes est utilisée, elle doit être conforme au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.3.5 Description du savoir-faire

Le fabricant doit décrire le savoir-faire relatif à la technologie de fabrication et à la plage de produits impliqués dans un manuel de savoir-faire (CM: Capability Manual), qui doit satisfaire aux exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant). Le manuel de savoir-faire doit indiquer les limites de la technologie couverte et les règles de conception, le cas échéant.

Le manuel de savoir-faire peut être confidentiel, et donc le fabricant doit fournir un résumé de la description du savoir-faire pouvant être publié.

#### Q.3.6 Démonstration et vérification de savoir-faire

La vérification du savoir-faire déclaré doit démontrer la conformité au contenu du manuel de savoir-faire et utiliser les composants pour agrément de savoir-faire (CQC) et le plan de contrôle de processus (PCP), selon les exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

Les composants pour agrément de savoir-faire doivent être utilisés pour démontrer les limites du savoir-faire et la conformité à la spécification particulière applicable.

#### Q.3.7 Octroi de l'agrément de savoir-faire

Un agrément de savoir-faire doit être accordé quand les procédures sont observées de façon satisfaisante conformément au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant) et quand les exigences de la spécification intermédiaire applicable sont satisfaites.

#### Q.3.8 Maintien de l'agrément de savoir-faire

Un agrément de savoir-faire doit être maintenu conformément au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant) et aux descriptions respectives du manuel de savoir-faire par des contrôles réguliers de conformité de la qualité sur les composants pour agrément de savoir-faire afin de démontrer la conformité aux exigences pour la conformité de la qualité indiquée dans la spécification particulière applicable.

#### Q.3.9 Contrôle de conformité de la qualité

Les contrôles de conformité de la qualité doivent être exécutés conformément aux dispositions du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant) et aux descriptions respectives du manuel de savoir-faire.

Le programme d'essai et les exigences pour le contrôle de conformité de la qualité doivent être indiqués dans la ou les spécifications particulières applicables pour les composants livrables, par exemple les spécifications particulières spécifiques pour les composants du catalogue normalisé ou pour les composants spécifiques à un client.

L'échantillonnage et la formation des lots de contrôle doivent être indiqués dans la spécification intermédiaire ou dans la spécification particulière. Les niveaux de contrôle et les plans d'échantillonnage doivent être choisis parmi ceux donnés dans l'IEC 61193-2, à l'exception des éléments du programme d'essai qui sont basés sur des effectifs d'échantillons fixes.

L'éprouvette pour un lot de contrôle doit être prélevée au hasard pendant un court intervalle de temps d'une période de contrôle, et ne pas présenter de modification majeure du procédé de fabrication.

### Q.4 Procédure d'agrément de technologie

#### Q.4.1 Généralités

L'agrément de technologie est une méthode d'approbation de l'ensemble du processus technologique couvrant les aspects d'approbation communs à tous les produits comme cela est déterminé par la technologie à l'étude. Il étend les concepts existants d'approbation (homologation et agrément de savoir-faire), en ajoutant les principes suivants comme des aspects obligatoires:

- a) un système formel de management de la qualité, impliquant un engagement actif de tous les employés dans le processus de qualité;
- b) l'utilisation de méthodes de contrôle en cours de fabrication, par exemple, un contrôle statistique des processus (SPC) devant être défini dans un programme d'agrément de technologie (TAS);
- c) une stratégie d'amélioration continue de la qualité;
- d) la surveillance des technologies globales et des fonctionnements associée aux processus de conception et de fabrication, ainsi que des composants mêmes;
- e) la souplesse de procédure due au système de management de l'assurance de la qualité et aux exigences d'un secteur de marché;

- f) l'acceptation d'une documentation de fonctionnement d'un fabricant pour fournir un moyen en vue d'un agrément rapide ou d'une extension de l'agrément.

#### Q.4.2 Aptitude à l'agrément de technologie

Un agrément de technologie peut être accordé à un fabricant possédant un agrément de fabricant conformément au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

Une condition préalable à un agrément de technologie est un programme d'agrément de technologie (TAS) couvrant tout le domaine d'application de la technologie à laquelle l'agrément est destiné, rédigé selon les exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.4.3 Demande d'agrément de technologie

La procédure et les exigences d'une demande d'agrément de technologie sont présentées dans le système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.4.4 Sous-traitance

Le programme d'agrément de technologie ou la spécification applicable peut limiter la sous-traitance conformément au système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.4.5 Description de la technologie

Le fabricant doit décrire la mise en œuvre du programme d'agrément de technologie (TAS) pour son organisation dans un document de déclaration d'agrément de technologie (TADD), qui doit satisfaire aux exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant). Le document de déclaration d'agrément de technologie doit décrire le domaine d'application applicable de la technologie pour la plage des activités couvertes par le programme d'agrément de technologie, mais sans s'en écarter.

#### Q.4.6 Démonstration et vérification de la technologie

Pour la vérification des processus opérationnels et technologiques, le fabricant doit démontrer la conformité au contenu du document de déclaration d'agrément de technologie, conformément aux exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

Dans le cadre de la vérification de la fabrication, les performances des processus doivent être caractérisées et évaluées sur des composants pour lesquels une spécification particulière existe. Une telle spécification particulière doit être basée sur la présente spécification générique et sur une spécification intermédiaire, et elle doit donner des dispositions pour un agrément de technologie.

#### Q.4.7 Octroi d'agrément de technologie

Un agrément de technologie doit être accordé par l'organisme de certification (CB) quand les exigences du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant) sont satisfaites.

#### Q.4.8 Maintien d'agrément de technologie

Un agrément de technologie doit être maintenu conformément aux dispositions du système spécifié d'assurance de la qualité (le cas échéant).

#### Q.4.9 Contrôle de conformité de la qualité

Le contrôle de conformité de la qualité doit être effectué conformément au programme d'agrément de technologie applicable.

Le contrôle de conformité de la qualité de fabrication doit être effectué sur des composants pour lesquels une spécification particulière a été consignée dans le document de déclaration d'agrément de technologie. Le programme d'essai et les exigences du contrôle de conformité de la qualité doivent être indiqués dans la spécification particulière.

L'échantillonnage et la formation des lots de contrôle doivent être indiqués dans la spécification intermédiaire ou dans la spécification particulière. Les niveaux de contrôle et les plans d'échantillonnage doivent être choisis parmi ceux donnés dans l'IEC 61193-2, à l'exception des éléments du programme d'essai qui sont basés sur des effectifs d'échantillons fixes.

L'éprouvette pour un lot de contrôle doit être prélevée au hasard pendant un court intervalle de temps d'une période de contrôle, et ne pas présenter de modification majeure du procédé de fabrication.

L'utilisation de la règle de modification de contrôle pour un contrôle réduit du groupe C du programme d'essai est autorisée dans tous les sous-groupes excepté pour l'endurance, sauf indication contraire dans la spécification applicable.

## Bibliographie

IEC 60384-2, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes pour courant continu à diélectrique en film de téréphtalate de polyéthylène métallisé*

IEC 60384-3, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 3: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes électrolytiques au tantale pour montage en surface, à électrolyte solide au dioxyde de manganèse*

IEC 60384-3-1, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 3-1: Spécification particulière cadre – Condensateurs fixes électrolytiques au tantale pour montage en surface, à électrolyte solide au dioxyde de manganèse – Niveau d'assurance EZ*

IEC 60384-3-101, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 3-101: Spécification particulière – Condensateurs fixes chipsets au tantale pour montage en surface, à électrolyte solide et à anode poreuse, modèle I – Niveau d'assurance E*

IEC 60384-26, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 26: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes électrolytiques en aluminium à électrolyte solide en polymère conducteur*

IEC 60410, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

IEC 60469:2013, *Transitions, impulsions et formes d'ondes associées – Termes, définitions et algorithmes*

ISO 9000, *Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire*

---





INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)